

Примечание: Русский перевод стандарта запускается в производство только совместно с официальной версией на английском языке. Регулирущей версией является версия на английском языке. В случае разночтений необходимо руководствоваться версией на английском языке.

Отсутствующие по тексту русского перевода таблицы и рисунки представлены в версии стандарта на английском языке.

# IPC-SM-839

# Pre and Post Solder Mask Application Cleaning Guidelines

Инструкция по очистке до и после нанесения припойного трафарета

сполнитель	Проверил	Нач.отд.	Гл.инженер
Романова	Степанова	Исупов	Търлевин
1-8.17.08	Oller	Kenny	(Kull
	N -		MINNE

записка отдела 2614

emenueur IPC-SM-838 na anon. ezure (na 44 nuctax)

A standard developed by IPC

2215 Sanders Road, Northbrook, IL 60062-6135 Tel. 847.509.9700 Fex 847.509.9798 www.ipc.org

- 1.0 Область применения Этот документ охватывает все аспекты (как методологические, так и специфические) очистки, связанной с подготовкой несмонтированных печатный плат до применения припойного трафарета. В продолжении осуществляется тщательный контроль над уровнем чистоты во время применения припойного трафарета и технологической обработки, поддержание уровня чистоты печатных плат с примененным припойным трафаретом во время предварительного монтажа и/или хранения до монтажа. В итоге на основе методов вышеописанной деятельности документ имеет отношение к техническому обслуживанию паяного узла с уровнем чистоты, соответствующим уровню чистоты при конечном пользовании.
- 1.1 Введение Процесс очистки до этапа сборки печатной платы - единственный наиболее важный процесс, над которым должен осуществляться полнейший контроль. Также важно помнить, что при любом типе производства, включающем сборку, каждый этап, независимо от его степени важности, может привести к дополнительным затратам. В особенности это касается печатных плат, при работе с которыми множество этапов требуют полного выполнения процедур очистки. Очистка до применения припойного трафарета необходимо, так как дальнейшей возможности по удалению инородного вещества после этапа применения не предвидится. В целом рекомендуется использование чистовой камеры класса 10,000 или выше для удаления корпускулярного загрязнения. Вследствие различий в подготовке и очистке плат с медью и оловом/свинцом, данный документ рассматривает каждый тип схем отдельно в разделах 3 и 4 соответственно.
- 2.0 Применимые документы Документ является частью данной инструкции в степени, указанной здесь же.
- 2.1 Инс титут компоновки и упаковки электронных схем (IPC)

ІРС-ТМ-650 Руководство по методикам испытаний

- 2.3.25 Удельное сопротивление экстракта селективной сольвентной очистки
- 2.3.26 Ионизируемое обнаружение поверхностных примесей (динамический метод)
- 2.3.26.1 Ионизируемое обнаружение поверхностных примесей (статический метод)
- 2.3.38 Испытание на обнаружение поверхностной органической примеси (внутренний метод)

- 2.3.39 Испытание на обнаружение поверхностной органической примеси (инфракрасный аналитический метод)
- 2.6.3.1 Сопротивление влаге и изоляции полимерные припойные трафареты и конформные покрытия

IPC-S-804 Методы испытаний на паяемость для печатных монтажных плат

IPC-SM-840 Проверка и функционирование постоянного полимерного покрытия (припойных трафарет) для печатных плат

- 3.0 Припойный трафарет для голой меди В данном процессе травленный резист, который обычно является оловом/свинцом, удаляется таким образом, что следы меди остаются голыми. Припойный трафарет наносится на голую медь для обеспечения выравнивания припоя, уменьшения загрязнения, обеспечения электрической целостности и устранения механических повреждений. Удаление травленных резистов описано в разделе 3. См. рис.1 с технологической схемой.
- 3.1 Удаление металлического резиста Используется две методики для удаления олова/свинца или олова, металлического резиста из печатных плат. Они определяются путем применения раствора перекиси или кислотного раствора и описываются в последующих параграфах.
- 3.1.1 Перекись Перекись является агрессивным окислителем. Любое оборудование, подвергаемое ее воздействию, должно быть иметь конструкцию из пластика. Кроме того, многие изделия также содержат гидродифторид, который травит стекло. Поскольку реакции перекиси экзотермические, рекомендуется применение охлаждающего змеевика. Расслаивание может произойти из-за тепла и гидродифторида аммония. Совместимость слоистых материалов с растворами должна быть проверена до утверждения технологического процесса.
- 3.1.2 Прочие растворы Прочие растворы, не включающее перекись, является азотными или борфтороводородными кислотными соединениями. Одноэтапные процессы обычно задействуют методику распыления, двухэтапные процессы либо вымачивание, либо распыление. Растворы, не содержащие перекись, обычно не экзотермичны и не агрессивны к многослойным материалам. Однако отдельно взятый многослойный материал должен быть проверен на совместимость с особым раствором.

В целом, такие растворы более медленные, чем перекись. При использовании борфтороводородных кислотных соединений распылительное оборудование не должно содержать титан из-за агрессивного воздействия.

Рисунок 1. См. оригинал

3.1.3 Обнаружение остаточных примесей О неполном удалении олова/свинца свидетельствует тусклое серое олово или белый порошковый остаток. Это указывает на неполное удаление интерметаплического слоя или фторида свинца

Примечание: Иногда возможно, что на плате визуально отсутствуют какие-либо остаточные примеси, но в действительности имеется интерметаллический слой, который приводит к несмачиванию. Это состояние можно определить, применив методы анализа поверхности, например, рентгеновский флуоресцентный анализ или электронную спектроскопию.

3.2 Удаление остаточных примесей Удаление остаточных примесей варьируется в зависимости от применяемой методики. При использовании перекиси, удаляются остаточные примеси фторида свинца путем более длительного периода выдержки в растворе, или путем погружения частей в кислотный раствор. Примеси могут также указывать, что присутствует необходимость пополнения/замены раствора.

При удалении раствором, не содержащим перекись, неполное удаление интерметаллического слоя олова-меди может потребовать более длительного периода выдержки во вторичном растворе или пополнения/замены раствора.

- 3.2.1 Удаление органического резиста Платы, сделанные плазменным травлением или другой методикой, где используется фоторезист или прочий органический резист в качестве конечного травленного резиста, должны быть очищены до голого олова для обеспечения соответствующего сцепления с припойным трафаретом и во избежание вздутий во время последовательной высокотемпературной обработки.
- 3.2,2 Резисты, обрабатываемые растворителем обрабатываемые растворителем, Резисты, обычно метиленхлоридом, который содержит удаляются азеотропное количество метанола. При правильной методике удаления такая пленка легко ликвидируется и практически не оставляет примеси. Самой большой потенциальной проблемой является недостаточная подача свежего растворителя, которая приводит к образованию остаточных примесей резиста, образующихся в конечных полостях растворения.

Испарение грязного растворителя затем оставляет пленку резиста на поверхности, которая должна быть удалена в процессе химической очистке, как описано ниже.

- 3.2.3 Резисты, обрабатываемые водой Водяные и полуводяные резисты удаляются щелочным раствором, иногда содержащим органический растворитель. Щелочь может либо органической (моноэтаноламин) или неорганической (гидроксид натрия). В целом, эти пленки удаляются не так чисто, так как растворители часто оставляют тонкий слой органического остатка на медной поверхности, который должен быть удален в процессе химической очистки.
- 3.2.3 Удаление остатков резиста Химическая очистка меди с удаленным резистом может быть выполнена либо в распылительной оборудовании с конвейером, либо в баке для обработки. Выбор оборудования будет зависеть от методики удаления. Между удалением и очисткой не должно быть времени удержания, поскольку остаток резиста может высохнуть и плотно прилипнуть к медной поверхности, что затруднит его удаление.

Процесс химической очитки обычно состоит из 3 этапов, каждый разделен тщательной промывкой водой:

Моющее средство: Моющее средство используется для ослабления остатков резиста и их размягчения так, чтобы химикаты микротравления могли проникнуть и атаковать медь, с которой они соединены. При использовании распылительной системы, следует использовать пенящееся, неионогенное средство, которое используется в автоматических посудомоечных машинах. Температура обычно в диапазоне 60-71°C, в зависимости от ограничений используемого оборудования. пребывания в распылительной системе обычно 1 минута; в баке = 4 минуты. Моющие средства могут быть либо щелочными, либо кислотными, но щелочные детергенты более распространены. Некоторые кислотные детергенты содержат травильный раствор. Их следует использовать осторожно, так как травильные характеристики могут быть непостоянными и травильный остаток может отложиться на поверхности.

Травильный раствор: Применение травильного раствора — это этап, в результате которого удаляется остаток резиста и открывается свежая медная поверхность. В случае сильного загрязнения поверхности, тонкая пленка резиста может быть видна плавающей в травильном растворе после короткого периода использования. По этой причине следует использовать систему фильтрации. Медь следует протравить, чтобы обеспечить всю поверхность свежей незагрязненной меди, обычно 1.8 µm.

Травитель должен быть раствором на основе сульфата (персульфат натрия, перекись водорода/серная кислота и т.д.), чтобы обеспечить чистую промывку.

Обработки в серной кислоте/противоосмоление: После обработки микротравителем следует промывка 5% или 10% серной кислотой для удаления остаточных солей. Противоосмоление необязательно; необходимо обратиться за рекомендациями к поставщику припойного трафарета. В качестве альтернативы противоосмолению, легкая очистка пассивирует поверхность путем механического удаления остаточных солей и предотвратит излишнее окисление.

Удаление резистов таким способом оставляет очень активную поверхностную медь, поэтому необходимо принять соответствующие меры ло обеспечению надлежащих условий хранения.

Эффективность удаления органического резиста Чтобы определить эффективность очистки при удалении остатков фоторезиста, можно запустить контрольную плату способом, аналогичным определению эффективности доплатовой очистки. Подготовьте панель с резистом, оставив секцию голой меди голой. Оголите или затвердите резист и подвергните его удалению и очистке. По завершении не должно быть разницы между участком, имеющим резист участком, никогда контактировавшим с ним. В качестве последнего испытания панель следует опустить в ванну пентагидрата сульфата меди на 10-15 минут без дополнительной очистки. Отслаивание или наличие затемненного, серого, изъеденного покрытия, отр свидетельствует органическом загрязнении, должно отсутствовать. Также должна отсутствовать демаркационная линия между обработанными и необработанными участками.

3.3 Обработка платы после удаления резиста Платы следует всегда брать только за края. Правильный выбор перчаток может облегчить работу. Неверный выбор перчаток дает ложное чувство безопасности, поскольку некоторые перчатки оставляют волокна на плате. Некоторые перчатки впитывают смазку, которая может быть передана плате.

Хранение на стойке — наиболее приемлемый метод для обрабатываемых плат. Платы следует хранить в атмосфере с низкой влажностью и отсутствием химических веществ. Чем дольше платы находятся в хранении, тем выше окисление меди. Излишнее окисление требует изменений в цикле очистке для обеспечения надлежащей медной поверхности.

3.4 Подготовка поверхности перед применением припойного трафарета Для обеспечения максимального

сцепления припойного трафарета с поверхностью платы, кондиционирование поверхности требуется применением припойного трафарета. В большинстве случаев термин «подготовка поверхности» относится к огрубению меди в остатках схемы и земляном слое для обеспечения наибольшей области площади поверхности для сцепления с припойным трафаретом. Главной проблемой является голый метадл, который обычно довольно данном этапе обработки. гладкий на Многослойный материал обычно довольно грубый для обеспечения хорошего сцепления без дальнейшей обработки и требует только удаления поверхностного загрязнения.

Наиболее часто используемые методы кондиционирования поверхности до применения припойного трафарета на голую медь - механическая чистка щеткой, пемзовая шлифовка, химическое микротравление, нанесение химического покрытия или комбинирование этих методов.

3.4.1 Механические методы Механическая очистка используется в большинстве процессов обработки, однако следует быть осторожным, так как тот или иной метод может не подходить для определенных целей. Обычно механическая очистка выполняется на конвейерных машинах, которые делятся на две категории. Первая щеточная машина или скруббер, который использует быстро вращающуюся шлифующую щетку для удаления загрязнения поверхностного (вместе с некоторым количеством поверхностной меди) И придает шероховатость остальной медной поверхности для лучшего сцепления. Второй тип машины выполняет аналогичные действия, но применяется гидросмесь пемзы, наносимой либо распылителем, либо щеткой.

#### 3.4.1.1 Механическая чистка

распространенный Самый механический метод использование чистильно-моечной машины C вращающейся шлифующей щеткой. Доступное оборудование обычно имеет вид свободностоящей машины с отделением щетки для обработки поверхности. Затем следует водная промывка для удаления остатков с поверхности платы и просушка для удаления капель воды и избыточной влаги. Три доступных типа щеток сплющенный круг, щетка с нейлоновыми щетинками и композитный круг. Сплющенный круг - наиболее агрессивный и быстрый механизм, но его волокна могут оторваться, отверстия забиться, что сокращает срок эксплуатации щетки. Нейлоновые шетинки имеет самый большой срок эксплуатации, не оставляют ненужные продукты износа, но менее агрессивны и могут привести к размазыванию нейлона по схемам. Композитный круг имеет мелкое зерно, он агрессивен, но продукты износа остаются проблемой. Поскольку доступно большое количество щеток, выбор может быть сужен до того или иного типа. Щетки с нейлоновыми щетинками не следует иепользовать для меди, так как нейлон оставляет невидимые пятна, вредящие сцеплению припойного трафарета, если прилагается слишком большое давление. Сплющенный или композитный круг для межсоединения или высокого разрешения гораздо лучше подходят для кондиционирования поверхности, так как имеют меньшее абразивное зерно, чем другие круги; меньше вероятности, что они оставят глубокие канавки в меди, которые не сможет покрыть припойный трафарет. Действительный размер зерна для таких щеток составляет около 600 или меньше (большее число означает меньший размер частиц). Надлежащее давление щетки обычно меньше, чем используется для чистки платы применения травителя или резиста. Излишнее давление может вызвать размазывание эпоксидной связки по поверхности меди, когда слоистый материал еще не полностью имеет поперечную связь.

Необходимое давление можно легко лостичь следующем испытании. Плата, плакированная медью, примерно аналогичной ширины, что и плата для нанесения трафарета пропускается над (или под) щеткой и конвейер останавливается. Щетка входит в контакт с платой и пропускается в течение нескольких секунд, манометр щетки замеряет давление. Щетка поднимается, плата удаляется из машины. Узкая полоска полированной меди остается в месте, где щетка вошла в контакт. Давление щетки верно, если ширина этой полоски составляет между 6,3 и 9,5 мм. Контрольная плата затем снова пропускается через скруббер и щетки регулируются, пока аналогичное значение не получается на манометре. Теперь машина готова для нанесения трафарета на печатные платы. В машинах, где конвейер невозможно остановить во время вращения щетки, на испытательном стенде необходимо провести корреляцию давления щетки и скорости конвейера со свойствами конечного продукта.

Гидравлическое испытание может выявить достоверность настройки машины. Правильно очищенная плата, плакированная медью, эквивалентная по толщине плате, подлежащей обработке, выдерживает непрерывную водную пленку в течение 30 секунд в вертикальном положении после чистки. Хотя эта процедура часто используется, она может быть неверно истолкована, особенно с медными поверхностями, подвергнутыми излишней очистке.

Непротиворечивые результаты и максимальный срок эксплуатации могут быть обеспечены в результате правки щеток. Щетки изнашиваются неравномерно, если платы загружаются в одном и том же месте на конвейере, причем некоторые части плат недостаточно очищаются, когда

другие подвергаются слишком высокому давлению. Правка довольно легко проходит со сплющенными и композитными кругами и может быть выполнена на станке с правильными плитами, поставляемым изготовителем станка или щетки. Щетки с нейлоновыми щетинками гораздо сложнее править на станке, чтобы не повредить их. Предлагается следовать инструкциям изготовителя станка или щетки, когда щетки требуют правки.

Необходимо соблюдать осторожность во избежание загрязнения оборудования для очистки меди с оловянными и оловянно-свинцовыми примесями. Нельзя использовать скруббер для очистки плат с медью и оловом или оловянно-свицовых плат. Аналогично должны быть удалены все следы олова, олова/свинца и интерметаллов перед чисткой медной поверхности.

Поскольку щетки могут оставлять продукты износа на поверхности платы, необходима хорошая промывка. Большинство шеточных машин оснащено интегрированной секцией ополаскивания. которой достаточно, пока давление не превышает 1,3 бара. После промывки плату нужно высушить с помощью теплого, бесмасляного, нагнетаемого воздуха. Большинство шеточных машин оснащено интегрированной сушилкой. выполняющей эту функцию. Использование инфракрасной сушилки, которая сушит путем испарения влаги на платы, избегать, поверхности следует загрязняющие вещества в воде остаются на поверхности после испарения воды и задерживаются под припойным трафаретом. Это может привести к окислению и снижению сцепления, что, в свою очередь, приводит к образованию пузырей.

3.4.1.2 Очистка пемзой Это также традиционный и эффективный механический метод очистки меди перед применением припойного трафарета. Пемза активируется кислотой или не содержит примесей. Активированный кислотой тип используется при очистке вручную, а пемза примесей используется гидросмесь как распылительных машинах. Распыление должно выполняться только в оборудовании, предназначенном специально для этой цели. Необходимо соблюдать обращении с гидросмесью в осторожность при распылительных машинах. Гидросмесь хорошо подходит для удаления оксидов и других остатков. Этот процесс оставляет поверхность чистой и огрубевшей для хорошего сцепления с припойным трафаретом. Однако, важно провести надлежащую промывку, так как остатки пемзы под припойным трафаретом могут вызвать отслаивание и вздутие во время последующей обработки.

Поскольку пемза не растворима в воде, требуется большой объем и высокое давление распыления для промывки. Платы сущатся бесмасляным горячим воздухом и

обрабатываются быстро во избежание образования окиси. Химическая очистка может предшествовать очистку п³мзой

Очистка пемзой неэффективна после очистки припойного трафарета. Она не только изотрет поверхность припойного трафарета, но и не прочистит отверстия, где эта чистка необходима.

3.4.2 Химическая очистка Методы химического кондиционирования могут использоваться для очистки медной поверхности. Наиболее эффективно осуществляется в распылительном оборудовании с конвейером. Типичный цикл рабочей станции состоит из очистки для удаления органики, например, отпечатков пальцев, с поверхности платы; водная промывка; микротравление для огрубения медной поверхности; промывка; просушка воздухом. теплым Использование присадки противоосмодения после микротравления может понадобиться, как микротравленная медная поверхность окисляется очень быстро, особенно если существует задержка между применением припойного трафарета. Совместимость присадки противоосмоления с припойным трафаретом должна быть подтверждена (см. 3.4.3.2).

Существует множество запатентованных распыляемых очистительных средств как кислотных, так и щелочных. Для получения успешных результатов рекомендуется использовать очистительное средство, специально предназначенное для распыления, поскольку пенообразование может быть главной проблемой у таких средств.

На этапе микротравления необязательно удалять много меди, так как требуется только огрубение поверхности. В большинстве случаев для достижения нужного огрубения удаление слоя в 1-2 µт более, чем достаточно. Самые распространенные ванны для микротравления сделаны на основе персульфата, перекиси водорода, серной кислоты или трихлориде железа. Травильный раствор персульфата продается, как запатентованная смесь от изготовителей химии. Ванны с персульфатом обычно обеспечивают несколько более грубую поверхность, которая более стабильна период времени. Естественно технологический процесс, по окончании которого от ванны избавляются, когда нагрузка меди достигает определенного уровня.

Микротравители на основе перекиси/серной кислоты также доступны как запатентованные средства для использования в баках и распыления. Раствор перекиси требует сильной стабилизации во избежание его перерасхода. Основное преимущество ванны с перекисью/серной кислотой заключается в том, что она

может быть восстановлена. Медь, оседаемая в ванне, может быть удалена в процессе охлаждения и осаждения в виде пентагидрат сульфата меди. Затем добавляют перекись водорода и серную кислоту, чтобы восполнить потери и ванна снова вводится в эксплуатацию. Этот процесс может быть восстановлен путем применения охладителя/кристаллизатора или выполнен во время групповой обработки.

Микротравители на основе трихлорида железа также доступны как запатентованные средства для использования в баках и распыления. Когда трихлорид железа используется как микротравитель, важно проверить поверхность платы на наличие остатков хлоридов металлов.

Промывка чрезвычайно важна, особенно при использовании щелочного очистительного средства и/или персульфата или микротравителепй на основе трихлорида железа. При использовании микротравителя на основе персульфата будет полезно выполнить промывку 2% или 3% серной кислотой после микротравления, чтобы убедиться, что все остатки персульфата удалены. После последнего этапа промыаки платы следует высущить теплым нагнетаемым воздухом.

3.4.3 Химическое покрытие Хотя механическое и химические методы очистки являются превалирующими в подготовке медных схем для применения припойного трафарета, существуют несколько методов химического покрытия, в результате которых получается постоянная или временная химическая обработка. Их применение более ограничено, условия обработки уже, поэтому имеет смысл принимать меры безопасности. Необходимо подтвердить совместимость этих покрытий с припойным трафаретом.

3.4.3.1 Оксиды Использование меди черной или коричневой оксидной ванны нанесения контролируемого слоя от 0,5 до 1,0 µm может в дальнейшем способствовать улучшению сцепления припойного трафарета. Кристаллическая структура оксидного слоя значительно увеличивает площадь поверхности для улучшения сцепления трафарета. Коричневый оксид более предпочтителен, так как он имеет меньшую кристаллическую структуру и может быть нанесен при более низкой температуре. Необязательно наносить покрытие на медь слишком толстым слоем так, чтобы получался насыщенно черный или коричневый цвет (как это обычно делается на сложных внутренних слоях). Для применения припойного трафарета все, что требуется это бронзовый или светло-коричневый цвет. Нанесение оксидов выполняется в специальных ваннах, нанесение возможно при помощи конвейерного оборудования. Этапы подготовки меди для оксидного слоя

аналогичны химическому кондиционированию, описанному в разделе 3.4.2, за исключением нанесения присадки противоосмоления. Изготовители оксидной химии имеют руководства последовательных действий для применения своей продукции.

3.4.3.2 Антиоксиданты/присадка против осмоления Если есть задержка между очисткой и применением припойного трафарета, можно использовать антиоксидант/присадку против осмоления. Существуют различные типы и все применяются в низкой концентрации. Они применяются как спрей или раствор для погружения, затем следует промывка. Точная концентрация, время и температура представлена в руководствах поставщиков.

Некоторые припойные трафареты могут быть применены непосредственно на обработанную поверхность, и антиоксидант/присадка позднее удаляется из других областей для дальнейшей обработки. Удаление обычно выполняется мягкими минеральными кислотами. Важно следовать рекомендациям поставщиков относительно времени, температуры, концентрации и цикла промывки. Большинство агентов следует удалить до выравнивания припоя, поскольку паяемость сильно снижается на обработанных поверхностях.

Испытание на совместимость со сцеплением припойного трафарета должно выполняться до нанесения антиоксиданта/присадки, так как могут появиться вздутия и отслаивания. Контрольные платы можно использовать, чтобы определить должны ли антиоксидант/присадка быть удалены до применения припойного трафарета или следует обратиться к поставщику за рекомендациями.

- 3.4.4 Окончательная промывка Требования к окончательной промывке могут быть проигнорированы во время очистке до применения трафарета. Задействованы множество факторов, включая требования к надежности для платы и разметки. В зависимости от источника воды (обычная проверка) может подойти для окончательной промывки. Однако, в связи с изменениями (которые могут произойти очень быстро) в жесткости и температуре воды предпочтительно использовать деионизированную воду с удельным сопротивлением 3-5 мегом/см.
- 3.4.5 Просушка Поглошенная вода и водные остатки часто являются причиной вздутий и потери сцепления припойного трафарета. Поэтому важно удалить всю оставщуюся воду с поверхности платы и отверстий, а также тщательно просушить плату перед применением припойного трафарета.

Сначала воду нужно удалить физически (продуть) с поверхности и из отверстий перед выполнением

испаряющего цикла просушки большого объема, применением сушилки и/или турбинной сушилки с фильтрованным бесмасляным воздухом. Если первый этап пропущен, загрязняющие вещества в промывочной воде могут отложиться на плате во время испарения. Также просушка испарением не всегда удаляет воду из отверстий. На стандартных платах FR-4 поглощенная вода удаляется в результате минимального 20 минутного прогрева в печке при температуре 110 ± 5 °C или при помощи конвейерного с рабочими инфракрасного станка параметрами, настроенными пользователем. Платы с основанием, отличным от стекла/эпоксидной связки FR-4 или платы другой конструкции (т.е. толщина, тепловая масса др.) могут иметь иные требования условий просушки. Если платы очищаются только в растворителе (без водной очистки или промывки), просушка турбинной сущилкой можно пропустить, однако, просушка остается важным этапом обработки. Сушильные печи должны быть специализированным оборудованием для предотвращения перекрестного загрязнения плат. Конструкция печи должны гарантировать ровный температурный режим во всех точках печи. Печи с нагнетаемым воздухом с хорошей внешней вытяжкой для удаления пара используется максимального лля повышения эффективности просушки.

3.5 Испытание на чистоту до применения припойного трафарета Чистота плат после очистки оценивается несколькими методами. Наличие ионных и органических остатков возможно после предыдущей обработки. Их присутствие требует дополнительной очистки, если превышены допустимые ограничения пользования. Важно использовать контрольный образец платы для испытания того, что изменения в обработки привели к надлежащей чистоте плат.

Остатки могут содержать смесь ионных и неионных материалов, которые обычно вместе откладываются на поверхности платы. Ионная часть остатков может послужить индикатором общей чистоты поверхности. Однако, чтобы убедится, что требования соблюдены, следует выполнить как ионные, так и органические испытания.

- 3.5.1 Гидравлические испытания Это не испытания на чистоту. Лучше всего проводить их на платах, плакированных медью для выявления эффективности механической очистки, См. 3.4.1.1
- 3.5.2 Испытание на паяемость Определение паяемости выполняется для выявления отсутствия поверхностного загрязнения платы, отрицательно влияющего на сцепление припойного трафарета. Согласно методике испытаний в стандарте IPOC-S-804, печатная плата без загрязнений демонстрирует свойство, известное как смачивание.

Смачивание — это образование относительно единообразной, гладкой, непрерывной, клейкой пленки припоя к металлической подложке.

Плата, имеющая поверхностное загрязнение показывает отсутствие смачивания иди характеристик смачивания. Отсутствие смачиваниеэто состояние. которое получается, расплавленный припой покрыл когда испытуемую поверхность и затем отошел, оставив несимметричные колмики припоя, разделенные областями, покрытыми тонкой припойной пленкой (металлическая подложка не оголена). Отсутствие смачивания - это состояние, в силу которого расплавленный припой соприкасался с поверхностью, но не получил сцепления со всей поверхностью (металлическая подложка оголена).

3.5.3 Ионы Поскольку наличие ионных остатков на голых печатных платах до применения припойного трафарета может значительно повлиять на качество платы, необходимо периодически проводить измерения остатков. Ионные материалы, оставшиеся на плате, могут содействовать коррозии металла, даже когда ионное загрязнение покрыто припойным трафаретом. Так как слой припойного трафарета может быть со временем пропитан влагой и кислородом, защищать поверхности с внутренней стороны от коррозийного атмосферного воздействия неэффективно, особенно при наличии гигроскопических ионных материалов.

Автоматизированное оборудование иногда используется для определения ионной чистоты. Следует соблюдать меры осторожности при получении соответствующих показателей эквивалентности между различными марками и моделями оборудования.

Экстрагирование Для 3.5.3.1. ионов измерения остатков сначала количества ионных необходимо экстрагировать ионы в водный раствор. Поскольку остатки часто содержат компоненты, которые плохо растворимы в воде, смесь воды и спирта, например, изопропанола, используется для экстрагирования ионов с поверхностей платы. Таким образом, могут быть растворены ионный компонент, растворимый в воде, и неполярный компонент, спирте, для измерения растворимый компонентов.

3.5.3.2 Измеритель удельной проводимости Многие методики испытаний на ионы основаны на принципах (разработанных Морским центром авиационного оборудования Индианаполисе, штат Индиана). M1L-P-28809. представленных В Смесь изопропанола/25% воды намывается на поверхность платы для растворения ионных материалов. Капли из избытка воды с поверхности платы собираются и измеряются отдельно при помощи измерителя удельной проводимости

или резистивиметра. См. 2.3.25 стандарта IPC-TM-650 для ознакомления с методикой испытаний.

3.5.3.3 Статический метод экстрагирования Автоматизированная использующая система, экстрагирования из статичного объема, погружает образец в фиксированный объем смеси воды со спиртом. После соответствующего времени экстрагирования, обычно 15 минут, считывается удельное сопротивление раствора. Это значение может быть конвертировано в эквивалентное количество ионного материала, используя хлорид натрия, и выражено как общее количество ионного материала, экстрагированного из образца. См. 2.3.26.1 Стандарта ІРС-ТМ-650 для ознакомления с методиками испытаний. См. 5.1.

3.5.3.4 Динамический метод экстрагирования Другой прибор использует динамическую систему ионного экстрагирования, в которой раствор воды со спиртом непрерывно закачивается с замкнутым циклом из бака через ионообменник, затем обратно в бак. Когда образец погружается в бак, проводимость возрастает до максимума, а затем падает до изначального уровня. Измерение и интеграция проводимости дает значения, являющиеся линейными функциями количества ионов, погруженных в раствор. См. 2.3.26 Стандарта IPC-TM-650 для ознакомления с методиками испытаний. См. 5.1.

3.5.4 Органика Наличие органических, неионных загрязняющих веществ на поверхности голой печатной платы из-за процесса сборки платы навредить сцеплению припойного трафарета. Неразрушающее обнаружение и квантификация подобных загрязняющих веществ описаны в Стандарте IPC-TM-650, Методы испытаний 2.3.38/2.3.39.

Метод Испытаний 2.3.38, «Испытание на обнаружение органических загрязнителей поверхности» является качественными методом определения наличия иди отсутствия широкого спектра возможных органических загрязнителей при помощи раствора ацетонитрила в качестве экстрагирующего средства. Этот метод не обнаруживает наличия специфичных загрязнителей и не разделяет загрязняющие смеси на отдельные компоненты. Визуальная граница обнаружения по средством этого метода приблизительно составляет 10 микрограмм/см<sup>2</sup>.

Метод испытаний 2.3.39, «Испытание на идентификацию органических загрязнителей поверхности (Инфракрасный аналитический метод)» является аналитическим методом количественного анализа широкого спектра неионных органических загрязнителей и выявления отдельных компонентов загрязнителей. Методика, также использующая ацетонитрил, более распространена, чем испытаний 2.3.38 И требует опытного спектроскописта пля эффективного использования инфракрасного спектрофотометрического оборудования множественного полного внутреннего отражения (МПВО), необходимого для испытания. Другое аналитическое испытание для определения общего органического загрязнения — электронная спектроскопия для химического анализа.

Поскольку ацетонитрил является растворителем для множества органических соединений, включая многие компоненты производства монтажных печатных плат. может потребоваться изначальное определение характеристик экстракта, полученного в результате менее технического Метода испытаний 2.3.38. Более технический, более чувствительный метод испытаний 2.3.39 может использоваться для определения тех органических компонентов экстракта, которые действительно представляют собой нежелательные загрязнители из этих компонентов, являющиеся неотъемлемой частью печатной платы, После определения характеристик использование метода испытаний 2.3.38 можно использовать в качестве отбора образцов или технологической проверки.

3.5.5 Сопротивление изоляции и влагостойкость Чувствительным методом обнаружения некоторых загрязнителей поверхности на многослойной плате является измерение сопротивления изоляции поверхности. Испытание обеспечивает измерение восприимчивости печатной платы к выявлению утечки тока между смежными проводниками на поверхности.

Если загрязняющих остатках содержатся следы гигроскопических материалов, поглощение влаги из атмосферы, особенно при наличии надземных условий влажности/температуры, приведет к утечке тока с поверхности при подаче напряжения. Это может неблагоприятно отразиться на электрическом функционировании многих схем или даже привести к поломке схем с полным сопротивлением. Процедура контрольной плате, подвергнутой выполняется на условиям обработки, что И идентичным изготовленных плат. Это делается для получения моделей с идентичной геометрией и результатов, которые можно показательно сравнить между собой. Процедура не осуществима при попытке измерить сопротивление изоляции поверхности между смежными линиями смешанных функциональных моделей плат. Чтобы решить эту задачу, плата проектирует с малым контрольным образцом, добавляемым сбоку функционирующей схемы специально для проведения испытания. Подобный подход включает в себя проектирование малой разрывной части платы, которую можно удалить и независимо испытать после обработки платы. Еще один метод -- запустить одну или более отдельных контрольных плат парадлельно обработке партии изготовленных плат. Эти контрольные платы, например, модель IPC-B-25, могут рассматриваться как носители воздействия обработки и материалов относительно партии плат.

Измерение сопротивления изоляции и влагостойкости очень сложный и трудоемкий процесс, требующий большого внимания, чтобы получить логичные и воспроизводимые результаты. Обычно обработанная стандартная модель монтируется в камеру для проведения температурных/влажностных испытаний с электрическими соединениями, подключенными к контактным площадкам. Напряжение смещения подводится между смежными Система обеспечивает имкиниц модели. условие длительных периодов времени, обычно до недели и более. Периодически проводятся измерения сопротивления между секциями модели CO встречно-штыревой Изначальное напряжение смещения структурой. отключается и подводится специальное измерительное напряжение. Минутные токи могут быть измерены высокочувствительным амперметром значением сопротивления, вычисленным закону Ома. Сопротивление может быть считано непосредственно с помощью омметра. Однако, омметр должен иметь измерения сопротивления при установленном значении измерительного напряжения. Измеренное значение обозначается как сопротивление изоляции и влагостойкости и сильно зависит от условий испытания. Результаты могут широко варьироваться в зависимости ОТ условий испытаний. Некоторые параметры, влияющие на результаты испытаний на сопротивление изоляции и влагостойкости:

- 1. Геометрия платы
- Материал платы
- 3. Температура
- 4. Влажность
- 5. Напряжение
- 6. Изначальное состояние очистки образца
- 7. Условия обработки платы
- 8. Типы, количество и распределение загрязняющих веществ на плате
- 9. Методика испытания
- 10. Испытательное оборудование

Если необходимо оценить воздействие переменных 7 и 8, важно, чтобы остальные параметры подвергались строгому контролю и воспроизводились от испытания к испытанию. Условия, использованные в испытаниях IPC на сопротивление изоляции и влагостойкости, указаны в методе 2.6.3.1 Стандарта IPC-TM-650.

3.6 Хранение до применения припойного трафарета Максимально допустимое время хранения очищенных плат зависит от метода очистки, типа меди и атмосферы площади хранения. Обычно оно должно быть сокращено до минимума, чтобы снизить окисление голой меди и загрязнение платы. Длительные периоды хранения требуют повторной очистки. Многослойный материал может впитывать воду и другие испаряющиеся вещества при неправильной защите влагонепроницаемой упаковкой. Во избежание этого голые платы должны быть просушены в течение 1 часа при температуре 150 °С и затем повторно подвергнуты очистке.

Не следует касаться пальцами печатной поверхности. В связи с коррозийной природой выделений рук, операторы всегда должны держать платы за края и носить чистые перчатки. См. 3.3 для получения информации о перчатках.

3.7 Применение припойного трафарета Методы и процедуры применения и работы с припойными трафаретами не описаны в данном руководстве. Нанесение припойного трафарета на очищенные медные схемы должно соответствовать рекомендациям отдельно взятого поставщика.

#### 3.8 Проблемы с нивелировкой до пайки

В таблице 1 представлен список проблем и решений к нанесенному припойному трафарету на голую медь. Будучи не полным, список дан в информационных целях.

- 3.9 Процесс нивелировки пайки Нивелировка пайки тип обработки, в результате которой улучшается паяемость медных печатных плат и срок хранения оловянно-свинцовых плат. В этом процессе нивелируются некоторых нежелательные особенности, например, переменчивое металлическое сцепление, образование паяльных флюсов и снижение сопротивления изоляции и электромиграции, что происходит зачастую оловянносвинцовых печатных плат.
- 3.9.1 Нивелирование Этот процесс быстрее, чем электроосаждение свинца/олова, и нужно гораздо меньше свинца/олова для аналогичного отверстия и паямости платы. В дальнейшем процесс ускоряется в сторону более

ровных линий и плотно упакованных конструкций печатных плат, что невозможно с оловянно-свинцовыми многослойными системами.

Были разработаны различное оборудование и материалы в попытке улучшить и оптимизировать процесс. Сюда входят методы применения горячего масла (1 нивелирование припоя горячим маслом) и горячего сжатого воздуха (2 - нивелирование припоя горячим воздухом) удаления излишков поипоя цилиндрических отверстий и с поверхностей платы. Другие варианты заключены в погружении и извлечении плат в вертикальном и горизонтальном положении при использовании различных углов, конфигураций, скоростей и времени выдержки для улучшения характеристик выравнивания. Операция 1 эволюционировала, будучи более распространенной, чем операция 2.

Для снижения загрязнения необходимо осуществлять строгий контроль над процессами и материалами. Все виды нивелирования пайки характеризуются как операции, связанные с устранением загрязнений и коррозии. Последующие этапы обработки аналогичны у всех процессов.

3.9.2 Осмотр и предварительная очистка Два эти крайне необходимым этапа выделяют предварительную очистку как важнейшую функцию операции. Первый этап — осмотр и какой-либо из видов очистки для удаления загрязняющих веществ, которые могут помещать удалению оксидных слоев и критически снизят паяемость меди.

Второй этап — успешное удаление оксидных слоев и обычно выполняется при помощи микротравителя умеренно активного типа для предварительной очистки. Обычно выбирается чистящий агент, способный удалить как поверхностные масла, так и микротравитель. При необходимости это выполняется в два этапа, хотя существуют хорошие чистящие средства для очистки за один этап. Для оценки этого процесса необходимо сначала обрабатывать платы в наихудшем состоянии. Далее следует промывка. В результате ее можно определить количество средства для предварительной очистки и чистую медь, которая может быть затянута во флюс.

#### Таблица 1 Припойный трафарет на меди

Проблема	Причина	Решение

Плохое сцепление припойного трафарета (обычно)	Загрязнение на поверхности плагы до применения припойного трафарета	Следуйте процедурам очистки, описанными в Разделе 3 4  Обеспечьте надлежащий уровень чистоты (Раздел 3.5)  Перепроверьте на наличие остатков во время снятия резиста, и при необходимости повторите очистку
	Влага под припойным графаретом может привести к круглым вздутием	Просущите в печке в течение недолгого времени при температуре 71 °C непосредственно перед применением маски Проверьте помещение на наличие высокой влажности или гидравлического оборудования Проверьте сроки хранения до применения припойного трафарета и время выдержки
Плохое сцепление припойного трафарета (термически обработанные трафареты)	Недостаточная обработка припойного трафарета - недостаточная поперечная связь полимерного покрытия уязвима для агрессивного воздействия флюсов и очистительных средств, теплового удара.	Используйте рекомендованный поставщиком отвердитель для полимерного покрытия и цикла смешивания для двухсоставных систем  Соблюдайте время просушки и температуру, рекомендованную поставщиком  Соблюдайте время поддержания температуры отверждения для холодных плат перед запуском таймера  Не открывайте печь во время цикла отверждения  Устраните участки недогрева в печи  Обеспечьте надлежащую вентиляционную струю через печь для удаления паров растворителей и проверые вентиляционную систему на предмет засорения  Выполняйте мониторинг температуры и очистку в печи  Испытание на отверждение метиленхлоридом не является единственным критерием для определения полного отверждения (см. IPC-SM-840B)
Плохое сцепление припойного трафарета (трафареты, обработанные ультрафиолетовым излечением)	Недостаточная обработка припойного трафарета - недостаточная поперечная связь полимерного покрытия уязвима для агрессивного воздействия флюсов и	Соблюдайте рекомендованный поставщиком энергетический уровень для отверждения толщины покрытия  Регулярно очищайте лампы, проверяйте уровень накала в рамках повседневного

-	очистительных средств, теплового удара	ухода и изменяйте его при необходимости Контролируйте гемпературу в ультрафиолетовой лампе во избежание излишнего нагрева платы
Плохое сопротивление растворителя или очистителя	Недостаточная обработка припойного трафарета (термически обработанные трафареты)	Используйте рекомендованный поставщиком отвердитель для полимерного покрытия и цикла смешивания для двухсоставных систем  Соблюдайте время просушки и температуру, рекомендованную поставщиком  Соблюдайте время поддержания температуры отверждения для холодных плат перед запуском таймера  Не открывайте печь во время цикла отверждения  Устраните участки недогрева в печи  Обеспечьте надлежащую вентиляционную струю через печь для удаления паров растворителей и проверые вентиляционную систему на предмет засорения  Выполняйте мониторинг температуры и очистку в печи  Испытание на отверждение метиленхлоридом не является единственным критерием для определения полного отверждения (см. IPC-SM-840B)
	Недостаточная обработка припойного трафарета (трафареты, обработанные ультрафиолетовым излечением)	Соблюдайте рекомендованный поставшиком энергетический уровень для отверждения толщины покрытия  Регулярно очищайте лампы, проверяйте уровень накала в рамках повседневного ухода и изменяйте его при необходимости обычно 1000 часов  Контролируйте температуру в ультрафиолетовой лампе во избежание излишнего нагрева платы
	Неподходящий гип припойного трафарета	Используйте припойный трафарет, соответствующий уровню производительности, описанному в IPC-SM-840B
	Несовместимые химические средства очистки	Найдите совместимую комбинацию трафарет очистительное средство

Таблица 1 Припойный трафарет на меди (продолжение)

Проблема	Причина	Решение
Плохие электрические свойства	Загрязнение поверхности платы до применения припойного трафарета	Выполняйте определенные процедуры очистки Проведите испытание на чистоту до применения припойного трафарета Повторно проверьте удельное сопротивление промывочной поды
	Недостаточное отверждение припойного графарета, обработанного ультрафиолетовым излучением	Увеличьте время отверждения Проверьте калибровку ульграфиолетовой печи
Плохой внешний вид – точечные дефекты покрытия, лунки или «рыбыи глаза»	Масляное загрязнение на поверхности до применения припойного трафарета	Тщательно удалите всю смазку и масла (см. Раздел 3.3)
	Образование вздутий во время обработки, которые могут лопнуть во время процесса отверждения	Используйте более мелкий материал сита Понизьте скорость работы резинового валика Добавьте вещество, повышающее текучесть, или растворить на припойный трафарет Обратитесь к поставщику для оптимизации параметров фильтрации

Обесцвечивание	Недостаточная обработка	Используйте рекомендованный поставщиком
_	припойного трафарета,	отвердитель для полимерного покрытия и
	приводящая к агрессивному	цикла смешивания для двухсоставных
	воздействию воды и флюсов	систем
		Соблюдайте время просушки и температуру,
		рекомендованную поставщиком
		Соблюдайте время поддержания
		температуры отверждения для холодных
		плат перед запуском таймера
		Не открывайте печь во время цикла
		отверждения
		Устраните участки недогрева в печи
		Обеспечьте надлежащую вентиляционную
		струю через печь для удаления паров
		растворителей и проверьте вентиляционную
		систему на предмет засорения
		Выполняйте мониторинг температуры и
		очистку в печи
		Испытание на отверждение
		метиленхлоридом не является
		единственным критерием для определения
		полного отверждения (см. IPC-SM-840B)
	Неполное удаление остатков	(пост-чистка растворителем)
		Используйте хлорированный углеводород
		спиртовой азеотроп для удаления оба типа
		загрязнителя
		Не используйте фторуглеродовые
		растворители – они наименее эффективны
		Проверьте очистительное оборудование на
		предмет засорения распылительного сопла и
		другие механические неисправности
		Полностью удалите флюсы в течение 10
		минут после пайки
		(пост-очистка водой)
		Поддерживайте водородный показатель
		омыляющего раствора между 10,5-11,8, так
		как низкие значения могут привести к
		недостаточной очистке, высокие значения
		ухудшат компоненты и покрытия
		Поддерживайте достаточный уровень
		напорного распыления для смывания

неомыляемых смоляных кислот

Замените выработанную чистящую жидкость

Тщательно очистите платы в течение 10 минут после пайки для облегчения очистки

Добавьте промывочные кислоты в воду для более эффективного удаления остатков

Правильная предварительная очистка позволит сделать выбор флюсов только на основе критерия пайки, чем на возможностях очитки. Рекомендуется использовать комнатную температуру, водорастворимый, малодымный, некарбонизирующий, малопенящийся флюс.

Хорошая предварительная очистка позволяет выполнять пайку с менее агрессивной флюсующей системой, таким образом, создавая плату, которую легче чистить после нивелирования припоя. В свою очередь обеспечивается хорошо паяемая и чистимая плата после сборки.

3.9.3 Флюсование Первое требование данной обработки создание сухой панели перед флюсованием. Это подходит для нового поколения флюсов, имеющих лучшие характеристики смачивания, а гакже снижает время выдержки при нивелировании пайки, так как воду не обязательно выпаривать перед предварительным нагревом (в случае применения такового) или при погружении припоя.

Этап оголения, очистки или удаления излишков флюса также полезен для снижения времени выдержки и количества остагков, которые могут остаться внутри припоя. Существует компромиссное соотношение для количества наносимого флюса, паяемостью и остатками. плате должен быть достаточный флюс предотвращения комкования припоя. Более определенное количество излишков флюса способствует нивелированию платы и минимизирует окисление на поверхности припоя. Надлежащее содержание припоя устранит карбонизированные или ухудшенные остатки флюса

Флюсы комнатной температуры используются, благодаря их напряжению нижней поверхности, которая содержится в исправности во время множественных операций. Однако, если используется предварительный нагрев нужно контролировать температуру нагревательного элемента, чтобы поддерживать соответствующую температуру активации флюса на поверхности плать (часто зависит от конструкции платы) Необходимо избегать высоких температур, которые могут привести к

отложению остатков, загрязняющих припой и, которые очень сложно удалить (очистить) с платы или, что наиболее важно, могут вызвать возгорание из-за самовоспламенения флюсов.

3.9.4 Покрытие припоя Нанесение припоя простое. Плата погружается в расплавленный припой при температуре, варьирующейся от 232°C до 260°C, в зависимости коэффициента олова свинца, беспримесности и точности оборудования. Оптимальный 238°С - 250°С. Время выдержки лиапазон от 2 до 8 сек., в зависимости от мощности тепловой нагрузки платы (определяется толщиной платы, количеством металлических слоев и процентом площади «земляного» слоя) и беспримесности припоя. Содержание меди в припое должно быть ниже 0,3% по весу. Анализ припоя следует проводить на регулярной основе.

3.9.5 Нивелирование припоя Отделение излишков припоя выполняется с использованием специальных воздушных жиклеров, горячего воздуха или жидкости. Последнее является высокотеплостойким маслом со стабилизацией при расщеплении (горячее масло). При использовании горячего воздуха воздушное давление для удаления излишков припоя может регулироваться в зависимости от гребуемых результатов. Толщина, яркость и равномерность в отверстиях и сглаженность покрытия прилоя зависит от воздушного давления, температуры конфигурации подачи воздуха, воздуха и угла погружения

При нивелировании припоя горячим маслом корректировка зависит от используемой жидкости. Спорным остается вопрос, какой тип нивелирования наилучший для каждого отдельного припоя, но удовлетворительные результаты получаются в большинстве случаев

3.10 Очистка после нивелирования припоя Тип и степень очистки зависят от предыдущих этапов процесса ниве: ирования припоя. Припой должен быть твердым, т.е. полностью охлажденным до промывки. Во время этапа очистки удаляются остатки флюса с плат для

большинства водорастворимых флюсов Двухэтапная промывка теплой водой с мягким моющим средством влечет за собой многоэтапную, каскадную, противоточную, распылительную промывку и полную просушку Мягкая цетка с нейлоновыми щетинками может быть при необходимости использована на первом этапе. Иногда может использоваться деионизированная вода, нагретая до 60°С.

Необходимо выполнить капельные испытания и попытаться контролировать эти процессы «Внешний вид» не самый главный критерий, так как неправильная обработка на данном этапе может привести к поломкам из-за высокой удельной проводимости поверхности в то время, как остатки флюса быстро разрушаются плату на хранении Параграфы 3 5.3, 3.5.4 и 3 5.5 описывают испытания на чистоту.

- **3.11** Проблемы с припоем после нивелирования В таблице 2 представлен список решений для нанесенного припойного трафарета на голую медь после нивелирования припоя.
- **4.0** Припойный графарет на олове/свинце В этом процессе травленный резист, обычно олово/свинец, оплавляется (расплавляется) таким образом, чтобы медная схема была покрыта припоем.

Поскольку используются различные типы плавящих жидкостей, необходимо полностью удалить их для обеспечения чистой, сцепляющей поверхности для максимального сцепления припоя. В разделе 4 дается подробное описание этих методов. См. рисунок 2, где дана технологическая схема процесса.

- 4.1 Очистка от плавящей жидкости Очистка должна напрямую соответствовать блоку плавления эффективного удаления водорастворимых жидкостей, обычно используемых для плавления голых плат Многоэтапная. противоточная, каскадная, распылительная промывка лучше всего подходит для окончательной деионизированной очистки волой Дополнительную чистоту можно получить, используя промывочные средства в рециркулирующем распылении, следуя рекомендациям поставщика.
- 4.1.1 Остатки и проблемы Существует два типа проблем с оловянно-свинцовыми платами с нанесенным припойным графаретом. Это паяемость и чистота под припойным трафаретом. Паяемость это способность припоя проникать через отверстия и сквозь платы Она описана в IPC-S-804. Остатки флюса в отверстиях, вызывающие проблемы с паяемостью, могут быть полярными и неполярными, органическими или ионными. Тяжелые оксиды припоя также могут вызвать проблемы с

паяемостью Степень чистоты должна быть определена до нанесения припойного трафарета, так как недостаточно очищенные платы имеют короткий расчетный срок эксплуагации и функциональные сбои Остатки флюса ионной природы (кислоты) также вызывают коррозию Органические остатки могут быть гигроскопическими, стать ионными с поглощением воды, что также приведет к сбоям.

- **4.1.2** Методы испытаний на обнаружение остатков Два типа методов испытаний ионная экстрагирование (см. 3.5.3) и сопротивление изоляции поверхности (см. 3.5.5).
- 4.1.3 Метод удаления Все платы должны быть тщательно промыты в каскадной, прогивоточной распылительной линии Если методы испытаний выявляют дополнительную очистку, можно добавить промывочные средства на щелочной основе в очистительную систему. Если необходима очистка щеткой, ее следует проводить только мягкой неабразивной щеткой, чтобы не размазать припой.
- **4.2 Обращение с платой** Плату следует всегда держать за края Необходимо выбрать подходящий тип перчаток

Неверный выбор перчаток дает ложное чувство безопасности, поскольку некоторые перчатки оставляют волокна на плате. Некоторые перчатки впитывают смазку, которая может быть передана плате.

Хранение на стойке наиболее приемлемый метод для обрабатываемых плат. Платы следует хранить в атмосфере с низкой влажностью и отсутствием химических веществ.

4.3 Очистка до нанесения припойного графарета Для обеспечения сцепления припойного трафарета плавленой платой требуется кондиционирование поверхности до нанесения припойного трафарета. Это возможно выполнить механическими и химическими средствами. Пемза не подходит для оплавленного припоя. Очистка щеткой также не рекомендуется. Платы с образованием тяжелых оксидов могут быть очищены восстановителем припоя В этом случае необходимо следовать инструкциям поставщика И тшательно промывать Окончательная промывка после процедур должно соответствовать рекомендациям п. 3.4.4

IPC-SM-839

•

Проблема	Причина	Решение ІРС-ЅМ-839
Комкование/сморщивание припоя	Плата слишком сухая	Нанесите больше флюса
припол	Припойный трафарет нанесен не	Уведичьте время выдержки для тепловых
•	полностью	графаретов и увеличьте энергию для УФ графаретов
	Несовместимость	Используйте больше вязкого флюса
	поверхностного натяжения	
	флюса из-за слишком сильного	
	испарения растворителя	
Сквозное металлизированное отверстие не запаяно	Оловянные/свинцовые остатки на меди в отверстиях	Пероксидный тип – свинцовые фторидные остатки
		1 Увеличьте время выдержки в очищающем растворе
		2 Пополните/замените очищающий раствор
		Непероксидный тип неполное удаление медно- оповянного интерметаллического слоя
		1 Увеличьте время выдержки во вторичном очищающем растворе
		2 Пополните/замените очищающий раствор
	Остатки сухой пленки припойного трафарета	Убедитесь, что момент проскока разработчика верен
	разработчика	Beper.
		Определите эффективность промывки после разработки
Наплавленные слои запаяны не	Остаток припойного трафарета	Обратитесь к поставщику для улучшения
полностью	на наплавленном слое	процесса нанесения припойного трафарета
		Используйте кислотный предварительный
		очиститель, производящий низкое
		микротравление и не оказывающий агрессивного воздействия на ранее паянные платы
Отсутствие смачивания припоя	Медная поверхность может быть	Выполните п. 3.5.4 для обнаружения органики.
	загрязнена органическими	Повторите процедуру очистки в разделе 3.4 или
	остатками	выполните иную процедуру, устраняющую органические остатки
Ванития причатиля	<u> </u>	
Вздутия припойного трафарета плохое сцепление	Недостаточное нанесение припойного трафарета	Используйте рекомендованный поставщиком отвердитель для полимерного покрытия и цикла
-papapeta monoc eqemente	(трафареты, нанесенные	смешивания для двухсоставных систем
	термически)	Соблюдайте время просушки и температуру,
		рекомендованную поставщиком
		Соблюдайте время поддержания температуры
		отверждения для холодных плат перед запуском

		таймера
-		Не открывайте печь во время щикла отверждения
		Устраните участки недогрева в печи
		Обеспечьте надлежащую вентиляционную струю через печь для удаления паров растворителей и проверьте вентиляционную систему на предмет
		засорения
F		Выполняйте мониторинг температуры и очистку в печи
		Испытание на отверждение метиленхлоридом не является единственным критерием для определения полного отверждения (см. IPC-SM- 840B)
	Неполное нанесение УФ трафарета	Соблюдайте рекомендованный поставщиком энергетический уровень для отверждения толщины покрытия
		Регулярно очищайте лампы, проверяйте уровень накала в рамках повседневного ухода и изменяйте его при необходимости, обычно 1000
		часов
		Контролируйте температуру в ультрафиолетовой лампе во избежание излишнего нагрева платы
	Медная поверхность неправильно очищена	Определите наличие интерметаллических и/или органических остатков
		Измените метод очистки как то, тип щетки, давление щетки, промывка или просушка.
		Дополнительно используйте микротравление перед очисткой щеткой
Плохие электрические свойства	Неполное удаление флюсов, содержащих неионные и ионные	(пост-чистка растворителем)
	загрязняющие вещества	Используйте хлорированный углеводород спиртовой азеотроп для удаления оба типа загрязнителя
		Не используйте фторуглеродовые растворители — они наименее эффективны
		Проверьте очистительное оборудование на предмет засорения распылительного сопла и другие механические неисправности
		Полностью удалите флюсы в течение 10 минут после пайки

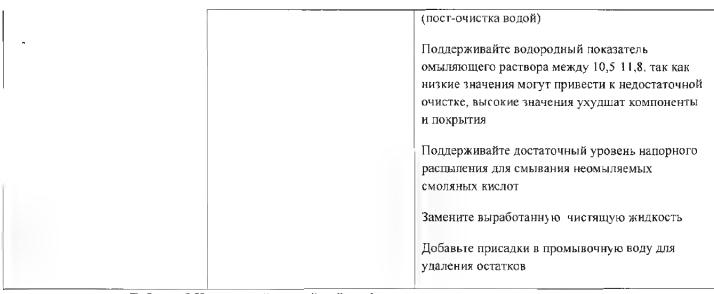


Таблица 2 Нанесенный припойный трафарет после нивелирования припоя

- 4.3.1 Механические методы Олово свинец обычно слишком мягкие для абразивной очистки, но ее можно провести очень осторожно. Очистительное оборудование с мягкими, неабразивными щетками можно использовать, если контактное давление минимизировано во избежание повреждений схем и искажения металла. Никогда не используйте скруббер для меди, поскольку возникнет последующее загрязнение.
- **4.3.2 Очистка распылением** Рекомендуется использовать соответствующее распылительное оборудование, позволяющее контактное время с чистящим средством минимум 45 сек., затем распылительная промывка минимум 15 сек
- 4.3.2.1 Растворитель Наилучшие результаты достигаются, когда растворители используются на этапе жидкости и пара Можно использовать типичные обезжиривающие растворители такие, как фторохлорзамещённые углеводороды и 1,1,1-трихлорэтан Использование метиленхлорида для очистки не рекомендуется, так как этот растворитель оказывает агрессивное воздействие на основание многослойного материала. Циклы очистки более 60 сек. могут повредить металлическую поверхность или основание многослойного материала.
- 4.3.2.2 Водная очистка Водная очистительные средства совместно с водной промывкой обеспечивают чистую поверхность. Промывка должна выполняться под высоким давлением. Распылительные насадки турбинного типа должны работать при 2-3 бар с теплой водой при 15 35°C. Длительность промывки должна составлять минимум 30 сек Смотрите п 3 4 4 и 3.4 5

Рисунок 2. Смотрите оригинал

- **4.4** Испытание на чистоту до нанесения припойного трафарета Смотрите п. 3.5
- 4.5 Нанесение припойного трафарета Методы и процедуры применения и нанесения припойного графарета не описаны в данном руководстве. Нанесение припойного трафарета на очищенные медные схемы должно соответствовать рекомендациям отдельно взятого поставщика.
- **4.6** Руководство по устранению неисправностей нанесенного припойного трафарета В таблице 3 представлен список проблем и решений для нанесенного припойного трафарета на оплавленное олово свинец.

#### 5.0 Примечание

**5.1 Оборудование для испытаний на чистоту** Далее представлен список доступного оборудования для испытаний на чистоту. По мере появления нового оборудования поставщики могут связаться с офисом IPC для предоставления соответствующей информации:

Альфа Металз Омега Метер, Джерси Сити, Нью-Джерси, (201) 434-6778

ЛОНКО Зиро Айон Систем, Бенсенвилль, Иллинойс, (800) 323-9625

Альфа Металз Айонограф, Джерси Сити, Нью-Джерси, (201) 434-6778

Протоник Контаминометр, Романель-сюр-Лозанн, Швейцария, (+21) 38 23 34

Кестер Солдер Айоникс 2000, Дес-Плейнс, Иллинойс, (708) 297-1600

Таблица 3 Припойный трафарет, нанесенный на оплавленный олово/свинец

Проблема	Причина	Решение
Плохое сцепление припойного трафарета (общее)	Загрязнение на поверхности платы до нанесения припойного трафарета	Следуйте процедурам очистки, описанным в разделе 4.3  Соблюдайте надлежащий уровень чистоты (раздел 3 5)
	Влага, скопившаяся под припойным трафаретом, может привести к округлым вздутиям	Просушите в печке в течение короткого времени при 71°С сразу перед нанесением трафарета  Проверьте пространство для нанесения трафарета на высокую влажность или давление обору дования водной обработки  Проверьте время хранения до нанесения припойного графарета и определите максимальное время промежуточного хранения
Плохое сцепление припойного трафарета (гермически нанесенные графареты)	Недостаточная обработка припойного трафарета - недостаточное образование поперечных связей полимерного покрытия делает его уязвимым для агрессивного воздействия флюсов, очистительных средств, тепла	Используйте рекомендованный поставщиком отвердитель для полимерного покрытия и цикла смешивания для двухсоставных систем Соблюдайте время просушки и температуру, рекомендованную поставщиком Соблюдайте время поддержания температуры отверждения для холодных плат перед запуском таймера  Не открывайте печь во время цикла отверждения Устраните участки недогрева в печи Обеспечьте надлежащую вентиляционную струю через печь для удаления паров растворителей и проверьте вентиляционную систему на предмет засорения

		Выполняйте мониторинг температуры и
		очистку в печи
		o methy b he-in
		Испытание на отверждение метиленхлоридом
		не является единственным критерием для
		определения полного отверждения (см ІРС-
		SM-840B)
Плохое сцепление припойного	Недостаточная обработка	Соблюдайте рекомендованный поставщиком
трафарета (УФ нанесенные	припойного трафарета	уровень энергии для нанесения в соотношении
трафареты)	недостаточное образование	с толщиной покрытия
	поперечных связей	
	полимерного покрытия делает	Регулярно чистите лампы, определяя
	его уязвимым для агрессивного	выходную мощность в плановом порядке и
	воздействия флюсов,	изменяя ее в соответствии с требованиями
	очистительных средств, тепла	Следите за температурой в средстве нанесения
		для предотвращения перегрева платы,
		вызывающего оплавление олова/свинца
Плохое сопротивление растворителя	Недостаточная обработка	Используйте рекомендованный поставщиком
или очистительного средства	прилойного трафарета	отвердитель для полимерного покрытия и
ibin o mermenbilero epegerba	(термически нанесенные	цикла смешивания для двухсоставных систем
	трафареты)	Amount of the state of the stat
	ipuqupo 121,	Соблюдайте время просушки и температуру,
		рекомендованную поставщиком
		Соблюдайте время поддержания температуры
		отверждения для холодных плат перед
		запуском таймера
		H
		Не открывайте печь во время цикла
		отверждения
		Устраните участки недогрева в печи
		Обеспечьте надлежащую вентиляционную
		струю через печь для удаления паров
		растворителей и проверьте вентиляционную
		систему на предмет засорения
		Выполняйте мониторинг температуры и
		очистку в печи
		Испытание на отверждение метиленхлоридом
		не является единственным критерием для
		определения полного отверждения (см. ІРС-
		SM-840B)
	Недостаточная обработка	Соблюдайте рекомендованный поставщиком
	припойного трафарета (УФ	уровень энергии для нанесения в соотношении
	нанесенные трафареты)	с толщиной покрытия
		Регулярно чистите лампы, определяя
		выходную мощность в плановом порядке и
		изменяя ее в соответствии с требованиями,

	обычно каждые 1000 часов
	Следите за температурой в средстве нанесения для предотвращения перегрева платы
Неправильный тип припойного графарета	Используйте припойный трафарет, соответствующий уровню производительности, описанному в IPC-SM-840B
Несовместимые химические средства очистки	Найдите совместимую комбинацию трафарет/очистительное средство

Таблица 3 Припойный трафарет, нанесенный на оплавленный олово/свинец (продолжение)

Проблема	Причина	Решение
Плохие электрические свойства	Загрязнение поверхности платы до применения припойного трафарета	Выполняйте определенные процедуры очистки Проведите испытание на чистоту до применения припойного трафарета Повторно проверьте удельное сопротивление промывочной поды
	Недостаточное отверждение припойного трафарета, обработанного ультрафиолетовым излучением	Увеличьте время отверждения Проверьте калибровку ультрафиолетовой печи
Плохое косметический вид - точечные дефекты покрытия, лунки или «рыбьи глаза»	Масляное загрязнение на поверхности до применения припойного трафарета	Тшательно удалите всю смазку и масла (см. Раздел 3.3)
	Образование вздутий во время обработки, которые могут лопнуть во время процесса отверждения	Используйте более мелкий материал сита Понизьте скорость работы резинового валика Добавьте вещество, повышающее текучесть, или растворить на припойный графарет Обратитесь к поставщику для оптимизации параметров фильтрации
Обесцвечивание	Недостаточная обработка	Используйте рекомендованный поставщиком

припойного трафарета, отвердитель для полимерного покрытия и приводящая к агрессивному цикла смешивания для двухсоставных систем воздействию воды и флюсов Соблюдайте время просушки и температуру, рекомендованную поставщиком Соблюдайте время поддержания температуры отверждения для холодных плат перед запуском таймера Не открывайте печь во время цикла отверждения Устраните участки недогрева в печи Обеспечьте надлежащую вентиляционную струю через печь для удаления паров растворителей и проверьте вентиляционную систему на предмет засорения Выполняйте мониторинг температуры и очистку в печи Испытание на отверждение метиленулоридом не является единственным критерием для определения полного отверждения (см. IPC-SM-840B) Неполное удаление остатков (пост-чистка растворителем) Используйте хлорированный углеводород спиртовой азеотроп для удаления оба гипа загрязнителя Не используйте фторуглеродовые растворители - они наименее эффективны Проверьте очистительное оборудование на предмет засорения распылительного сопла и другие механические неисправности Полностью удалите флюсы в течение 10 минут после пайки (пост-очистка водой) Поддерживайте водородный показатель омыляющего раствора между 10,5-11,8, так как низкие значения могут привести к недостаточной очистке, высокие значения ухудшат компоненты и покрытия Поддерживайте достаточный уровень напорного распыления для смывания неомыляемых смоляных кислот

		Замените выработанную чистящую жидкость Тщательно очистите платы в течение 10 минут после пайки для облегчения очистки Добавьте промывочные кислоты в воду для более эффективного удаления остатков
Плохая паяемость	Остатки припойного трафарета на плате	Проверьте печку на сбалансированный размер нагружения с достаточным уровнем вентиляции  Используйте специализированную печку для предотвращения перекрестного загрязнения  Обратитесь к поставщику для улучшения процесса нанесения припойного графарета

## 2.3.25 Удельное сопротивление экстракта селективной сольвентной очистки

1.0 Область применения Данный метод испытаний предназначен для определения наличия ионизируемых загрязнителей поверхности на платах и монтажных схемах с печатными соединениями Базой для испытания является изменение электрического удельного сопротивления используемого растворителя для промывки платы или монтажной схемы. Удельное сопротивление снижается, когда загрязнители такие, как соли, остатки флюса, травители или моющие средства растворяются.

#### 2.0 Применимые документы

- 2.1 Смотрите 6 1, Ссылки
- 3.0 Образец для испытаний Любая печатная плата или монтажная схема достаточной площади для нанесения растворителя при определении удельного сопротивления.
- 4.0 Оборудование для испытаний

- **4.1** Разнообразное лабораторное оборудование такое, как мензурки, воронки, промывалки и бутылки. Подобное оборудование может быть стеклянным или полиэтиленовым, но необходимо, чтобы все используемые в процедурах приборы были безупречно чистыми.
- **4.2** Мост для измерения малых сопротивлений, модель Барнстеда РМ-70СВ или эквивалент.
- **4.3** Ячейка для измерения электрической проводимости, модель Бекмана CEL-A01-Y87-CERT с постоянной элемента К 0.10/см или эквивалент.
- 4.4 Промывной раствор, состоящий на 75% по объему из изопропилового спирта, 25% по объему дистиплированная вода с минимальным удельным сопротивлением 6,0 х  $10^6$  Ом/см.
- **4.5** Линейный датчик, например, кронциркуль, способный измерить площадь печатной платы или монтажной схемы до примерно 25,4 мм<sup>2</sup>.

#### 5.0 Процедура испытания

- **5.1** Определите площадь поверхности печатной платы или монтажной схемы, включая обе стороны платы и вычислите площадь всех компонентов, установленных на нее.
- **5.2** Поместите образец для испытаний внутрь воронки соответствующего размера, расположенной над накопительной мензуркой.
- **5.3** Используйте 100 миллилитров промывочного раствора на каждые 250 мм<sup>2</sup> площади платы или схемы и направьте его тонкой струей с обеих сторон образца. Промывку следует проводить в течение минимум 1 минуты.
- **5.4** Измерьте удельное сопротивление собранного промывочного раствора в соответствии с инструкциями изготовителя моста для измерений малого сопротивления.

#### 6.0 Примечания

6 L Ссылки Эта процедура испытаний, вкиючая приготовление раствора процедуру очистки лабораторного оборудования, занесены в Отчет об исследовании материалов № 3-72. «Монтажные схемы: Обнаружение ионных загрязнителей». Заявку получении копии этого отчета следует выслать по адресу:

Freedom of Information Act Office

Naval Avionics Center

6000 East 21st Street

Indianapolis, IN 46219-2189

## 2.3.26 Ионизируемое обнаружение загрязнителей поверхности (динамический метод)

#### 1.0 Облас ть применения

- 1.1 Цель Метод испытаний устанавливает процедуру определения количества поверхностной ионного грунта на печатной плате или монтажной схеме. Грунт должен быть растворим в воде, спирте или смеси из воды со спиртом. Определение может быть выполнено на количественной или качественной основе.
- 1.2 Ограничения Оборудование не дифференцирует различное содержание ионов Оно определяет их наличие и классифицирует их согласно их подвижности. Соли с более высокой ионной подвижностью весят больше, чем соли с низкой.
- 1.3 Применение Данный метод имеет применение в качестве инструмента контроля качества и как метод разработки и оценки параметров очистки. Будучи инструментом контроля качества, он может использоваться для проверки деталей при определении их соответствия предустановленным уровням чистоты. При разработке параметров эта процедура используется для оценки эффективности растворителей, а также для утверждения уровней допустимой чистоты

#### 2.0 Применимые документы Отсутствуют

- 3.0 Образец для испытаний Любая предварительно обработанная или обработанная печатная плата или монтажная схема.
- 4.0 Оборудование для испытаний Устройство динамического измерения, экстратирующее ионы с поверхности и проверяющее удельную проводимость промывочного раствора. Растворитель прокачивается через цепь рециркуляции, включающую пластмассовый бак, ячейку для измерения электрической проводимости раствора и ионообменную колонну для удаления все

следов ионов из растворителя перед попаданием его в бак Ячейка для измерения электрической проводимости раствора компенсируют температурные воздействия во избежание вариаций показаний, вызванных перепадами температуры. Насос-дозатор прокачивает раствор через цепь с постоянным коэффициентом. Регистрирующее устройство записывает изменения удельной проводимости со временем (Смотрите примечания).

#### 5.0 Процедура

5.1 Растворители Оборудование можно использовать с чистой водой или смесью воды/спирта. Вода используется, когда необходимо измерить водорастворимые соли. Использование чистой воды приводит к появлению мерной жидкости с изначальной проводимостью около 0,1 микроома (10 мегаом).

Растворители на основе воды/спирта используются, когда неполярный грунт герметизирует или иным образом перекрывает водорастворимый ионный грунт Успешно спирты. Предпочтительные применялись разные растворители используют N-пропанол или изопропанол растворитель Из-за спиртовой высокой диэлектрической постоянной спиртов обычно излишки спирта в смеси ухудшают дискретность измерения. Для получения максимальной дискретности и удаления достаточным количеством спирта всех неполярных остатков рекомендуется использовать смесь, состоящую из 40% (по объему) из N-пропанола и 60% воды или 50% (по объему) изопропанола и 50% воды. Смеси, превышающие по объему 75% изопропанола, успешно используются.

- 5.2 Калибровка Как только жидкость в системе установила стабильный уровень удельной проводимости, точное количество калибровочного раствора вводится в контрольный раствор. интегрирует Система затем переменные удельной проводимости контрольного раствора, быстроты подачи насоса, области образца и времени с уровнем загрязнения, указанным как эквивалентные микрограммы хлорида натрия (на удельный вес) образца
- **5.3 Испытание** Как только система была откалибрована в соответствии с п. 5.2, образец для испытаний погружается в бак. Не следует прикасаться к образцу и прочим устройствам, погружаемым в бак. Грязь на пальцах содержит высокоподвижный ионный грунт, что приведет к ложным показаниям

Во время проведения измерения удельная проводимость раствора отклонится от базовой линии проводимости и затем постепенно вернется обратно. Когда удельная проводимость вернется к базовой линии, невозможно

будет удалить дополнительный грунт и измерение будет завершено. Кривая для образца затем интегрируется согласно разделу 5.2. Кривая калибровки используется для определения количества загрязнения.

- 5.4 Оценка Без образца в баке состояние будет установлено, где удельная проводимость растворителя, измеренная ячейкой, достигнет постоянно низкого значения. С помещением загрязненного образца в бак показание удельной проводимости, измеренное ячейкой, будет быстро расти Образец остается погруженным в растворитель, пока удельная проводимость растворителя не вернется в изначальное состояние равновесия. В этой точке нельзя удалять ионный материал с образца
- 5.4.1 Теория метода измерения Общее количество ионного материала, удаленного с образца может быть связано с интегралом показаний удельной проводимости через период времени, необходимый для растворения материала и фильтрации его через систему следующим образом: В любой момент, t, число молей, n, ионного ячейки материала внутри измерения удельной проводимости равно  $n_t = V_\epsilon X C_t$ , где  $C_t$ концентрация ионов и  $V_c$ объем ячейки, являющийся постоянным. Через бесконечное количество времени общее число молей ионов, проходящих через ячейку, N, будет:

$$N = \int_{0}^{\infty} n_{t} dt - V_{c} \int_{0}^{\infty} C_{t} dt$$

Поскольку мы имеем дело с очень низкими концентрациями  $(10^4 N)$  мы можем допустить полную ионизацию. Таким образом:

#### Удельная проводимость L kC

(допуская, что присутствует одна соль). Конечно, различные ионные соли с разной ионной подвижностью покажут разную проводимость для данной концентрации.

$$N = kV_c \int_{0}^{\infty} L dt$$

Если показания монитора и регистратора линейны в отношении L, тогда, согласно последнему уравнению, площадь под кривой проводимости-времени, показанной регистратором, является линейной функцией N, общим количеством ионов, удаленных с образца.

5.4.2 Обработка данных испытаний Число, полученное из раздела 5.3, будет ионным загрязнением поверхности платы в переводе на эквивалентные микрограммы хлорида натрия (Если калибровочный раствор содержал другую соль, а не хлорид натрия, число будет в единицах эквивалентных микрограммов этой соли) Обычной практикой является разделение этой цифры на общую область с обеих сторон печатной платы или монтажной

схемы и представление данных в единицах эквивалентных микрограммов соли на единицу площади.

Используя шкалу измерений на основе только одной соли, т е. хлорида натрия, ионные загрязнители измеряются, исходя из их ионной подвижности. Чем более мобильным или активным является ион, тем вероятнее то, что он вызовет проблему. Таким образом, данный метод испытаний не дифференцирует различные ионы и является эффективным способом определения количества множества ионов.

#### 6.0 Примечания

- 6.1 Другие области применения Поскольку оборудование измеряет ионную активность добой детали или раствора, содержащих ионный материал, оно может быть использовано для различных целей. Далее спедует их частичный список:
- 1. Входной контроль оплавленных оловянных/свинцовых плат на полное отсутствие загрязняющих остатков.
- 2. Измерения чистоты поступающих или редистиллированных растворителей.
- 3 Измерение количества активированного смоляного флюса, растворенного в отстойнике установки для обезжиривания паром.
- 4. Измерение уровня активности активированного емоляного флюса.
- **6.2** Возможность получения Описанное оборудование или его эквиваленты могут быть приобретены коммерческим путем. Источник Alpha Metals Inc (Название оборудования Ionograph  $^{\Gamma M}$ ).

## 2.3.26.1 Ионизируемое обнаружение загрязнителей поверхности (статичный метод)

#### 1.0 Область применения

- 1.1 Цель Метод испытаний устанавливает процедуру определения количества поверхностной ионного грунта на печатной плате или монтажной схеме. Грунт должен быть растворим в воде, спирте или смеси из воды со спиртом. Определение может быть выполнено на количественной или качественной основе.
- 1.2 Ограничения Оборудование не дифференцирует различное содержание ионов. Оно определяет их наличие и классифицирует их согласно их подвижности. Соли с более высокой ионной подвижностью весят больше, чем соли с низкой.
- 1.3 Применение Данный метод имеет применение в качестве инструмента контроля качества и как метод разработки и оценки параметров очистки. Будучи инструментом контроля качества, он может использоваться для проверки деталей при определении их соответствия предустановленным уровням чистоты. При разработке параметров эта процедура используется для

оценки эффективности растворителей, а также для утверждения уровней допустимой чистоты.

#### 2.0 Применимые документы Отсутствуют

- 3.0 Образец для испытаний Любая предварительно обработанная или обработанная печатная плата или монтажная схема.
- 4.0 Оборудование для испытаний Измерительное устройство на основе экстракции ионов в статичном растворе. Раствор очищается через ионообменные колонны до значения высокого удельного сопротивления до начала испытаний. Во время испытания используется рециркуляционная цепь, состоящая из раствора в баке, накачиваемого для обеспечения возмущения, через измерительный электрод и обратно в испытательную ячейку, проходя через иснообменные колонны. Поэтому и гермин «статичный». Для записи результатов наряду с регистратором или принтером применяется измеритель или цифровой дисплей. Резистивиметр компенсирует температуру

#### 5.0 Процедура

**5.1** Растворители/системы Оборудование можно использовать со смесью спирта/воды в пропорции 50% на 50% или 75% спирта на 25% воды плюс-минус 10%.

Растворители на основе воды/спирта используются, когда неполярный грунт герметизирует или иным образом перекрывает водорастворимый ионный грунт. Успешно применялись разные спирты. Предпочтительные растворители используют N-пропанол или изопропанол растворитель. Из-за спиртовой высокой ĸaĸ диэлектрической постоянной спиртов обычно излишки спирта в смеси ухудшают дискретность измерения. Для получения максимальной дискретности и удаления достаточным количеством спирта всех неполярных остатков рекомендуется использовать смесь, состоящую из 50% спирта (по объему) и 50% воды или 75% спирта (по объему) и 25% воды Рекомендуемая оптимальная смесь 75% спирт/25% вода.

- 5.2 Калибровка Как только жидкость в системе установила высокий уровень чистоты (20 мегаом или выше) точное количество калибровочного раствора измеряется контрольном растворе Система затем измеряет удельную, которая может быть рассчитана в окончательный уровень загрязнения в эквивалентных микрограммах хлорида натрия.
- **5.3 Испытание** Как только система была откалибрована в соответствии с п. 5 2, и раствор очищается до значения высокой удельной проводимости, можно проводить испытание путем погружения образца в ячейку. Не следует

прикасаться к образцу и прочим устройствам, погружаемым в бак. Грязь на пальцах содержит высокоподвижный ионный грунт, что приведет к ложным показаниям.

После погружения образца и во время проведения измерений удельная проводимость раствора будет понижаться. Испытания завешается в заранее выбранный момент времени или (в зависимости от модели оборудования) автоматически прерывается при отсутствии изменений в уровне загрязнения.

- 5.4 Оценка Без образца в баке состояние будет установлено, где удельная проводимость растворителя, измеренная ячейкой, достигнет максимального значения в мегаомах на измерителе или дисплее. При введении загрязненного образца в ячейку, показание удельной проводимости пойдет на спад. Образец остается погруженным в раствор на предустановленный период или при установке автоматического таймера до отсутствия изменений в уровне загрязнения.
- 5.4.1 Теория метода измерения Вся количество удаленного с образца ионного материала может иметь отношение к формуле математического расчета загрязнения как эквивалента NaCl в микрограммах на удельный вес, где:
- D Объем раствора в контрольной ячейке
- В Конечная удельная проводимость в мегаомах
- С ~ Площадь поверхности образца (L x W x 2)
- G Исходная удельная проводимость в мегаомах
- А % спирта в контрольном растворе
- Е эмпирическая постоянная -0,008175
- F Эмпирическая постоянная 0,3093028

#### Формула:

D C x 10 (A E + F) x (1/B - 1/G) Микрограммы NaCl/ удельный вес

Расчет можно также произвести без вычитания начального загрязнения (1/G), учитывая то, что оно достаточно мало, чтобы им пренебречь.

5.4.2 Обработка данных испытаний Число, полученное из раздела 5 3 будет ионным загрязнением поверхности платы в исчислении на эквивалентные микрограммы хлорида натрия. (Если калибровочный раствор содержал другую соль, а не хлорид натрия, число будет в единицах эквивалентных микрограммов этой соли) Обычной

практикой является разделение этой цифры на общую область с обеих сторон печатной платы или монтажной схемы и представление данных в единицах эквивалентных микрограммов соли на единицу площади.

Используя шкалу измерений на основе только одной соли, т.е. хлорида натрия, ионные загрязнители измеряются, исходя из их ионной подвижности. Чем более мобильным или активным является ион, тем вероятнее то, что он вызовет проблему. Таким образом, данный метод испытаний не дифференцирует различные ионы и является эффективным способом определения количества множества ионов.

#### 6.0 Примечания

- 6.1 Другие области применения Поскольку оборудование измеряет ионную активность любой детали или раствора, содержащих ионный материал, оно может быть использовано для различных целей Далее следует их частичный список:
- 1. Входной контроль оплавленных оловянных/свинцовых плат на полное отсутствие загрязняющих остатков
- 2. Измерения чистоты поступающих или редистиллированных растворителей.
- 3. Измерение количества активированного смоляного флюса, растворенного в отстойнике установки для обезжиривания паром
- 4. Измерение уровня активности активированного смоляного флюса.
- **6.2 Возможность получения** Описанное оборудование или его эквиваленты могут быть приобретены коммерческим путем Источник Alpha Metals Inc. (Название оборудования Omegameter  $^{\text{TM}}$ ).

- 2.3.38 Испытание на обнаружение органических загрязнителей поверхности (метод собственной разработки)
- 1.0 Область применения

- 1.1 Этот простой неразрушающий метод испытания используется для определения наличия органических неионных загрязнителей на голой печатной плате или готовой поверхности монтажной схемы на производственном участке, выполняемый техническим персоналом с ограниченным допуском.
- 1.2 В ходе испытания не будет установлен тип загрязнителей, а гакже смеси загрязнителей не будут разделены на различные структурные составляющие (см. метод испытаний 2.3.39). Настоящая видимая граница обнаружения органических загрязнителей этим метод составляет примерно 10 микрограмм/см<sup>2</sup>.

#### 2.0 Применимые документы

IPC-TP-383 «Загрязнение органической поверхности Идентификация, Характер, Удаление, Воздействие на сопротивление изоляции и Сцепление конформного покрытия».

**IPC-TM-650** Метод испытаний 2.3.39. «Испытание на определения гипа органических загрязнителей поверхности (Лабораторный аналитический метод)».

#### 3.0 Образец для испытаний

**3.1** Голая печатная плата или законченный сборочный узел толщиной минимум 50 мм x 75 мм.

#### 4.0 Приборы и материалы

- 4.1 Контрольная жидкость, ацетонитрил для жидкостной хроматографии высокого давления. Другие соответствующие растворители могут быть использованы по согласованию пользователя и поставщика.
- 4.2 Предметные стекла 25 мм х 75 мм
- **4.3** Обычная стеклянная медицинская пипетка с резиновой насадкой
- **4.4** Резиновая насадка на 60 мл для стеклянной медицинской пипетки
- 4.5 Перчатки, не содержащие льна

#### 5.0 Процедура

#### 5.1 Подготовка

**5.1.1** Очистите предметное стекло, промывая его контрольной жидкостью, просушите его как описано в п. 5.2. Убедитесь, что оно не содержит остатков как описано в п. 5.4.

**5.1.2** Держите образец для испытаний за края под углом над очищенным предметным стеклом Образец не должен касаться стекла.

#### 5.2 Испытание

- **5.2.1** Медленно капайте 0,25 0,50 мл контрольной жидкости на образец, омывая небольшую площадь поверхности образца, чтобы жидкость затем попадала на предметное стекло Не касайтесь пипеткой контрольного образца. Смотрите рисунок 1
- **5.2.2** Выпарите контрольную жидкость слабой струей сухого, бесмасляного воздуха в хорошо проветриваемом вытяжном шкафу (пароуловителе) Если сжатый воздух или азот, упомянутый выше, не доступны, слабую воздушную струю можно создать, используя большую резиновую насадку и стеклянную трубку.
- **5.2.3** Быстрого испарения контрольной жидкости следует избегать, чтобы предотвратить охлаждение испарением предметного стекла и последующей конденсации влаги из воздуха на стекле
- **5.2.4** Подвод тепла для испарения воды может вызвать частичное или полное улетучивание остатков и свести на нет результаты.
- **5.2.5** Повторите процедуру, пока на предметном стекле не накопится 2 мл контрольной жидкости на квадратный дюйм площади поверхности обмытого образца.

#### 5.3 Проверка

- **5.3.1** Распределите такое же количество контрольной жидкости на втором предварительно очищенном предметном стекле и дайте ей испариться.
- **5.3.2** Обследуйте стекло как описано в п. 5.4. Остатков не должно быть видно.
- **5.3.3** Если остатки видны, контрольная жидкость не является достаточно чистой для испытания.

#### Рисунок 1. Сбор загрязнителей на предметном стекле

- **5.3.4** Нечеткое очертание контрольной жидкости может быть видно на стекле Это необязательно указывает на наличие загрязнения.
- **5.4 Оценка** Держите предметное стекло на края и наклоните его так, чтобы сверху падающий свет отражался от поверхности. Остатки (при наличии), смытые с образца, будут четко видны

#### 6.0 Примечания

- 6.1 При проведении данного испытания была использована контрольная жидкость ацетонитрил для жидкостной хроматографии высокого давления от компании Fisher Scientific Co. Можно использовать эквивалентные материалы от других поставшиков, при условии, что поспе выпаривания отсутствуют какие-либо остатки как описано в данном методе
- 6.2 Американская конференция правительственных и промышленных гигиенистов одобрила величину порогового предела ацетонитрила, равную 40 промилле Рекомендуется выполнять нанесение и выпаривание контрольной жидкости в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу. Лица, проводящие испытание, должны быть оснащены резиновыми перчатками и защитными очками.
- 6.3 При проведении данного испытания использовались простые стеклянные предметные стекла (1" х 3") от компании Fisher Scientific Co., каталожный номер 12-549 Для испытания можно использовать эквивалентные стекла
- **6.4** При проведении данного испытания использовались прямые медицинские пипетки от компании Fisher Scientific Со, каталожный номер 13-700 Для испытания можно использовать эквивалентные пипетки
- 6.5 Для использования подходят резиновые насадки емкостью 60 мл от компании Fisher Scientific Co., каталожный номер 14-070D (или эквивалентные), совместимые с пипеткой.
- 6.6 Идентификация загрязнителей может быть выполнена, используя Метод испытаний IPC 2 3.39. Смотрите п. 5.3.1 Метода испытаний IPC 2.3.39.

2.3.39 Испытание на определение типа органических загрязнителей поверхности (инфракрасный аналитический метод)

#### 1.0 Область применения

1.1 Данный метод испытания на основе инфракрасного спектрофотометрического анализа используется определения природы неионных органических загрязнителей, присутствующих на поверхности печатной платы или схемы при использовании множественного полного внутреннего отражения (МПВО), как только их было обнаружено путем наличие процедуры экстрагирования растворителем, описанной в ІРС-ТМ-650, Метод испытаний 2.3.38 Данное испытание должен проводить только опытный спектроскопист.

#### 2.0 Применимые документы

IPC-TP-383 «Загрязнение органической поверхности Идентификация, Характер, Удаление, Воздействие на сопротивление изоляции и Сцепление конформного покрытия»

**IPC-TM-650** Метод испытаний 2.3.38. «Испытание на обнаружение органических загрязнителей поверхности (метод собственной разработки)».

#### 3.0 Образец для испытаний

- 3.1 Голая печатная плата или законченный сборочный узел толщиной минимум 51 мм x 51 мм
- 4.0 Приборы и материалы
- **4.1** Инфракрасный спектрофотометр, способный сканировать в 2,5 16 микронном диапазоне
- **4.2** Устройство МПВО с пластиной KRS-5 или ZnSe (см. 610).
- **4.3** Контрольная жидкость ацетонитрил для жидкостной хроматографии высокого давления. Другие

соответствующие растворители могут быть использованы по согласованию пользователя и поставщика

**4.4** Обычная стеклянная медицинская пипетка с резиновой насадкой или стеклянный шприц объемом 2 мл.

#### 5.0 Процедура

- **5.1** Прочистите пластину МПВО, намочив контрольной жидкостью мягкую ткань, затем осторожно оботрите поверхность платы, пока не будут удалены все остатки Поскольку плата KRS-5 легко царапается, стойкие пятна можно удалить ультразвуковой очисткой в ацетоне.
- **5.2** Возьмите загрязненный образец предметного стекла, полученный в Методе испытаний 2.3.38.
- **5.3 Испытание** Держите загрязненное предметно стекло за края под углом над чистой пластиной МПВО. Образец не должен касаться пластины.
- 5.3.1 Перенесите остаток с предметного стекла как описано ниже. Медленно капайте 0,25 0,50 мл контрольной жидкости на загрязненное предметное стекло, омывая поверхность поперек, чтобы затем жидкость попадала на пластину МПВО (Смотрите рисунок 1).

#### Рисунок 1 Перенос загрязнителей на пластину МПВО

- **5.3.2** Выпарите контрольную жидкость слабой струей сухого, бесмасляного воздуха в хорошо проветриваемом вытяжном шкафу (пароуловителе).
- **5.3.3** Можно выполнять аналогичные процедуры, если испытание проводится с нанесением контрольной жидкости непосредственно на голую плату или сборочный узел и отложением смытых загрязнителей на пластине МПВ (Смотрите рисунок 2).
- **5.3.4** Поместите платину МПВО в устройство МПВО Создайте инфракрасный спектр остатка в соответствии с рекомендуемым порядком работы изготовителя устройства Удалите и очистите пластину МПВО.
- **5.4** Выпарите аналогичное количество контрольной жидкости на чистой пластине МПВО для получения контрольного образца.

#### 5,5 Оценка

5.5.1 Сравните спектр испытаний и контрольный спектр.

#### Рисунок 2 Сбор загрязнителей на платине МПВО

**5.5.2** Если спектры не совпадают, контрольный образец для испытаний загрязнен

5 5 3 Химический класс загрязнителя может быть определен, исходя из основных полос спектра в таблице 1

Таблица 1 Определение класса органических загрязнителей по основным полосам инфракрасного спектра

Класс органического загрязнителя	Полосы инфракрасного спектра основных классов загрязнителей
Эфир, Алифатический	8,8 9,1
Эфир, Арильный	7,8 8,0
Карбоновая кислота	3,2 - 4,1
	5,8 - 5,9
	6,9 7,1
	10,4 10,9
Соли карбоновой кислоты	6,2 - 6,4
	7,1 7,4
Сложный эфир	5,7 5,8
	8,0 - 8,5
Амид	2,8 3,3
	5,9 - 6,5
Нитрил (циано)	4,4 – 4,5
Спирт (включая гидроксил	2,8 3,1
гликоль, полиол и т.д.)	8,7 -9,7

## **5.5.4** Смотрите рисунки 3 и 4, сравнительные примеры графиков спектра

#### Рисунок 3 Типичное сравнение спектров

#### Рисунок 4 Типичное сравнение спектров

#### 6.0 Примечания

6.1 При проведении данного испытания использовался инфракрасный спектрофотометр, модель 283 Перкина Элмера. Эквивалентные приборы от других изготовителей должны удовлетворять требованиям, если они имеют устройство МПВО. Могут понадобится другие растворители для удаления отдельных остатков.

- **6.3** При проведении данного испытания использовались прямые медицинские пипетки от компании Fisher Scientific Co., каталожный номер 13-700 Для испытания можно использовать эквивалентные пипетки.
- 6.4 Американская конференция правительственных и промышленных гигиенистов одобрила величину порогового предела ацетонитрила, равную 40 промилле. Рекомендуется выполнять нанесение и выпаривание контрольной жидкости в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу. Лица, проводящие испытание, должны быть оснащены резиновыми перчатками и защитными очками.
- 6.5 Модифицированные процедуры допускают обнаружение и идентификацию загрязняющих остатков, содержащих функциональные группы карбоновой кислоты, солей карбоновой кислоты, сложных эфиров, гидроксила, амидов или нитрилов (циано). Например, дегидроацетовая дициандиамид, кислота. незаполимеризовавшаяся эпоксидная типа смола бисфенол-А, древесная смола и длинноцепочные амиды также были распознаны на поверхностях печатных монтажных плаг
- **6.6** Хотя контрольная жидкость способна растворять очень малые количества различных неорганических соединений, их наличие обычно перекрывается гораздо более толстыми слоями органических загрязнителей
- 6.7 Быстрого испарения ацетонила следует избегать, чтобы предотвратить охлаждение испарением пластины МПВО и последующей конденсации влаги из воздуха на стекле. Подвод тепла для испарения воды может вызвать частичное или полное улетучивание остатков и свести на нет результаты. Сегодняшний предел обнаружения арилалкилового полиэфира эти методом оставляет 10 микрограммисм<sup>2</sup>.
- 6.8 Максимальные уровни органического загрязнения, допускающие надежную эксплуатацию печатных монтажных плат с различной плотностью расположения компонентов и расстояниями между проводами или проводниками, для различных загрязнителей не были установлены.
- **6.9** Сегодняшний предел обнаружения может быть легко увеличен на порядок при использовании более современного и точного оборудования и компьютерных технологий спектра.
- **6.10** Пластина KRS-5 очень гоксична; ее следует держать только в перчатках Ее следует полировать голько рекомендованной полировальной пастой для уменьшения образования вредной пыли.

IPC-SM-840 Квалификация и характерис гики перманентного полимерного покрытия (припойного трафарета) для печатных плат

IPC-CC-830 Квалификация и характеристики электрои золяционного компаунда для печатных монтажных плат

#### 3.0 Образец для испытаний

Многоцелевая контрольная плата, номер IPC-B-25 (смотрите иллюстрацию для квалификационных испытаний)

Стандартные военные пробные Y-тест-купоны для испытаний покрытий на соответствие Промежуток в Y-тест-купоне должен быть либо 25 мил линий/25 мил интервалов, либо минимальный промежуток на рабочей плате тот, который меньше.

#### 4.0 Приборы

- **4.1** Чистовая испытательная камера, обеспечивающее программирование и регистрацию окружающей среды от  $25 \pm 2$ °C до минимум  $65 \pm 2$ °C и как минимум от 90% до 98% относительной влажности
- **4.2** Источник электропитания, обеспечивающее стабильное напряжение смещения 100 В постоянного тока с допустимым отклонением ± 10%
- **4.3** Омметр, обеспечивающий считывание высокого напряжения ( $10^{12}$  Ом или выше), с испытательным напряжением 500 В
- 4.4 Металлические щипцы
- 4.5 Мягкая щетинная щетка
- **4.6** Деионизированная или дистиплированная вода (рекомендуется удельное сопротивление 2 мегаом -см)
- 4.7 Изопропаловый спирт
- 4.8 Сушильная печь, поддерживающая минимум 120 °C

#### 5.0 Испытание

#### 5.1 Условия испытания

- **5.1.1** Класс I  $35 \pm 5$  °C, минимум 90 98% отн. влаж., 4 дня (статичный)
- **5.1.2** Класс 2 50 ± 5 °С, минимум 90 98% отн влаж , 7 дней (статичный)
- **5.1.3** Класс 3 от 25 ± 2 °C до 65 ± 2 °C, минимум 90% 98% отн влаж.\*, 6 2/3 дней (цикличный)

## 2.6.3.1 Влагостойкость и сопротивление изоляции – полимерные припойные трафареты и конформные покрытия

1.0 Область применения Этот метод испытаний служит определения влагостойкости и сопротивления изоляции нанесенного полимерного припойного трафарета или конформных покрытий в соответствии с двумя отдельными заданными условиями температуры и влажности Первый - это комплекс условий для квалификационных испытаний материала, применяемого для контрольных плат IPC-В-25 после прохождения материалом сырьевых испытаний. Второе - это испытания срответствие качества материала, применимо к стандартным пробным Ү-тест-купонам. Методы электрических измерений различны для квалификационных испытаний И испытаний соответствие качеству материала в том, что для испытания на соответствие качества измерения сопротивления изоляции выполняются во время и после воздействия факторов окружающей среды

#### 2.0 Применимые документы

\*Может падать до 80% отн. влаж во время падения температуры Смотрите 5.3.5

#### 5.2 Подготовка образца

- **5.2.1** Положительная, перманентная и незагрязняющая идентификация образца для испытаний имеет первостепенное значение.
- **5.2.2** Наружный осмотр образцов для испытаний на наличие явных дефектов, как описано в IPC-A-600. Если существуют сомнения в общем качестве какого-либо образца, он должен быть забракован.

#### 5.2.3 Электрические соединения

- 5.2.3.1 Для образцов, подлежащих квалификационным испытаниям, припаяйте отдельный многожильный провод с тефлоновой изоляцией к каждой панели тест-купонов В и Е контрольного образца IPC-B-25. Эти провода будут использованы для стыковки каждой панели купона В и Е к испытательному оборудованию на поляризацию и сопротивление изоляции.
- 5.2.3.2 Для образцов, подлежащих испытаниям на соответствие качества, припаяйте одиночные многожильные провода с тефлоновой изоляцией в места соединений образцов У-тест-купонов. Эти провода будут использованы для стыковки У-образцов к испытательному оборудованию на поляризацию и сопротивление изоляции
- **5.2.4** Удаление флюса для пайки Удалите флюс со свинцовых участков следующим образом:
- 5.2.4.1 Намочите контактные выводы деионизированой или дистиллированной водой и чистите мягкой щетинной щеткой минимум 30 сек В течение подготовки образца держите образцы только за края.
- **5.2.4.2** Тщательно распылите деионизированную или дистиплированную воду. Держите образец под углом примерно 30° и распыляйте сверху донизу.
- **5.2.4.3** Намочите контрольные контактные выводы чистым изопропиловым спиртом и встряхивайте в течение 30 сек. Прочистите щетинной щеткой для удаления остатков флюса.
- **5.2.4.4** Тщательно промойте очищенную область свежим изопропиловым спиртом.
- **5.2.4.5** Просушите образцы в сушильной печи в течение 3 часов при температуре  $49-60\,^{\circ}$ C.
- **5.2.5 Хранение образцов** Если до испътания нужно хранить необработанные образцы, поместите платы в

чистых полиэтиленовые мешки и закройте их (не запаивайте).

#### 5.2.6 Покрытия

- **5.2.6.1** Нанесение Нанесите покрытие(-я) на соответствующую область образца для испытаний в соответствии с технологиями производства пользователя, как указано поставщиком. Эксплуатируйте (голые) платы как контрольные образцы во время испытаний.
- **5.2.6.2** После нанесения покрытия образцы для испытаний подлежат отверждению как указано поставщиком.
- **5.2.6.3** После отверждения голые платы и платы с нанесенным покрытием подлежат кондиционированию при лабораторной температуре окружающего воздуха в течение суток.
- **5.2.7 Чистота образцов** для испытаний Для остальной подготовки образцов и испытаний поверхность образцов либо непокрытая, либо покрытая припойным трафаретом или конформным покрытием, в зависимости от того, что испытывается, не должна подвергаться какому-либо загрязняющему воздействия.

#### 5.3 Процедура

- **5.3.1** Кондиционировать образцы при температуре 50 °C ± 5 °C без дополнительной влажности в течение суток.
- **5.3.2** Дайте образцам остынуть и сделайте изначальные измерения сопротивления изоляции при лабораторной температуре окружающей среды

Смотрите Примечание 6 3. Подайте 500 В постоянного тока на контрольные точки образца как описано в п. 5.3.2.1 омметром и считайте показания через 1 минуту.

5.3.2.1 Контрольные точки для квалификационных испытаний 1 до 2, 2 до 3, 3 до 4, 4 до 5 образцов В шили Е на платах для испытаний IPC-B-25 (смотрите схему ниже). Контрольные точки 1,3,5 соединены с положительные (+) выводом, контрольные точки 2-4 соединены с отрицательными выводами омметра. Для испытания на соответствия качеству контрольные точки находятся во всех точках соединений на Y-тест-купонах.

#### Схема

5.3.3 Поместите образцы в камеру вертикально под экран защиты от конденсации, подведя источник постоянного напряжения к контрольным точкам образца как описано в п. 5.3.2.1. Подведите 100 В постоянное напряжение поляризации ко всем образцам. Каждая камера должна содержать минимум один образец без покрытия, подвергнутый аналогичной обработке (за исключением

нашесения покрытия), что и образцы с покрытием Все образцы должны быть обработаны до п. 5.2 включительно одновременно.

- **5.3.4** Подвергните образцы класса 1 и 2 статическим условиям, описанным в п.5.1.1 и 5.1.2 соответственно Образец(-ы) без покрытия должен быть также включен как контрольное средство.
- 5.3.5 Подвергните образцы класса 3 20 циклам температуры и влажности. Образец без покрытия должен быть также включен как контрольное средство. Будучи в камере, образец без покрытия должен быть экранирован во избежание образования поверхностной влаги. Напряжение поляризации должно поддерживаться при 90% отн влаж в течение периода из 20 циклов. Исключением является то, что при снижении температуры (шаг (с) влажность может упасть до 80% отн. влаж.
- (a) Начните испытание при 25 °C и поднимайте температуру до 65 °C по прошествии  $1-3/4 \pm 3/4$  часов.
- (b) Поддерживайте температуру при 65 °C по прошествии 3 3-1/2 часов.
- (c) Понизьте температуру с  $65^{\circ}$ C до  $25^{\circ}$ C по прошествии  $1-3/4 \pm 1/2$  часов.

Это составляет полный цикл. Между циклами не должно быть задержек. Смотрите Рисунок 1.

# Рисунок 1 График испытаний на влагостойкость и сопротивление изоляции

#### 5.4 Измерение

- **5.4.1** Отключите напряжение поляризации 100 В постоянного тока перед измерением сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции измеряется, как описано в п. 5.3.2. Электрические соединения к образцу или Y-тест-купону В/Е контрольной платы должны выполняться гак, чтобы электрическое напряжение поляризации и испытательное напряжение той же полярности были подведены к одному выводу.
- 5.4.2 Для квалификационных испытаний измеряйте и записывайте сопротивление изоляции (как описано в п 5.3.2) раз в сутки между 2 и 3 высокотемпературными фазами каждого цикла или при статических условиях для класса 1 и 2 (см. п. 64). Эти испытания подлежат выполнения без открытия камеры Квалификационные испытания должно завершиться отключением напряжения смещения, удалением образдов из камеры и снятием показания сопротивления изоляции после одного часа или до двух часов.

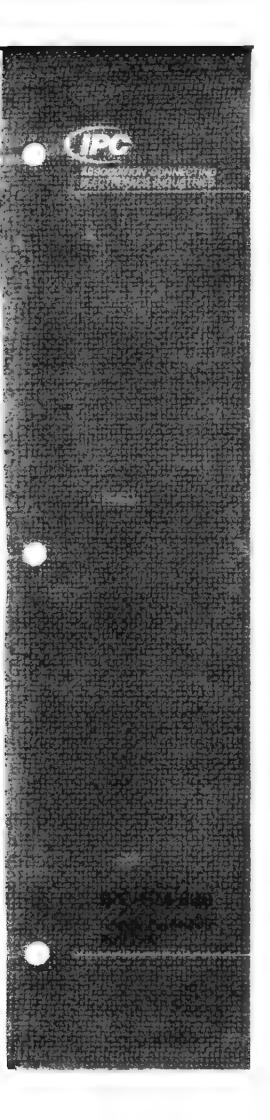
**5.4.3** Для испытаний на соответствие качества измерения (как описано в п. 5 3.2) должны выполняться после отключения напряжения смещения удаления образцы из камеры и после 1 часа и до 2 часов стабилизации при гемпературе и влажности окружающей среды (25  $\pm$  2°C, 50  $\pm$  3% отн. влаж ) Смотрите п 6.5

#### 5.5 Оценка

- 5.5.1 Каждый образец для испытаний должен быть проанализирован на качество сопротивления изоляции для своего класса и типа в соответствии и/или при наличии вышеописанных условий Хотя некоторые показания сопротивления изоляции снимаются во время испытания, только окончательные показания в камере и показания, считанные вне камеры, должны использоваться для определения критерия соответствия/несоответствия. (Другие показания можно использовать в качестве диагностических данных или для отмены испытания). покрытия не соответствуют предписанным требованиям сопротивления индиклоги, проанализировать рабочие характеристики сопротивления изоляции платы без покрытия. Если плата без покрытия также не проходит, испытания следует повторить с новыми образцами, подготовленными и очищенными надлежащим образом.
- **5.5.2** После завершения всех электрических испытаний образцы следует изучить на предмет вздутий, отслоений или других форм деградации. Затем следует стабилизация в течение суток при лабораторной температуре и влажности окружающей среды  $(25 \pm 2^{\circ}\text{C}, 50 \pm 3\% \text{ отн.})$  влаж.).

#### 6.0 Примечания

- 6.1 Описанные документации альтернативные процедуры очистки можно применить, если есть вероятность, что очистка щеткой тэжом оказать отрицательное воздействие на результаты испытаний, т.е. когда образцы для испытаний имеют очень мелкий зазор илии плакированы мягкими металлами (олово свинец, золото и т.д.)
- 6.2 Плату нельзя сушить между этапами п. 5.2.4.1 и 5 2.4.4.
- **6.3** Изначальное расположение проводов должно быть сохранено для обеспечения воспроизводимых результатов
- **6.4** *Примечание*: Первые пять измерений выполняются только в диагностических целях или для определения отмены испытания. Только шестое показание используется для критерия соответствия несоответствия. Смотрите 5.5.1.
- **6.5** Образцы можно стабилизировать при указанных условиях окружающей среды внутри камеры



# IPC-SM-839

Pre and Post Solder Mask Application Cleaning Guidelines

A standard developed by IPC

#### The Principles of Standardization

In May 1995 the IPC's Technical Activities Executive Committee adopted Principles of Standardization as a guiding principle of IPC's standardization efforts.

#### Standards Should:

- Show relationship to Design for Manufacturability (DFM) and Design for Engineering (DFE)
- Minimize time to market
- Contain simple (simplified) language
- Just include spec information
- · Focus on end product performance
- Include a feedback system on use and problems for future improvement

#### Standards Should Not:

- · Inhibit innovation
- · Increase time-to-market
- · Keep people out
- Increase cycle time
- Tell you how to make something
- Contain anything that cannot be defended with data

#### **Notice**

IPC Standards and Publications are designed to serve the public interest through eliminating misunderstandings between manufacturers and purchasers, facilitating interchangeability and improvement of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining with minimum delay the proper product for his particular need. Existence of such Standards and Publications shall not in any respect preclude any member or nonmember of IPC from manufacturing or selling products not conforming to such Standards and Publication, nor shall the existence of such Standards and Publications preclude their voluntary use by those other than IPC members, whether the standard is to be used either domestically or internationally.

Recommended Standards and Publications are adopted by IPC without regard to whether their adoption may involve patents on articles, materials, or processes. By such action, IPC does not assume any liability to any patent owner, nor do they assume any obligation whatever to parties adopting the Recommended Standard or Publication. Users are also wholly responsible for protecting themselves against all claims of liabilities for patent infringement.

IPC Position Statement on Specification Revision Change

It is the position of IPC's Technical Activities Executive Committee (TAEC) that the use and implementation of IPC publications is voluntary and is part of a relationship entered into by customer and supplier. When an IPC standard/guideline is updated and a new revision is published, it is the opinion of the TAEC that the use of the new revision as part of an existing relationship is not automatic unless required by the contract. The TAEC recommends the use of the lastest revision.

Adopted October 6, 1998

# Why is there a charge for this standard?

Your purchase of this document contributes to the ongoing development of new and updated industry standards. Standards allow manufacturers, customers, and suppliers to understand one another better. Standards allow manufacturers greater efficiencies when they can set up their processes to meet industry standards, allowing them to offer their customers lower costs.

IPC spends hundreds of thousands of dollars annually to support IPC's volunteers in the standards development process. There are many rounds of drafts sent out for review and the committees spend hundreds of hours in review and development. IPC's staff attends and participates in committee activities, typesets and circulates document drafts, and follows all necessary procedures to qualify for ANSI approval.

IPC's membership dues have been kept low in order to allow as many companies as possible to participate. Therefore, the standards revenue is necessary to complement dues revenue. The price schedule offers a 50% discount to IPC members. If your company buys IPC standards, why not take advantage of this and the many other benefits of IPC membership as well? For more information on membership in IPC, please visit www.ipc.org or call 847/790-5372

Thank you for your continued support.

©Copyright 1990 IPC, Northbrook, Illinois All rights reserved under both international and Pan-American copyright conventions. Any copyring, scanning or other reproduction of these materials without the prior written consent of the copyright holder is strictly prohibited and constitutes infringement under the Copyright Law of the United States.



## **IPC-SM-839**

# Pre and Post Solder Mask Application Cleaning Guidelines

Developed by the Pre-Solder Mask Cleaning Task Group of the IPC Dry Fabrication Processes Committee of IPC



Users of this standard are encouraged to participate in the development of future revisions.

#### Contact:

IPC 2215 Sanders Road Northbrook, Idinois 60062-6135 Tel 847 509.9700 Fax 847 509.9798 This Page Intentionally Left Blank

# Pre and Post Solder Mask Application Cleaning Guidelines

# **Table of Contents**

Ack	nowledgement		3533 Static volume Extraction .	6
1.0	<b>Scope</b> ,		3534 Dynamic onic Extraction .	6
	1.1 introduction		354 Organics .	6
2.0	Applicable Documents		3.5.5 Moisture and Insulation Resistance (M&IR)	6
3.0	Solder Mask Over Bare Copper		3.6 Storage Prior To Solder Mask Application .	7
	3.1 Metailic Resist Str.pping		3.7 Application of Solder Mask	7
	3 1.1 Perox de		3.8 Pre-Soider Leveling Problems	. 7
	31.2 Non-Peroxide		3.9 Solder Leveling Processes	7
	3.1.3 Detection of Residuals		391 Background ,,	7
	3 1 4 Remova of Residuals		3.9.2 Inspection and Preclean	
	3.2 Stripping Organic Resists		3.9.3 Fluxing	
	3 2.1 Solvent Processed Resists 1		3.9 4 Solder Coating	
	3 2.2 Aqueous Processed Resists		3.9.5 Solder Leveling	
	3 2 3 Removing Resist Residues		3.10 Post-Solder Leveling Cleaning .	
	3.2.4 Effectiveness of Organic Resist Stripping 3		3.11 Post-Solder Leveling Problems	
	3.3 Board Handling After Resist Stripping	4.0	Solder Mask Over Tin/Lead	
	3.4 Pre-Solder Mask Surface Preparation	****	4.1 Fusing Fluid Cleaning	
	3.4.1 Mechanical Methods		411 Residues and Problems	
	3 4 1.1 Mechanical Scrubbing 3		4.1.2 Test Methods for Residual Detection	
	3 4.1.2 Purnice Scrubbing		4.1.3 Method of Removal	
	3.4.2 Chemical Cleaning		4.2 Board Handling	-
	3 4.3 Chemical Coating 4			
	3 4 3 1 Copper Oxdes 5		4.3 Pre-Solder Mask Cleaning	
	3.4.3.2 Antioxidants/Antitarnish Agents		4 3.1 Mechanica, Methods	
	3.4.4 Final Rinse 5		4 3.2 Spray Cleaning	
	34.5 Drying 5		4.3.2.1 Solvent	
	3.5 Pre-Solder Mask Cleaniness Testing		43.22 Aqueous	
	3.5.1 Water Break Test		4.4 Pre-Soider Mask Cleanliness Testing .	
	3.5.2 Solderability Test		4.5 Application of Soldier Mask	12
	3.5.3 rones 5		4.6 Trouble Shooting Guide—Curea Solder Mask	12
	3.5.3 1 Ionic Extraction	5.0	Notes	12
	3.5.3.2 Conductivity Meter 6		5 1 Cleanliness Test Equipment	12

# **Acknowledgment**

Any Standard involving a complex technology draws material from a vast number of sources. While the principle members of the Pre-Solder Mask Cleaning Task Group of the IPC Dry Fabrication Processes Committee are shown below it is not possible to include a of those who assisted in the evolution of this Standard. To each of them, the members of the IPC extend their gratifude.

#### Dry Fabrication Processes Committee

Chairman A.J Siegmund Siegmund no

### Technical Liaison of the IPC Board of Directors

Vincent Gatto
Tyco Printed Circuit Group

#### Solder Mask Processes Subcommittee

Chairman Roger Landolt E.I. DuPont

### Pre-Solder Mask Cleaning Task Group

Chairman Ted Sulzberg Alpha Metals Inc

FC Albers	. Unisys Corp
G.E. Albert	. El DuPont De Nemours & Co
Artak	AT&T Bell _aborator.es
_ Auer	. Hughes Aircraft Co
M Bakszt	Enceson Telecom
D F Bal	Chemcut Corp
F Belia .	Raytheon Co.
S E Berger	. Alled Signal Inc
JG Bernauer .	
L.J. Bobo	All ed Signal Aerospace Co
JK Bonner	
	Allied Signa Inc
C Bradshaw .	
J Brous	. A pna Metars Inc
G Buchi	C.ba-Geigy Corp
S F Caci	
C.C Chang .	. AT&T Bell Laboratories
J.A. Clanton	Genera Electric Co
J Denkler	M&T Chemicals inc
F Durso .	Mac Dermid Inc
W. Dziwis .	Genera Electric Co
M D Eaves	Hewlett-Packard Co.
E W Ertey	
G.B. Fefferman.	AT&T Bell Laboratories
J.R Felty	Texas Instruments inc
CC Fifed	Hercules Inc.
_∪ Fisher	
N.S. Fox .	. Inland Specialty Chemical Corp
G A George	
A Gliman	
E. Gorondy	E I DuPont De Nemours & Co.
B Gulat	
K.E Hafften	Bureau of Engraving Inc.
Ry Hall	Morton International
PE Hinton	
	Sanders Associates Inc
	Robisan Laboratory inc
	.Digitai Equipment Corp
JY Hule	
L C Hymes	
J.M. Jandrev .	
M W Jawitz	Litton Guidance & Control Systems
M Kasiao .	. "Aerojet Electrosystems Co.
A Kiehle .	Aerojet Electrosystems Co.
C WELLE .	tBivi CO/p

	= = =
•	.E. DuPont De Nemours & Co
J. Kitazaki .	. Chemelex
SD Koch	Enthone Inc
S Korchynsky	BM Corp
R Kremer	Mac Dermid Inc
Eu Kuntz	Rockwell International NTSD
S La Croce	. Enthone Inc
ON Le	Boeing Electronics Co
DE Long	WR Grace & Co
	.Martin-Marietta Missile System
C MacKay.	Microelectronics & Computer
	Northern Telecom Canada Ltd
B. Maiofsky	Loctite Corp
R E Mc Lean	. Storage Technology Corp
K Merchel	
	General Electric Co
	Methode Electronics nc /East
H O'Hailoran	Stromberg-Carison Corp
C.A Parmer	Rockwell International
N J. Preimesberger	. Hughes Aircraft Co
C.T Ray	Fairchid
	Texas Instruments
	Dynachem Div
D.W. Bumps	. AT&T Technology Systems
	. Alpha Metals Inc.
S Shoemaker	Dynachem Div
	Allied Signal Aerospace Co
	E I DuPont De Nemours & Co.
	. Mac Dermid Inc
	Encsson Telecom
	Eldec Corp
	Gardiner Soider Co
D Varnell	Hercules Inc
	El DuPont De Nemours & Co
	London Chemical Co. Inc
WB Wargotz	AT&T Consumer Products
G.H Wener	. Weiner & Assoc inc
B Williams	M&T
WA Wseman	Coates Circuit Products/USA
R Woodgate	. Woodcarp no

# Pre and Post Solder Mask Application Cleaning Guidelines

- 1.0 Scope This document is intended to cover all aspects, both method and degree of cleaning associated with the preparation of bare printed circuit boards prior to solder mask application. It continues with the prudent control of the cleaniness level during the solder mask application and cure processes, it includes maintenance of the cleanliness level of solder masked boards during pre-assembly processes and/or storage time prior to assembly Finally, based on the procedures used in the previous steps it deals with maintaining the soldered assembly at a degree of cleanliness consistent with the end use
- 1.1 Introduction The cleaning process prior to any printed board fabrication step is the single most important function over which there must be complete control. Also, it is paramount to remember that with any "build up" type of manufacturing, each step taken, no matter now trivial it is perceived may involve mutiples in cost added. This is especially true with printed circuit boards where the myriad of steps require complete cleaning procedures. Cleaning before solder mask application is critical because there will not be further opportunity to remove extraneous matter after the application step. In general, the use of a class 10,000 or better clean room is desirable to reduce particulate contamination.

Because of the differences in preparing and cleaning boards with copper and tin/lead, this document treats each type of circuitry individually in Sections 3 and 4, respectively

**2.0 Applicable Documents** The following document, of the issue currently in effect, forms a part of this specification to the extent specified herein.

# 2.1 Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits (IPC)<sup>1</sup>

IPC-TM-650 Test Methods Manual<sup>2</sup>

- 2 3.25 Resistivity of Solvent Extract
- 23.26 Ionizable Detection of Surface Contaminants (Dynamic Method)
- 2.3.26 1 Ionizable Detection of Surface Contaminants (Static Method)
- 2.3.38 Surface Organic Contaminant Detection Test (In-House Method)
- 2.3 39 Surface Organic Contaminant Identification Test (Infrared Analytica, Method)
- 2.6.3.1 Moisture and Insulation Resistance—Polymeric Solder Masks and Conforma. Coatings

IPC-S-804 Sorderability Test Methods for Printed Wining Boards

IPC-SM-840 Qualification and Performance of Permanent Polymer Coating (Solder Mask) for Printed Boards

- **3.0 Solder Mask Over Bare Copper** In this process an etch resist, which is usually plated tin/lead, is removed so that the plated copper traces are left bare. Solder mask is applied over bare copper to permit solder leveling, reduce solder pot contamination, protect electrical integrity, and eliminate mechanical damage. The removal of etch resists, pre-cleaning and post-cleaning are explained in Section 3. See Figure 1 for the process flow chart.
- **3.1 Metallic Resist Stripping** Two techniques are used for stripping tin-lead or tin, the key metallic resists, from circuit boards. They are distinguished by the use of either a peroxide or a non-peroxide (acid based) solution, and are described in the following paragraphs.
- **3.1.1 Peroxide** Peroxide is an aggressive oxidizer and all equipment exposed to it should be of plastic construction in addition many products also contain ammonium bifluoride which will also etch glass. Since the peroxide reactions are exothermic cooling coils are recommended. Laminate attack can result from the heat and the ammonium bifluoride. Compatibility of laminates with the solutions should be checked before setting process guidelines.
- 3.1.2 Non-Peroxide Non-peroxide strippers are nitric- or funbond-acid-based solutions. They are used in either single- or two-step processes. Single-step processes usually involve spray techniques, while two-step processes can involve either soak or spray techniques. Non-peroxide strippers are generally not exothermic, and will not attack laminate. However a specific amnate should be checked for compatibility with the particular stripper being used. In general, non-peroxide strippers are slower than peroxide. With fluoboric acid-based solutions, spray equipment used must not contain titanium, as it is readily attacked by fluoboric acid.
- **3.1.3 Detection of Residuals** incomplete tin/lead stripping is evidenced by a dulil gray-colored copper or white powdery residue. This indicates incomplete removal of the intermetallic layer or lead fluoride.

Note: At times it may be possible to have a board that visually appears to be free of residuals, but actually still has an intermetallic layer that can lead to non-wetting. This condition can be dentified using surface analytical techniques, such as X-ray fluorescence or Auger electron spectroscopy.

3.1.4 Removal of Residuals Removal of residuals varies with the type of stripping technique used. In peroxide stripping.

<sup>1</sup> Publications are available from IPC, 7380 N. Lincoln Ave. Lincolnwood. L 60646

<sup>2</sup> For convenience, reprints of IPC TM-650 test methods are provided at the end of this specification.

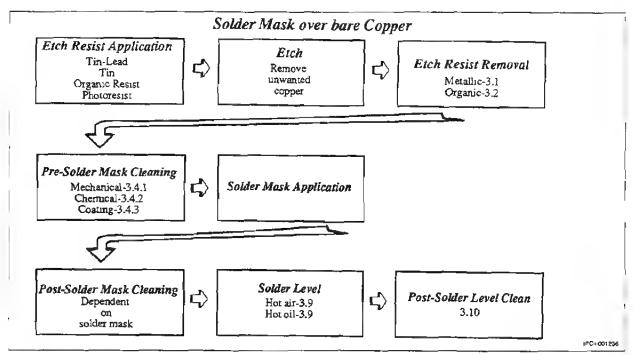


Figure 1

lead fluor de residues are removed by an extended owel time in the stripper or by immersing the parts in an acid cleaner. Residues may also indicate that a need exists for replenishment/ replacement of the stripper solution.

n non-peroxide stripping, the incomplete removal of a copper-tin intermetallic layer may require extended dwell-time in the second step stripper solution or the replenishment/replacement of the stripper solution.

- **3.2 Stripping Organic Resists** Panels made with the tent and etch process, or any other process where a photoresist or other organic resist is used as the final etch resist, must be stripped to bare copper to insure proper soider mask adhesion and no blisters during subsequent high temperature processes.
- **3.2.1 Solvent Processed Resists** Solvent processible resists are generally stripped in methylene chloride containing an azeotropic amount of methanol. Properly exposed, these films strip very quickly, and leave almost no residue. The biggest potential problem is an insufficient supply of fresh solvent, which leads to resist residues building up in the final solvent chambers. Evaporation of the dirty solvent then leaves a film of resist on the surface, which must be removed through a chemical cleaning process as described below.
- 3.2.2 Aqueous Processed Resists Aqueous and semaqueous resists are stripped in a caustic solution which sometimes contains an organic solvent. The caustic can be either forganic (monoethanolamine) or inorganic (sodium hydroxide). In general, these films do not strip as cleanly as the solvent products and frequently leave a thin film of organic residue on the surface of the copper which must be removed with a chemical cleaning process.

**3.2.3 Removing Resist Residues** The chemical cleaning of copper stripped of resist can be done in either conveyorized spray equipment or process tanks. The choice of equipment will probably depend on the method of stripping. There should be little or no hold time between the stripping and the cleaning process since the resist residues can dry and become firmly attached to the copper surface making them more difficult to remove

The chemical cleaning process generally consists of three parts, each separated by a thorough water rinse

Detergent Cleaner: A detergent cleaner is used to loosen the resist residues, and soften them so that the microetchant chemicals can penetrate and attack the copper to which they are attached. If the equipment is a spray system, it must be a non-foaming, non-ionic cleaner, such as those used in automatic dishwashers. The temperature is usually in the 60-71 °C (140-160 °F) range depending on the limitations of the processing equipment. Residence time in a spray system is typically 1 minute; in a tank system, 4 minutes. Cleaners can be either alkaline or acidic but alkaline detergents are the most common. Some acidic detergents contain a microetch. These should be used with caution, as the etch characteristics can be erratic, and etchant residues can be left on the surface.

*Microetch:* The microetch is the step which actually removes the resist residues and exposes the fresh copper surface in cases of severe surface contamination, thin films of resist can be seen floating in the etchant after a short period of use. For this reason, a filter system should be considered for this solution. Sufficient copper should be etched to insure that the entire surface is fresh uncontaminated copper, typically 1.8  $\mu$ m [70  $\mu$ m]

The etchant should be a sulfate-based system (sodum persufate, hydrogen peroxide/sulfund acid, etc.) to insure that the etchant rinses clean

Sulfuric Acid Rinse/Antitamish: The microetch should be foliowed by a 5 to 10% sulfuric acid rinse to remove any residual etchant saits. The antitamish is optional and the soider mask vendor should be contacted for recommendations. As an alternative to the antitamish, a light scrubbing will serve to passivate the surface by mechanically removing any trace salts, thus keeping it from becoming excessively oxidized.

Removing resists in this manner leaves a very active surface copper, so care should be taken in maintaining proper storage conditions

- **3.2.4 Effectiveness of Organic Resist Stripping** To determine the effectiveness of the cleaning process in removing photoresist residues, a test panel can be run in a manner similar to that used for determining the effectiveness of a preplate cleaning process. Prepare a panel with resist, leaving a section of bare copper exposed. Expose or cure the resist, and send it through the stripping and cleaning processes. When finished there should be no difference between the portion which had resist on it and that which never contacted the resist. As a final test, the panel should be plated in a copper sulfate bath for 10 to 15 minutes without additional cleaning. There should be no evidence of peeling or hazy, dull, or pitted plating, which would indicate an organic contamination; nor should there be any line of demarcation between the treated and untreated areas.
- **3.3 Board Handling After Resist Stripping** Boards should always be handled by the edges only. The proper choice of gloves can provide some handling benefit. Improper glove selection can provide a false sense of security, since some gloves contribute fibers to the board. Some will also absorb hand oils which can be transferred to the board.

Racking is the preferred storage technique for boards in process. Boards should be stored in an atmosphere without high humidity or the presence of process chemicals. The longer that boards are stored, the more the copper can oxidize. Excessive oxidation could require changes in the cleaning cycle to assure a proper copper surface.

**3.4 Pre-Solder Mask Surface Preparation** To insure maximum adhesion of the solder mask to the board surface, conditioning of the surface is required before the solder mask is applied in most cases, the term surface preparation refers to the roughening of the copper in the circuit traces and ground planes to provide the greatest amount of surface area for solder mask adherence. The major concern is the exposed metal, which tends to be fairly smooth at this stage of the process. The laminate is usually rough enough to give good adhesion without any further treatment and needs only to have surface contamination removed.

The most commonly used methods for surface conditioning phor to solder mask application over bare copper are mechanical brushing purpose scrubbing, chemical micro-etching or the application of a chemical coating, or a combination of these methods.

- **3.4.1 Mechanical Methods** Mechanical cleaning has been used in most fabrication processes, but caution should be exercised to be sure that this method is suitable for the application Most mechanical cleaning is done on conveyorized machines that generally fall into two categories. The first is a brushing machine or scrubber that uses a rapidly rotating abrasive brush to remove the surface contamination (along with some of the surface copper) and roughen the surface of the remaining copper for better adhesion. The second type of machine does the same thing but uses a surry of pumice applied either as a spray or with a brush
- 3.4.1.1 Mechanical Scrubbing The most common mechanical method is the use of a scrubbing machine with a rotating abrasive brush. The available equipment usually takes the form of a free standing machine with a brush section to do the surface preparation. This is followed by a water rinse to remove debris from the panel surface, and a driver to remove water droplets and excess moisture. The three available types of brushes are the compressed wheel, the hylon bristle and the composite wheel. The compressed wheel is most aggressive and is the fastest but fibers can be torn away to leave debris in holes and shorten brush life. Nylon brushes have the longest life and do not leave unwanted debris, but are less aggressive and can lead to hylon smear on directry. Composite wheels use a finer grit and are aggressive, but debris is still a problem. While a wide variety of brushes is available, the choice can be narrowed down somewhat for this application. Nylon bristle brushes should be avoided over copper since the nylon can leave an invisible smear that is detrimental to solder mask adhesion if too much pressure is used. A fine line or high resolution compressed or composite wheel is much better suited for this surface conditioning since they have a much finer abrasive grit than other wheels and are less likely to leave a deep gouge in the copper that the solder mask cannot penetrate. The actual grit size for these brushes is around 600 or smaller (higher number means smaller particle size). The proper brush pressure is generally less than would be used to scrub a board prior to the application of an etch or plating resist. Excessive pressure can cause epoxy to smear on to copper surfaces when laminate is not completely cross-linked.

The proper pressure can easily be determined by using the stripe test. A copper clad board of approximately the same width as the boards to be masked is run over (or under) the brush to be adjusted and the conveyor stopped. The brush is brought into contact with the board and allowed to run against it for several seconds and the brush pressure meter reading noted. The brush is raised and the board removed from the scrumber. A narrow stripe of polished copper is left where the brush made contact. The proper brush pressure is when the width of this stripe is between 6.3 and 9.5 mm [1/4 and 3/8 in.] The test board is then run through the scrubber again and the brushes adjusted until the same reading is obtained on the pressure meters. The machine is now ready for the boards to be solder masked. In machines where the conveyor can not be stopped while the brush is rotating, a correlation of brush pressure and conveyor speed with end use properties should be run. on test panels.

A water break test may be used to indicate the adequacy of the machine setting. A properly scrubbed copper clad board, equivalent in thickness to the board to be processed will hold an unbroken film of water for 30 seconds while held vertically after proper scrubbing. This procedure, although widely used, can be misinterpreted, especially with copper surfaces that are oversortabled.

Consistent results and maximum life can be assured by keeping the brushes round. Brushes wear uneventy it panels are alloaded in the same spot on the conveyor with parts of the panels being undercleaned while other areas seeing too much pressure. Dressing is fairly easy with compressed and composite wheels and can be done on the machine with dressing plates provided by the machine or brush manufacturer. Nyion bristle brushes are much more difficult to dress on the machine without ruining the brush. It is suggested that the machine manufacturer or brush suppliers recommendations be followed when these brushes need dressing.

Care must be taken to avoid contaminating equipment to be used for cleaning copper with tin or tin-lead residues. A single scrubber must not be used for cleaning both copper and tin or tin-lead panels. In the same way all traces of tin tin-lead and intermetallics must be removed before scrubbing the copper surface.

Since the brushes can leave debris on the board surface, good rinsing is necessary. Most brushing machines have an integrated rinse section that is usually adequate, as long as the water pressure is at least 1.3 bar [20 psi]. Following rinsing, the board should be died using warm, oil-free forced air. Most brushing machines have an integrated driver that will do the job. The use of infra-red drivers that dry by evaporating the moisture on the board surface should be avoided since any contaminants that are carried by the water remain on the surface after the water evaporates and will be trapped under the solder mask. These could lead to oxidation and reduced adhesion resulting in blistening.

**3.4.1.2 Pumice Scrubbing** This method is also a traditional and effective mechanical cleaning method for copper prior to solder mask application. Pumice is either acid activated or plain. The acid activated type is used with hand scrubbing, while the plain is primarily used as a slurry in spray machines. Spraying should only be done in equipment especially made for that purpose. Care should be taken to maintain the slurry per the manufacturer's recommendation. Siurnes are good in removing oxides and previous process residues. This process leaves the surface clean and roughened for good solder mask adhesion. However, it is very important to have adequate rinsing since pumice residues under the solder mask can cause peeling and bilstering during subsequent processing.

Since purise is not soluble in water, high volume high pressure spray rinses are required. Boards should be dried with oil-free, hot air and processed quickly to avoid oxide build-up. Chemical cleaning can precede the purise scrubbing.

Pumice scrubbing is not effective in post solder mask cleaning. Not only would it abrade the surface of the solder mask, but it would not clean in the holes where cleaning is needed.

**3.4.2 Chemical Cleaning** Chemical conditioning methods can be used to clean the surface of the copper and this is most efficiently accomplished in conveyorized spray equipment. A typical sequence of process stations would consist of a cleaner to remove organics such as tingerprints from the board surface, a water rinse a micro-etch to roughen the surface of the copper, a water rinse and a warm air dryer. The use of an anti-tarnish agent after the micro-etch may be needed since the micro-etched copper surface will oxidize very quickly especially if there is any detay between the cleaning and the application of the solder mask. Compatibility of the anti-tarnish agent with the solder mask must be assured (see 3.4.3.2).

There are many proprietary, sprayable cleaners available both acidic and alkaline, for the first cleaning step. For best results, it is recommended that a cleaner formulated for spray applications be used since foaming can be a major problem with these types of cleaners.

It is not necessary to remove much copper in the micro-etching step, since only a surface roughening is needed. In most cases a total removal of 1–2  $\mu m$  [40 to 80  $\mu m$ ] is more than sufficient to achieve the desired roughening. The most common micro-etch baths are either based on persulfate, hydrogen peroxider surface acid, or ferric chloride. Persulfate micro-etchants are available as a proprietary mixture from most chemistry suppliers. Persulfate baths generally give a slightly rougher surface and remain more stable over a period of time it is essentially a batch process with the bath needing to be disposed of when the copper loading reaches specified limits

Peroxide/sulfunc micro-etchants are also available as proprietary formulations for both tank and spray operations. The peroxide solution needs to be strongly stabilized in order to prevent the consumption of peroxide from becoming excessive. The major advantage of a peroxide/sulfuric bath is that it can be regenerated. The copper that builds up in the bath can be removed by chilling and precipitating the copper as copper sulfate. Additions of hydrogen peroxide and sulfunc acid are then made to replace losses, and the bath put back into service. This process can be regenerated through the use of a chiller/crystallizer, or done in a batch operation.

Ferno chloride micro-etchants are also available as proprietary formulations for both tank and spray operations. When ferro chloride is used as a micro-etchant, it is important to analyze the board surface for iron chloride and other chloride residues.

Rinsing is extremely important especially when using an alkaline cleaner, and/or persulfate, or ferric chioride micro-etchants. When using a persulfate micro-etch it would be useful to follow the micro-etch with an acid rinse of 2 to 3% sulfuric acid to be sure that all the persulfate residues are removed. After the final rinsing step, the boards should be dried using a warm forced air dryer.

**3.4.3 Chemical Coating** Although the mechanical and chemical cleaning techniques are the predominant methods of preparing copper circuitry for soider mask application, there are

several chemical coating methods available which leave either a permanent or a temporary chemical treatment. Their use is more restricted and the process conditions are narrower so care must be taken for proper use. Compatibility of these coatings with the solder mask must be confirmed.

3.4.3.1 Copper Oxides The use of an oxide bath either brown or black, to put a controlled layer of 0.5 to 1.0  $\mu$ m [19 to 39 µn] copper oxide on the copper surfaces can further enhance the adhesion of the solder mask. The crystalline structure of the oxide layer tremendously increases the surface area for improved mask adhesion. A brown oxide is generally more destrable since it has a smaller crystal structure and can be applied at a lower temperature. It is not necessary (as is typically done on multilayer innerlayers) to put a coating on the copper so thick that a deep brown or black color results. For solder mask application, a bronze or light brown color is all that is needed Most oxide applications are done in dip tanks although conveyorized equipment is available. The process steps to prepare the copper for the oxide layer are the same as the chemical conditioning described in section 3.4.2 with the exception that no antitarnish is applied. The suppliers of oxide chemistry will have complete step by step instructions for their chemistries.

**3.4.3.2** Antioxidants/Antitarnish Agents If there is delay between cleaning and the application of solder mask antioxidant/antitarnish agents can be used. There are many different types, and all are used in low concentrations. They are applied as a spray or an immersion dip followed by a water rise. Exact concentration, time and temperature are according to vendor's recommendations.

Some solder masks can be applied directly to the treated surface and the antioxidant/antitarnish is later removed from the other areas for further processing. Removal is usually done with mind mineral acids, following vendor's recommendations for time, temperature, concentration and rinse cycle. Most agents must be removed prior to solder leveling, since solderability is greatly impaired on treated surfaces.

Compatibility testing with adhesion of solder mask must be done prior to putting antioxidant/antitarnish agents in production since blistering and peeling of the solder mask can occur. Test panels can be run to determine if the antioxidant/ antitarnish agent should be removed just prior to solder mask application, or the vendor can be contacted for recommendations.

- **3.4.4 Final Rinse** Final rinse requirements may be one of the most overlooked aspects of presolder mask cleaning. Many factors are involved, including reliability requirements for the board and the spacings. Depending on the water source, tap water (routinely monitored) may be adequate as a final rinse. However, due to variations in water hardness and temperature (which can happen very quickly), defonized water with a resistivity of 3–5 megohim-cm is preferred for the final rinse.
- **3.4.5 Drying** Adsorbed water and water residues are frequent causes of bisters and loss of solder mask adhesion. It is, therefore, essential that all standing water is removed from the board surface and holes and that the boards are thoroughly dried before solder mask application.

Water should first be physically removed (blown off) from the surface and from via holes before using a heated evaporative drying cycle with a high volume, hot air knife and/or turbine dryer with filtered ou-free air. If the first step is omitted, contaminants carried by the rinse water could be deposited on the board during evaporation. Also, drying by evaporation may not remove alwater from holes. On typical FR-4 panels absorbed water can be removed by a 20 minute minimum bake in an oven set at temperatures of 110 ±5°C (230 ±9°F) or by a conveyorized nfrared machine with user-established operating parameters. Boards with substrates other than FR-4 glass/epoxy or boards with different constructions (i.e. thickness thermal mass, etc.) may require different drying conditions. If boards are cleaned nsolvent only (no aqueous cleaning or water rinse), the turbine drying may be omitted, but drying is still important. Drying ovens should be dedicated pieces of equipment to prevent cross-contamination of panels. The oven design should guarantee an even temperature profile at al locations within the oven Forced air ovens with good external exhaust to remove vapors should be used to maximize drying efficiency

3.5 Pre-Solder Mask Cleantiness Testing Cleanliness of the boards following cleaning can be evaluated by several techniques. Both onic and organic residues are possible from previous processing. Their presence would require additional cleaning if higher than acceptable customer limits, it is important that a representative board sample be used for testing to insure that process changes give adequately cleaned and tested panels.

A residue may contain mixtures of onic and non-ionic materials which are usually deposited on the board surfaces together. The ionic portion of the residue can then provide an indicator of overall surface cleanliness. However, to be certain that cleanliness requirements are met, both ionic and organic testing should be conducted.

- **3.5.1 Water Break Test** This is not a cleanliness test, and is best used on copper clad panels to indicate the adequacy of mechanical scrubbing. See 3.4.1.1
- **3.5.2 Solderability Test** A solderability determination is made to verify that the board is free of surface contamination that would effect solder mask adhesion. Following test procedures in IPC-S-804, a printed board that is contaminate-free, will exhibit a characteristic known as wetting. Wetting is the formation of a relatively uniform smooth, unbroken, and adherent film of solder to a base metal.

A board that contains surface contamination will exhibit dewetting or non-wetting characteristics. De-wetting is a condition which results when the moliten soider has coated the tested surface and then receded, leaving irregularly shaped mounds of soider separated by areas covered with a thin soider film (base metal not exposed). Non-wetting is a condition whereby moliten soider has contacted a surface, but has not adhered to all of the surface (base metal remains exposed).

**3.5.3 Ionics** Since the presence of ionic residues on bare printed boards prior to application of solder mask can significantly affect the board quality, residue measurements should be

run periodically onic materials left on the board can contribute to corrosion of metallic materials even when the ionic contamination is over-coated with solder mask. Since a solder mask layer can in time be permeated by moisture and oxygen, it is insufficient to protect surfaces beneath from atmospheric corrosive effects particularly it hygroscopic ionic materials are present.

Automated equipment is sometimes used to determine ionic cleanliness. Care should be taken to obtain appropriate equivalence factors between different equipment brands and models

**3.5.3.1 lonic Extraction** In order to measure the onic residues quantitatively it is first necessary to extract the ions into aqueous solution. Since residues often contain components which are not readily water-soluble, a mixture of water and an aicoholieig, isopropanol, is used for extracting ions from board surfaces. In this way, both the water-soluble ionic component and the aicohol-soluble non-polar component can be solubilized to allow measurement of the ionic components.

**3.5.3.2 Conductivity Meter** Most ionic testing procedures tollow the methods (developed at the Naval Avionics Center, Indianapolis IN) specified in MIL-P-28809 A 75% isopropanol/25% water mixture is flushed over the board surface to dissolve the ionic materials. The drippings or run-off from the board surface are collected and measured separately using a conductivity or resistivity meter. Reference 2 3 25 of IPC-TM-650 for test methods.

**3.5.3.3 Static Volume Extraction** An automated system using a similar static volume extraction method immerses the sample into a fixed volume of an alcohol-water mixture. After a suitable time is allowed for the extraction typically 15 minutes the resistivity of the solution is read. This value can be converted to equivalent amounts of an ionic material usually sodium chloride, and expressed as the total amount of onic material extracted from the sample. Reference 2.3.26.1 of IPC-TM-650 for test methods. See 5.1

3.5.3.4 Dynamic Ionic Extraction Another instrument utilizes a dynamic system of onic extraction in which the water/alcohol solution is pumped continuously in a closed loop from the sample tank through an ion-exchange column and then back to the sample tank. When the sample is immersed into the tank, the conductivity rises to a peak and then falls back to the original pre-immersion level. Measurement and integration of the conductivity gives values which are linear functions of the amounts of ions taken into solution. Pieterence 2.3.26 of IPC-TM-650 for test methods. See 5.1

**3.5.4 Organics** The presence of organic, non-ionic contaminants on the bare board surface due to board fabrication processes can be detrimental to solder mask adhesion. The non-destructive detection and quantification of such contaminants is covered in IPC-TM-650, Test Methods 2 3.38/2 3 39

Test Method 2.3.38, "Surface Organic Contaminant Detection Test (In-House Method)", is a qualitative method of determining

the presence or absence of a wide spectrum of possible organic contaminants using a solvent, aceton-trie, as the extracting medium. This method does not identify the specific contaminants present nor separate contaminant mixtures into the individual constituents. The visual limit of detection via this method is approximately 10 micrograms/cm<sup>2</sup>.

Test Method 2 3 39 "Surface Organic Contamination Identification Test (Infrared Analytical Method)", is an analytical method of quantitatively analyzing a wide spectrum of non-onic organic contaminants and identifying the individual constituents in the contaminants. This technique, which also uses the solvent acetonitrile, is more involved than Test Method 2 3 38, and requires an experienced spectroscopist to effectively utilize the multiple internal reflectance (MIR) infrared spectrophotometric equipment required for the test. Another analytical test for identification of total organic contamination is Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (ESCA)

Since acetonitrile is a solvent for numerous organic compounds including many constituents of the printed wiring board manufacture, initial characterization of the extract obtained from the less technical Test Method 2.3.38 may be required. The more technical, more sensitive Test Method 2.3.39 may be utilized to identify those organic constituents in the extract that truly represent undesirable contaminants from those constituents that are an inherent part of the printed wiring board. After characterization, the utilization of Test Method 2.3.38 may be used as a sampling or n-process check.

3.5.5 Moisture and Insulation Resistance (M&IR) A sensitive method for the detection of the presence of some surface contaminants on a laminate board is the measurement of surface insulation resistance (SIR). This test provides a measurement of the susceptibility of a circuit board to develop electrical leakages between adjacent conductors on the surface

If traces of hygroscopic materials are contained in contaminant residues, the absorption of moisture from the atmosphere, particularly when exposed to elevated humidity/temperature condtions, will result in surface electrical leakages when voltages are applied. This can adversely affect the electrical performance of many circuits or even be catastrophic to the functioning of high impedance circuits. The procedure is conducted on a test board. which has been put through the identical processing conditions as the batch of boards being manufactured. This is done to provide, from test to test, patterns with identical geometries (such as a standard comb pattern), and to obtain results which can be meaningfully compared to each other. This is not feasible if one attempts to measure SIR between adjacent lines of assorted functional circuit patterns. To overcome this problem, a board is designed with a small test comb pattern added to the side of the functional circuitry for the specific purpose of this test. A similar approach is to design a small break-off portion of the board which can be removed and independently tested after the board processing. Still another method is to run one or more separate. test boards along with a production batch being processed These test boards such as the IPC-B-25 pattern, can then be considered as representative of the effects of the processing and materials on the production group

The measurement of M&IR is a very complex and timeconsuming process which requires much attention in order to get consistent and reproducible results. Typically a standard comb pattern which had been processed, is mounted in a temperature/hum dity chamber with electrical connections made to contact pads. A bias voltage is applied between adjacent ines of the comb pattern and the system is allowed to condition for extended periods of time, usually up to a week or more. At perodic ntervals, measurements are made of the resistance between sections of the interdigitated comb pattern. The original bias voltage, if used, is removed and a specified measurement voltage applied. The minute currents can be measured with a very high sensitivity ammeter and the resistance value calculated using Ohm's law. The resistance can also be read directly using a high resistance meter it must, however, have the capability of measuring resistance at a predetermined specified value of measuring voltage. The resulting measured value is then designated as the M&IR of the test which is very specific to the conditions of the test and the results can vary widely from one set of test conditions to another. Some of the parameters affecting the M&IR results are

- 1 Geometry of board used
- 2. Board materia.
- 3 Measurement temperature
- 4 Measurement humidity
- 5 Measurement voltage
- 6. Original state of cleanliness of the sample
- 7 Board processing conditions
- Types, amounts and distribution of contaminants left on board.
- 9 Test Technique
- 10 Test Equipment

If the effects of variables 7 or 8 on M&IR are to be evaluated, it is imperative that all of the others be rigorously controlled and reproduced from test to test. The conditions used in the IPC testing of M&IR are specified in method 2.6.3.1 of IPC-TM-650

3.6 Storage Prior To Solder Mask Application With cleaned panels, the allowable maximum storage time will vary with the method of cleaning, type of copper and the atmosphere of the storage area, but generally should be minimized to reduce oxidation of the bare copper and contamination of the board. In general, less than two hours are preferred between cleaning of the board and application of the solder mask. Extended hold times may require re-cleaning. The laminate can adsorb water and other volatiles when not adequately protected by moisture-proof packaging. To overcome this, the bare boards should be baked for a minimum of one hour at 150°C (302°F) and then recleaned.

Finger contact with the printed surface must be avoided. Due to the corrosive nature of hand oils, operators should always handie boards by their edges only and wear clean gloves. See 3.3 for discussion of gloves.

- **3.7 Application of Solder Mask** The methods procedures and techniques for applying and curing solder masks are beyond the scope of this guideline. The screening or application of solder mask onto clean copper circuitry should be in agreement with the individual solder mask vendor's recommendations.
- **3.8 Pre-Solder Leveling Problems** Table 1 is a list of problems and solutions of cured solder mask on bare copper. While not a complete list, it is provided for information purposes.
- **3.9 Solder Leveling Processes** Solder leveling is a process which leads to copper printed circuit boards with the improved solderability and longer storage life usually provided by tin/lead boards. The process eliminates some less desirable traits le givariable metal adhesion, swelled or bridged circuit traces flux entrapment and a tendency toward poorer insulation resistance and electromigration performance, which are often associated with the tin/lead printed circuit boards.
- **3.9.1 Background** This process is faster than tin/lead plating and uses far less tin/lead to provide equivalent hole and pad solderability its use is being further accelerated by the push to finer lines and more densely packed printed circuit designs which are not possible with tin/lead plated systems.

Various equipment and materials have been developed in an effort to improve and optimize this process. This includes the use of both hot oil (Hot Oil Soider Leveling—HOSL), and hot pressunzed air (Hot Air Solder Leveling—HASL) methods for removal of excess solder from hole barrels and pad surfaces. Other variations included dipping and extracting boards in both the vertical and horizontal modes, as well as the use of different angles, configurations, speeds, and dwell times to improve leveling characteristics. The HASL operation has evolved as the more widely accepted of the two.

It is necessary that control of processes and materials are carefully maintained to reduce contamination. All forms of solder leveling can only be characterized as dirty, corrosive, and contamination-prone operations with the following steps being common to all processes.

**3.9.2 Inspection and Preclean** These two critical steps make precleaning the single most important function of the operation. The first step is to predict success by inspection, and by employing whatever cleaning is necessary to remove contaminants which might interfere with removing oxide layers or prevent the solderability of the copper.

The second step is the successful removal of those oxide layers and is usually done with a mildly active microetchant type of acid preclean. Generally, a cleaning agent capable of removing surface oils, and a microetch, are chosen. If required, this can be done in two stages, although good cleaners do exist for single stage cleaning. The worst panels should be run first to evaluate the process. The after-rinse is important, it will determine the amount of precleaner and free copper which may be dragged into the flux, and then into the solder pot.

Table 1 Cured Solder Mask on Copper

Problem	Cause	Solution
Poor solder mask adhes on (general)	Contamination on board surface	Follow cleaning procedures outlined in Section 3.4
	prior to soider mask application	Assure proper cleanuness level (Section 3.5)
		Recheck for residuals in resist stripping processes and rerun if needed
	Moisture trapped under solder mask can lead to circular bisters	Briefly oven dry boards at 71°C (160°F) just prior to mask application
		Check mask application room for high humidily or presence of aqueous processing equipment
	1	Review storage time prior to solder mask application and determine maximum hold time.
Poor solder mask adhesion (thermally cured masks)	Undercure of the solder mask— insufficient cross-linking of the poly-	Follow supplier's recommended hardener to resin ratio and mix cycle for two-part systems
	mer coating will leave it vulnerable to attack from fuxes and cleaners and	Follow supplier's bake time and temperature
	to thermal shock	A low sufficient time for cold boards to reach curing temperature before starting the timer.
		Do not open oven during cure cycle
		El minate " cold spots" in oven
		Allow adequate at flow through oven to remove solvent vapors and assure that vent system is not blocked
		Maintain oven by regular temperature monitoring and cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see PC-SM-840B).
Poor solder mask adhesion (U V cured masks)	Undercure of the solder mask— insufficient cross-linking of the poly mer coating will leave it vulnerable to attack from fluxes and cleaners and to thermal shock.	Follow supplier's recommended energy level for curing at the coating thickness used
		Maintain bulbs in lamp unit by cleaning regularly, deter- mining output energies routinely and changing as required.
		Monitor temperature in curing unit to prevent excessive board heating
Poor solvent or cleaner resistance	Undercure of the solder mask (thermally cured masks)	Follow the supplier's recommended hardener mix ratio and stir cycle for two-part systems
		Follow supplier's bake time and temperature
		A low sufficient time for cold boards to reach heat cur- ing temperature before starting timer
		Do not open over during cure cycle.
		Elimenate " coid spots" in oven
		Allow adequate air flow through oven to remove solvent vapors and assure that the vent system is not blocked
		Maintain oven by regular temperature monitoring and deaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see IPC-SM 840B)
	Undercure of the solder mask (LV cured masks)	Follow supplier's recommended energy level for curing at the coating thickness used.
		Maintain bulbs in lamp unit by cleaning regularly, determining output energies routinely and changing as required, typically 1000 hours
		Monitor temperature in curing unit to prevent excessive board heating.
	Inadequate solder mask type	Use solder mask that meets the proper performance level of iPC-SM-840B
	Incompatible cleaning chemistry	Change to a compatible mask/cleaner combination

Table 1 Cured Solder Mask on Copper (cont.)

Problem	Cause	Solution
Poor electrical properties	Contamination on board surface	Follow defined cleaning procedures
	prior to solder mask application	Perform cleanliness testing prior to applying solder mask
		Recheck resistivity of process rinse waters
	ncomplete cure of UV-curable solder	ncrease cure time
	mask	Check calibration of UV curing oven
Poor cosmetic appearance pin-holes, craters or f sheyes	Oily contamination on surface prior to solder mask application	Thoroughly remove a, grease and ols (see Section 3.3)
	Bubbling during screening process	Use finer mesh screen fabric
	which can pop during the cure step	Slow down squeegee speed
		Add flow agent or solvent to solder mask
		Work with supplier to optimize screening parameters
Discoloration	Undercure of solder mask which leads to water and flux attack	Follow supplier's recommended hardener to resin ratio and stir cycle for two-part systems
		Follow supplier s bake time and temperature
	1	Allow sufficient time for coid boards to reach curing temperature before starting timer.
		Do not open oven during cure cycle.
		Eliminate "cold spots" in oven
		Allow adequate air flow through oven to remove solvent vapors and assure that the vent system is not blocked
		Maintain oven by regular temperature monitoring and cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see PC-SM-840B)
	incomplete removal of residues	(solvent post-clean) Use a chlorinated hydrocarbon—alcohol azeotrope to remove both contaminant types.
		Avoid fluorocarbon solvents since they are less efficient
		Check cleaning equipment for plugged spray nozzies or other mechanical failures.
		Completely remove fluxes within I0 minutes after soldering.
		(aqueous post-clean)  Maintain pH of saponifier solution between 10.5-11.8 since low values cause nefficient cleaning and high values will degrade laminate, components and coatings
		Maintain efficient high pressure sprays to flush away non-saponifiable rosin acids.
		Replace spent cleaning fluid
		Thoroughly post-clean boards within 10 minutes after soldering to minimize cleaning difficulties.
		Add rinse aids to rinse water to help remove residues

Proper precleaning will allow the choice of fluxes to be based solely on soldering criteria, rather than on cleaning capabilities. It is recommended that a room temperature, water-soluble, low-smoking non-carbonizing, and low-foaming flux be used

A good preciean allows complete solderability with the least aggressive fluxing systems available, thus producing a more easily cleanable board after the solder leveling operation. This in turn, provides a solderable and more easily cleaned board after assembly.

3.9.3 Fluxing The first requirement of this process is to produce a dry panel just prior to fluxing. This is a benefit with the

new breed of fluxes offering better wetting characteristics. This also reduces the solder leveling dwell time, since water does not have to be boiled off in the preheat (if used), or in the solder dipping application.

A stage to strip, squeegee, or remove the excess flux is also nelpful in reducing the dwell time and residues which could be left inside the solder pot. Tradeoffs exist between amount of flux applied, solderability and residues. There must be sufficient flux on the board to prevent solder webbing and balling. Moreover, a

certain amount of excess flux aids in leveling the panel and minmizes oxidation on the surface of the solder pot. Proper maintenance of the pot will prevent carbonized or degraded flux residues.

Room temperature fluxes are used due to their lower surface tension which is maintained more consistently through multiple operations. However if preheat is used it is important to control heater temperatures while being certain that the proper activation temperature of the flux is achieved at the board surface (often depending on board design). It is important to avoid high temperatures that could promote residues which might contamnate the sorder pot, or be extremely difficult to remove (clean) from the board or most importantly, cause a fire from autognition of the fluxes.

- **3.9.4 Solder Coating** The application of solder is straight forward. The board is submerged into the molten solder at a temperature which may vary from 232°C (450°F) to 260°C (500°F) depending on the tin/lead ratio and purity and equipment efficiency. An optimum range is 238-250°C (460-480°F). The dwell time will vary from 2 to 8 si depending on the heat sink capability of the board (determined by panel thickness, number of metallic layers, and percent of ground plane area), and the purity of the solder. The copper content of the solder should be kept below 0.3% by weight, with solder analysis being performed on a regular basis.
- 3.9.5 Solder Leveling The str.pp.ng-off of the excess solder is accomplished by using either specialized air jets, hot air, or a liquid, the latter a high temperature-resistant oil with stabilization against decomposition (hot oil). With not air, the air pressure used for the removal of excess solder can be adjusted depending on the results desired. The thickness, brightness, and evenness in the hotes and feature flatness of the solder coating is effected by air pressure, air temperature, air configuration, and angle of immersion.

In HOSL, adjustments are dependent on the liquid used. Some controversy remains about which leveling choice is best for each feature, but satisfactory results are accomplished in most cases.

- 3.10 Post-Solder Leveling Cleaning The type and degree of cleaning is dependent on the previous steps of the solder leveling process. The soider must be in a solid state, i.e., completely cooled, prior to washing. This cleaning step removes the flux residues from the panels for most water soluble fluxes. A two-stage warm water wash with a mild detergent is followed by multiple stage cascade counter flow spray rinsing and complete drying. A soft hylon-bristle brush can be used in the first stage, if needed. Water soluble fluxes may not require the use of detergent. De-onized water heated to 60 °C [140 °F] can sometimes be used.
- it is important to spot-test and attempt to control these processes. "Appearance" is not the prime criteria, since improper processing at this stage can lead to failures due to high surface conductivity, while active flux residues will quickly detenorate a stored paner Paragraphs 3.5.3, 3.5.4 and 3.5.5 address cleanliness testing

- **3.11 Post-Solder Leveling Problems** Table 2 is a list of problems and solutions occurring with cured sorder mask over bare copper after solder leveling
- **4.0 Solder Mask Over Tin/Lead** In this process an etch resist, usually tin/lead is reflowed (fused) so that the copper circuitry is covered with solder

Since various types of fusing fluids can be used to aid this process, it is necessary to completely remove them to have a clean adherent surface for maximum solder mask adhesion. Section 4 is a detailed explanation of these methods. See Figure 2 for a process flow chart.

- **4.1 Fusing Fluid Cleaning** The cleaning should be directly in line with the fusing unit to effectively remove the water soluble fusing fluids which are usually used for fusing of bare boards. Multiple stage cascade counterflow spray rinsing is best with the final rinse being deionized water. Additional clean liness can be obtained using rinsing agents in a recirculating spray following the recommendations of the vendor.
- **4.1.1 Residues and Problems** The two types of problems experienced with solder masked tim/lead boards are solderability and cleanliness under the solder mask. Solderability is the ability of the solder to wick up through the holes and onto the pads and is determined by IPC-S-804. Flux residues left in the holes causing solderability problems could be polar or non-polar, organic or ionic. Heavy solder oxides could also cause solderability problems. Cleanliness must be determined prior to solder mask application because boards not thoroughly cleaned will have a short life expectancy and functional difficulties. Flux residues that are ionic (acid) will also cause corrosion. Organics can be hygroscopic and become onic with water absorption causing failures.
- **4.1.2 Test Methods for Residual Detection** The two types of test methods are ion extraction (see 3.5.3) and surface insulation resistance (See 3.5.5)
- **4.1.3 Method of Recoval** All boards should be thoroughly rinsed in cascading counter. Now spray rinses if additional cleanliness is indicated by the test methods, then alkaline-based rinsing agents can be added to the post fusing cleaning system if scrubbing is indicated, it should only be done with a soft non-abrasive brush so as not to smear the solder.
- **4.2 Board Handling** Boards should always be handled by the edges only. The proper choice of gloves can provide some handling benefit. Improper glove selection can provide a false sense of security since some gloves contribute fibers to the board. Some will also absorb hand oils which can be transferred to the board.

Racking is the preferred storage technique for boards in process. Boards should be stored in an atmosphere without high humidity or the presence of process chemicals.

**4.3 Pre-Solder Mask Cleaning** To insure adhesion of the solder mask to the fused board, conditioning of the surface is

Problem Webbing.baing of solder	Board too dry	Solution Apply more flux
	Solder mask not completely cured	Increase cure time for thermal masks and increase enigles for UV masks
	Flux surface tension incompatibility since too much solvent evaporation	Use more viscous flux
Plated-through hole not soldered	Unstripped tin/ ead residues	Perox de type—lead tuor de residues
-		1) Extend awe time in stripper
		2) Repienish replace stripper solution
		Non-peroxide type—incomplete removal of copper- intermetallic layer
		. 1) Extend dwell time in second stripper solution
		2) Replenish/replace stripper solution
	Dry fim soider mask developer	Ensure developer preak point is correct
	residues	Determine efficiency of post-developer rinsing
Pads not completely soldered	Solder mask residue on pads	Work with vendor to improve solder mask applicat
		process
		Use acid precieaner which produces ow micro-etch a will not cause attack on previously soldered boards
Dewetting of solder	Copper surface may be contaminated with organic residues	1 Run 3 5 4 to detect the presence or organics. Re- cleaning procedure in Section 3 4 or change to one to doesn't leave organic residues.
Solder mask bilsters/poor adhesion	Undercure of the solder mask (thermally cured masks)	Follow supplier's recommended hardener mix ratio a stir cycle for two-part systems
		Follow supplier s bake time and temperature
		Allow sufficient time for cold operds to slowly heat cur temperature before starting timer
		Do not open oven during cure cycle
		Eliminate cold spots in oven
		Allow adequate air flow through oven to remove solve vapors and assure that the vent system is not blocke
		Maintain oven by regular temperature monitoring a cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as sole enter a for determining complete cure (see IPC-8 8408)
	Incomplete cure of UV masks	Follow suppliers recommended energy level for cur at the coating thickness used
		Maintain bulbs in amp unit by cleaning regularly, de mining output energies routinely and changing required, typically 1000 hours
	_	Monitor temperature in curing unit to prevent excess board heating
	Copper surface moroperly cleaned	Determine presence of intermetallic and/or organic ridues
		Change cleaning method such as brush type, bru pressure ninsing and drying if not used, add microelbefore scrubbing
oor e-ectrica properties	ncomplete removal of fluxes which	(solvent post-clean)
	contain non-ionic and rortic contami- nants	Use a chlorinated hydrocarbon-alcohol azeotrope remove polar and non-polar contaminants
		Avoid fluorocarbon solvents since they are less efficie
		Check cleaning equipment for plugged spray nozzle: other mechanical failures

(aqueous post-clean)

Replace spent cleaning fluid

Maintain pH of saponifier solution between 10.5-11.8 since ow values cause inefficient cleaning and high values will degrade aminate, components and coatings

Maintain efficient high pressure sprays to flush away non-saponified rosin acids.

Add rinse alds to rinse water to help remove residues

required before the solder mask is applied. This can be achieved by mechanical or chemical methods. *Pumice should* not be used on fused solder. *Scrubbing is also not recommended.* Boards with neavy oxide build up could be cleaned with a solder conditioner. If this is done, it is important to follow vendor is guidelines and to rinse thoroughly. Final mining after these procedures should follow recommendations under 3.4.4.

- **4.3.1 Mechanical Methods** Tin/lead is usually too soft for abrasive cleaning but it can be done when extreme care is taken. Cleaning equipment with soft, non abrasive brushes can be used if contact pressure is minimized to avoid damage to the circuitry and smeaning of the meta. *Never* use a scrubber that is used for copper since subsequent contamination can occur
- **4.3.2 Spray Cleaning** The appropriate spray equipment is recommended which allows a contact time with the cleaning agent of at least 45 seconds followed by at least 15 seconds of a clean spray rinsing
- **4.3.2.1 Solvent** The best results are obtained when solvents are used in both liquid and vapor phases. Typical degreasing solvents such as fluorochloro-hydrocarbons or 1,1,1-trichloroethane may be used. The use of methylene chloride for cleaning is not recommended because this solvent will attack the base laminate. Cleaning cycles of longer than 60 seconds can damage the metal surface or the base laminate.
- **4.3.2.2 Aqueous** Aqueous cleaning agents combined with a water rinse should provide a clean surface. Rinsing should incorporate high pressure, fan type spray nozzles operating at 2-3 bar (30-45 psi) with warm 15-35°C (60-95°F) water. Rinse duration should be at least 30 seconds. Refer to 3 4.4 and 3 4.5

- 4.4 Pre-Solder Mask Cleanliness Testing See 3.5
- **4.5 Application of Solder Mask** The methods procedures and techniques for applying and curing of solder mask are beyond the scope of this guideline. The screening coating or amination of solder mask onto clean timead circuitry, should be considered with the individual solder mask vendor's recommendations.
- **4.6 Trouble Shooting Guide—Cured Solder Mask** Table 3 is a list of problems and solutions of cured solder mask on fused tim/lead.

#### 5.0 Notes

**5.1 Cleanliness Test Equipment** The following is a list of available cleanliness test equipment. As new equipment becomes available vendors are encouraged to contact the IPC office with the appropriate information.

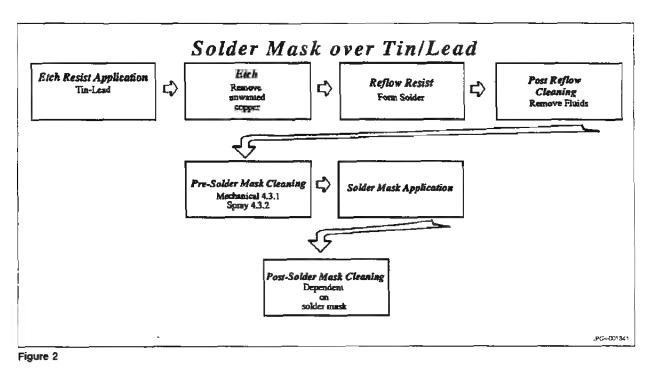
Alpha Metals Omega Meter Jersey City NJ (201) 434-6778 Alpha Metals lonograph Jersey City, NJ (201) 434-6778

Kester Soider Ionics 2000 Des Paines, IL (708) 297-1600 LONCO Zero Ion System Bensenville. IL

(800) 323 9625

Protonique Contaminometer Romanei-sur-Lausanne,

Switzerland (+21) 38 23 34



12

Table 3 Cured Solder Mask on Fused Tin/Lead

	Table 3 Cured Solder Mask on F	used Tin/Lead
Problem	Cause	Solution
Poor soider mask adhesion (general)	Contamination on board surface prior to solder mask application	Follow cleaning procedures out ned in Section 4.3
		Assure proper clean ness level (Section 3.5)
	Mosture trapped under solder mask can lead to circular birsters	Briefly oven dry beards at 71°C (160°F) List prior to mask application
		Check mask application room for high humidity or presidence of aqueous processing equipment
		Review storage time prior to solder mask application and determine maximum hold time
Poor solder mask adhesion (thermally cured masks)	Undercure of the solder mask—insufficient cross-linking of the poly-	Follow supplier's recommended nardener to resin rationand mix cycle for two-part systems
	mer coating will leave it vulnerable to attack from fluxes and cleaners and	Follow supplier sipake time and temperature
	to thermal shock	Allow sufficient time for cold boards to reach curing temperature before starting the timer
		Do not open oven during dure cycle
		Eliminate cold spots in over
		Allow adequate air flow through oven to remove solvent vapors and assure that vent system is not blocked
		Maintain oven by regular temperature monitoring and cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see iPC-SM-840B)
Poor solder mask adhesion (U.V. cured masks)	Undercure of the solder mask— insufficient cross-linking of the poly- mer coating will leave it vulnerable to attack from fluxes and cleaners and to thermal shock	Follow suppliers recommended energy level for curing at the coating thickness used
		Maintain buibs in lamp unit by cleaning regularly deter- mining output lenergies routinely and changing as required.
		Monitor temperature in curing unit to prevent excessive board heating which could reliew the tin-lead
Poor solvent or cleaner resistance	Undercure of the solder mask (thermally cured masks)	Follow the supplier's recommended hardener mix ratio and stir cycle for two-part systems
		Follow suppliers bake time and temperature
		Allow sufficient time for cold boards to reach heat cur- ing temperature before starting timer
		Do not open oven during cure cycle
		Eaminate cold spots in oven
		Allow adequate air flow through oven to remove solvent vapors and assure that the vent system is not blocked
		Mantain oven by regular temperature monitoring and cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see IPC-SM-840B)
	UV cured masks)	Follow supplier's recommended energy leve, for curing at the coating thickness used.
		Maintain buibs in lamp unit by cleaning regularly, determining output energies routinely and changing as required, typically 1000 hours
		Monitor temperature in our rig unit to prevent excessive board heating
	.nadequate solder mask type	Use solder mask that meets the proper performance rever of IPC-SM-840B.
	Incompatible cleaning chemistry	Change to a compatible mask/c eaner combination

Table 3 Cured Solder Mask on Fused Tin/Lead (cont.)

Problem	Cause	Solution
Poor electrica, properties	Contamination on board surface	Follow defined cleaning procedures
	prior to solder mask application	Perform deanwess testing prior to applying solder mask
		Recheck resistivity of process rinse waters
	ncomplete cure of UV-curable solder	Increase cure time
	mask	Check calibration of JV curing oven
Poor cosmetic appearance— pinhoies craters or tisheyes	Only contamination on surface prior to solder mask application	Thoroughly remove a grease and ois (see Section 3.3)
	Bubbling during screening process	Use finer mesh screen fabric
	which can pop during the cure step	Slow down squeegee speed
		Add flow agent or solvent to solder mask
		Work with supplier to optimize screening parameters
D scoloration	Undercure of solder mask which leads to water and flux attack	Follow suppliers recommended hardener to resin ratio and stricycle for two-part systems
		Follow supplier sipake time and temperature
		Allow sufficient time for cold boards to reach curing temperature before starting timer
		Do not open oven during cure cycle
		Eliminate "cold spots in oven
		Allow adequate air flow through oven to remove solven vapors and assure that the vent system is not blocked
		Maintain oven by regular temperature monitoring and cleaning
		DO NOT use the methylene chloride cure test as the sole criteria for determining complete cure (see IPC SM-840B)
	Incomplete removal of residues	(solvent post-clean) Use a chlorinated hydrocarbon—alcohol azeotrope to remove both polar and non-polar contaminants
		Avoid fluorocarbon solvents since they are less efficient
		Check cleaning equipment for plugged spray nozzles of other mechanical failures.
		Completely remove fluxes within 0 minutes after solder ing
		(aqueous post-clean) Maintain pH of saponifier solution between 10.5-11.8 since low values cause inefficient cleaning and high values will degrade aminate components and coatings.
		Maintain efficient high pressure sprays to fush away non-saponif able rosin acids
		Replace spent cleaning fluid.
		Thoroughly post-clean boards within 10 minutes after soldering to minimize cleaning difficulties
		Add rinse aids to rinse water to help remove residues
Poor solderability	Solder mask residue on pads	Check oven for baranced load size with efficient venting capability.
		Use dedicated oven to prevent cross contamination
		Work with vendor to improve solder mask application process

#### Resistivity of Solvent Extract

#### 2/88

Δ

**1.0 Scope** This test method is designed for determining the presence of ion zable surface contaminants on printed-wiring boards and assemblies. The basis of the test is the change in electrical resistivity of the solvent used to wash the printed-wiring board or assembly. The resistivity is lowered when contaminants, such as plating salts, flux residues, etchants, or detergents, are dissolved.

#### 2.0 Applicable Documents

- 2.1 See 6.1, References
- **3.0 Test Specimen** Any printed-wiring board or assembly of sufficient area to provide enough the solvent to determine its resistivity

#### 4.0 Test Equipment

- **4.1** Miscellaneous laboratory ware such as beakers, funnels storage and wash bottles. The laboratory ware may be made of glass or polyethylene but it is imperative that all apparatus used in this procedure be scrupulously clean.
- **4.2** Conductivity Bridge, Barnstead Model PM-70CB or equivalent.
- **4.3** Conductivity Cell, Beckman Model CEL-A01-Y87-CERT with a cell constant  $K=0.10/\mathrm{cm}$  or equivalent.
- **4.4** Wash solution composed of 75% by volume, ASC Reagent Grade isopropyl archol, 25% by volume distilled water with a minimum resistivity of  $6.0 \times 10^6$  ohm-cm.
- 4.5 Linear measuring device such as calipers capable of measuring the area of the printed-wiring board or assembly to the nearest 25.4 mm<sup>2</sup> [1.0 in <sup>2</sup>]

#### 5.0 Test Processure

- **5.1** Determine the surface area of the printed-wiring board or assembly including both sides of the board and an estimate of the area of any components mounted thereon.
- **5.2** Suspend the test specimen within a convenient sized funnel positioned over a collection breaker.

- **5.3** Use 100 milliliters of wash solution for each 250 mm² [10 n²] of the board or assembly area and direct in a fine stream on both sides of the test specimen. The wash activity shall occur for a minimum of one (1) minute. It is imperative that the initial washings be included in the sample to be measured for resistivity.
- 5.4 Measure the resistivity of the collected wash solution in accordance with the conductivity bridge manufacturer's instructions

#### 6.0 Notes

**6.1 References** This test procedure, including solution preparation and a laboratory ware cleaning procedure, is documented in Materials Research Report No 3-72. "Printedwiring assemblies; Detection of ionic contaminants on". Application for copies of this report should be addressed to.

Freedom of Information Act Office Naval Avionics Center 6000 East 21st Street Indianapolis, IN 46219–2189

Ionizable Detection of Surface Contaminants (Dynamic Method)

2/88

A

#### 1.0 Scope

- **1.1 Purpose** This test method establishes a procedure for determining the amount of surface onic soil on a printed board or printed board assembly. The soil must be soluble in water, alcohol or some mixture of both. The determination can be made on either a quantitative or a qualitative basis
- **1.2 Restrictions** The equipment used does not differentiate between specific ionic specie. It determines their presence and ranks them according to their ionic mobilities. Salts with higher ionic mobilities are weighed heavier than salts with lower ionic mobilities.
- **1.3 Application** This method has application as a quality control tool and as a method for developing and evaluating cleaning process parameters. As a quality control tool it can be used to inspect parts to determine if they conform to predetermined levels of cleanliness. In process development this procedure can be used to evaluate solvent and process efficiency and also to set levels of acceptable cleanliness.
- 2.0 Applicable Documents None
- **3.0 Test Specimen** Any preproduction or product on bare printed board or printed board assembly.
- **4.0 Test Equipment** A dynamic measurement device which extracts the ions from the surface being measured and checks conductivity of a rinse solution. Solvent is pumped through a recirculating loop which includes a plastic tank, conductivity cell and ion exchange column to remove all traces of ons from the solvent before entering the tank. The conductivity cell used is temperature compensated to avoid reading variations caused by temperature changes. A metering pump pumps the solution through the loop at a constant rate. A recorder is used to follow the change of conductivity with time. (See notes).

#### 5.0 Procedure

**5.1 Solvent Systems** The equipment can be used with either pure water or water/alcohol mixtures. Water is used when only water soluble salts such as plating salts are to be measured. The use of pure water results in a measuring fluid with an initial conductivity of about 0.1 micromhos (10 megohms).

Water/aicoho, systems are used when nonpolar sols might encapsulate or otherwise mask the water soluble ionic soils Various alcohols have been used successfully. The preferred systems use either N-propanol or isopropanol as the alcohols solvent. Because of the high dielectric constant of the alcohols excessive alcohol in the mixture will generally degrade the sensitivity of the measurement. To obtain maximum sensitivity and to insure sufficient aicohol to readily remove all nonpolar residue, the recommended mixtures are 40% (by volume) N-propanol and 60% water or 50% (by volume) isopropanol and 50% water. Mixtures with as high as 75% by volume is sopropanol have been successfully used.

- **5.2 Calibration** Once the fluid in the system has established a stable level of conductivity, a precise quantity of calibration solution is injected into the test solution. The system then integrates the variables of test solution conduct vity, pumping rate sample area and time into a contamination level specified as equivalent micrograms of sodium chloride (per sq.) of the sample.
- **5.3 Testing** Once the system has been calibrated in accordance with 5.2, the test specimen is immersed in the sample tank. Care must be taken not to handle the sample or any of the appliances used to insert it into the tank. Finger dirt contains highly mobile ionic soils and may give spurious readings

During the course of the measurement, the conductivity of the solution will depart from the baseline of conductivity and then gradually return. When it has returned to the baseline, no additional soil can be removed and the measurement is complete.

The curve for that sample is then integrated as per section 5.2 and the calibration curve is used to determine the amount of contamination on the part

- **5.4 Evaluation** Without a sample in the tank, a condition will be established in which the conductivity of the solvent, as measured by the conductivity cell, will attain a constant low value. With the introduction of a contaminated sample into the tank, the conductivity reading measured at the cell will rise rapidly. The sample remains immersed in the solvent until the conductivity of the solvent returns to its original equilibrium level. At that point, no further ionic material can be removed from the sample.
- **5.4.1 Theory of Measurement Technique** The entire amount of ionic material removed from the sample can be related to the integral of the conductivity readings over the

# Ionizable Detection of Surface Contaminants (Dynamic Method)

2/88

A

period of time required to dissolve the material and purge it through the system as follows. At any instant it, the number of moles,  $n_1$ , of ionic material within the conductivity cell is  $n_1 = V_c \times C_t$  where  $C_t$  is the concentration of ions and  $V_c$  is the cell volume which is constant. Over an infinite amount of time, the total number of moles of ions passing through the cell, N, will be:

$$N = \int_{0}^{\infty} n_{t} dt = V_{c} \int_{0}^{\infty} C_{t} dt$$

Since we are dealing with very low concentrations (10 <sup>4</sup>N), we can assume complete ionization, therefore

Conductivity 
$$-L = kC$$

(assuming one salt to be present). Of course, differentionic saits with different ionic mobilities will give different conductivities for a given concentration

$$N = kV_c \int_{0}^{\infty} L_t dt$$

If the monitor and recorder responses are linear with respect to L, then according to the last equation, the area under the conductivity-time curve which is charted on the recorder is a linear function of N, the total amount of ions removed from the sample.

**5.4.2 Treatment of Test Data** The number obtained from section 5.3 will be the ionic contain nation on the surface of the board in terms of equivalent micrograms of sodium chloride. (If the calibration solution contained a different salt than sodium chloride the number will be in term of equivalent micrograms of that salt). It is common practice to divide this figure by the total area on both sides of the printed board or printed board assembly and present the data in terms of equivalent micrograms of salt per unit of area.

By using a scale of measurement based on only one sait, i.e. sodium chloride, the ionic contaminants are being measured in terms of their ionic mobility. The more mobile or active an ion is, the more likely it is to cause a problem. Thus, while this test method will not differentiate between specific ions, it is an effective way of quantifying the presence of many ions

#### E.O Nates

- 6.1 Other Uses The equipment measures the ionic activity of any part or solution which contains ionic material, it may be used for various other purposes. A partial list appears below.
- A. Incoming inspection of reflowed tin/lead boards to determine if residues have been completely removed.
- B. Measurements of purity of incoming and redistilled solvents
- C. Measurement of amount of activated rosin flux dissolved in the boiling sump of a vapor degreaser.

- D. Measurement of activity level of activated rosin fluxes.
- **6.2 Availability** The equipment specified, or its equivalent, may be procured commercially. Source is Alpha Metals Inc. (Equipment name is lonograph<sup>TM</sup>).

#### 2.3.26.1

Ionizable Detection of Surface Contaminants (Static Method)

#### 2/88

#### 1.0 Scope

- **1.1 Purpose** This test method establishes a procedure for determining the amount of surface onic solion a printed board or printed board assembly. The soil must be soluble in water, alcohol or some mixture of both. The determination can be made on either a quantitative or a qualitative basis.
- **1.2 Restrictions** The equipment used does not differentiate between specific ionic specie. It determines their presence and ranks them according to their ionic mobilities. Saits with high ionic mobilities are weighted heavier than saits with lower ionic mobilities.
- **1.3 Application** This method has application as a quality control tool and as a method for developing and evaluating cleaning process parameters. As a quality control tool, it can be used to inspect parts to determine if they conform to predetermined levels of cleanliness. In process development this procedure can be used to evaluate solvent and process efficiency and a so to set levels of acceptable cleanliness.

#### 2.0 Applicable Documents None

- **3.0 Test Specimen** Any preproduction or production bare printed board or printed board assembly.
- **4.0 Test Equipment** A measuring device based on extraction of ions in a static volume of solution. Solution is cleaned through ion exchange columns to a high resistivity value before initiation of a test. During a test, a recirculating loop is used consisting of the solution in the test tank being pumped to provide agitation, past the measuring probe and back into the test cell again, bypassing the ion exchange columns. Thus the term "static". A meter or digital display along with a recorder or printer is used to record the results. The conductivity probe is temperature compensated

#### 5.0 Procedure

**5.1 Solvent/Systems** The equipment can be used with alcohol/water mixtures of 50% alcohol/50% water to 75% alcohol/25% water plus or minus 10%

Alcohol/water systems are used when nonpolar soils might encapsulates or otherwise mask the water soluble onic soils. Various alcohols have been used successfully. The preferred

systems use either N-propanoi or isopropano as the alcohol solvent. Because of the high dielectric constant of the alcohols excessive alcohol in the mixture will generally degrade the sensitivity of the measurement. To obtain maximum sensitivity and to insure sufficient alcohol to readily remove all nonpolar residue the recommended mixtures are from 50% alcohol (by volume) and 50% water to 75% alcohol (by volume) and 25% water. The recommended optimum mixture is recommended to be 75% alcohol/25% water.

- **5.2 Calibration** Once the fluid in the system has established a high level of cleanliness (20 megohms or higher) a precise quantity of calibration solution is measured into the test solution. The system then measures resistivity, which can be calculated into a final contamination level expressed in equivalent micrograms of sodium chioride.
- **5.3 Testing** Once the system has been calibrated in accordance with 5.2, and the solution cleaned to a high resistivity value, a test may be accomplished by immersing the test specimen in the test cell. Care must be taken not to handle the sample or any of the appliances used to insert it into the tank. Finger dirt contains highly mobile ionic soils and may give false readings.

After insertion of the sample and during the course of the measurement, the resistivity of the solution will decline. End of test is determined by a preselected time or (depending on model of equipment) automatically aborted when no further change in contamination is measured.

- **5.4 Evaluation** Without a sample in the tank, a condition will be established in which the resistivity of the solvent, as measured by the conductivity cell, will obtain a maximum value as indicated by the meter or display readings in megohms. With the introduction of a contaminated sample into the test cell, the resistivity reading will decay. The sample remains immersed in the solvent for the predetermined time or if automatic time was preselected, until no further contamination is measured.
- **5.4.1 Theory** of **Measurement Technique** The entire amount of ionic material removed from the sample can be related using a formula for mathematical calculation of contamination as the equivalent of NaCl is micrograms per sq Where.
- D = Volume of solution in test cell
- B = End resistivity in megohms

2.3.26.1

# Ionizable Detection of Surface Contaminants (Static Method)

2/88

C = Sample surface area (L x W x 2)

G = Starting resistivity in megohins

A = % of alcohol in test solution

E = Empirical constant -0 008175

F = Emp rical constant 0 3093028

Formula will be

$$\frac{D}{C \times 10 \text{ (A E + F)}} \times \left(\frac{1}{B} - \frac{1}{G}\right) = \text{Micrograms NaCl/Sq}$$

Calculation can also be computed without subtracting the starting contamination (1/G). This is assuming that the starting contamination is small enough so that it may be ignored

**5.4.2 Treatment of Test Data** The number obtained from Section 5.3 will be the ronic contamination on the surface of the board in terms of equivalent micrograms of sodium chloride. (If the calibration solution contained a different sait than sodium chloride, the number will be in terms of equivalent micrograms of that sait). It is common practice to divide this figure by the total area on both sides of the printed board or printed board assembly and present the data in terms of equivalent micrograms of sait per unit of area

By using a scale of measurement based on only one salt i.e., sodium chloride, the ionic contaminants are being measured in terms of their ionic mobility. The more mobile or active an ion is, the more likely it is to cause a problem. Thus, while this test method will not differentiate between specific ons, it is an effective way of quantifying the presence of many ions.

#### 6.0 Notes

- **6.1 Other Uses** Because the equipment measured the ionic activity of any part or solution which contains ionic material, it may be used for various other purposes. A partial list appears below
- A. Incoming inspection of reflowed tin/lead boards to determine if residues have been completely removed
- B. Measurement of purity of incoming and redistilled solvents.
- C. Measurement of amount of act vated rosin flux dissolved in the boiling sump of a vapor degreaser.
- D. Measurement of activity level of activated rosin fluxes.
- **6.2** Availability The equipment specified, or its equivalent, may be procured commercially. Source is Alpha Metals Inc. (Equipment name is Omegameter<sup>TM</sup>).

Surface Organic Contaminant
Detection Test (In-House Method)

#### 2/88

Α

#### 1.0 Scope

- 1.1 This simple and rapid non-destructive test method is for use in determining if organic, non-ionic contaminants are present on bare printed wring board, and completed assembly surfaces in the production area by imited technical personnel. Although the test fluid is also capable of dissolving very small amounts of various inorganic compounds, their presence would generally be masked by the much higher levels of the organic contaminants.
- **1.2** The test will neither identify the contaminants present nor separate contaminant mixtures into the individual constituents (see test method 2.3.39). The present visual limit of organic contaminant detection by this method is approximately 10 micrograms/cm<sup>2</sup>.

#### 2.0 Applicable Documents

**IPC-TP-383** 'Organic Surface Contamination—Its Identification, Characterization Removal, Effects on Insulation Resistance and Conformal Coating Adhesion''

IPC-TM-650 Test Method 2.3.39, "Surface Organic Contamination Identification Test (Laboratory Analytical Method )"

#### 3.0 Test Specimen

**3.1** A bare printed wining board or completed assembly at least 50 mm  $\times$  75 mm  $\{2'' \times 3''\}$   $\times$  thickness.

### 4.0 Apparatus & Materials

- **4.1** The test fluid: Spectro or High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) grade acetonitrile. Other appropriate solvents may be used as agreed upon by user and vendor.
- 4.2 Microscope slides, 25 mm x 75 mm [1" x 3"], glass
- **4.3** Disposable glass medicine dropper with rubber squeeze bulb
- **4.4** 60 m (2 oz.) capacity rubber squeeze builb fitted with glass medicine gropper tube
- 4.5 Lint free gloves

#### 5.0 Procedure

#### 5.1 Preparation

- **5.1.1** Pre-clean microscope side by rinsing the side with test fluid, drying it as described in 5.2 and establishing that it is free from residues as described in 5.4.
- **5.1.2** Hold the test specimen by the edges at an angle above the pre-cleaned microscope slide. The specimen should not touch the slide.

#### 5.2 Test

- **5.2.1** Slowly drip 0.25-0.50 ml of test fluid onto the test specimen, allowing it to wash across a small area of the surface of the specimen and drip onto the microscope side. Do not allow medicine dropper to touch test specimen. See Figu're 1.
- **5.2.2** Evaporate the test fluid with a gentle stream of dry, offree air or nitrogen in a well-ventilated fume nood. If the compressed air or nitrogen specified above is not available, a gentle air stream may be generated using a large rubber squeeze bulb and glass tube.
- **5.2.3** Rapid evaporation of the test fluid must be avoided, to prevent evaporative cooling of the glass slide and subsequent mosture condensation from the air onto the slide
- **5.2.4** Application of sufficient heat to evaporate the water may volatize part or all of the residue and invalidate the results.
- **5.2.5** Repeat until 2 m of test fluid washings per square inch of washed specimen surface area have been accumulated on the side

#### 5.3 Control

- **5.3.1** Dispense the same quantity of test fluid onto a duplicate pre-cleaned microscope slide and allow to evaporate.
- **5.3.2** Examine the slide as described in 5.4. No residue should be seen.
- **5.3.3** If residues are seen, the test fluid is not pure enough to use in this test

2

Surface Organic Contaminant Detection Test (In-House Method)

2/99

W

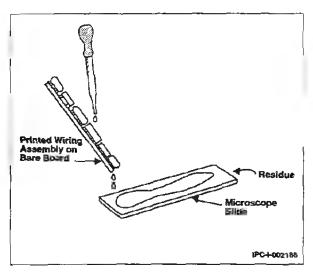


Figure 1 Contaminant collection on microscope slide

- **5.3.4** A faint outline of the test fluid may be seen on the slide. This does not necessarily indicate the presence of contamination.
- 5.4 Evaluation Hold the slide on the edges and tilt so overhead incident light is reflected from the surface. The residues (if present) washed from the test specimen will be readly visible.

#### i.0 Notes

- **6.1** Test fluid from Fisher Scientific Co. High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) grade acetonitrile was used to develop this test method. Equivalent material from other suppliers may be used, provided no residue remains after evaporation as described in this test method.
- **6.2** The American Conference of Governmental and Industrial Hygienists has adopted a 40 ppm (v/v) Threshold Limit Value (TLV) for acetonitrile, it is recommended that the application and evaporation of test fluid be carried out in a well-ventilated fume hood. Rubber gloves and safety glasses should be provided for the person(s) running the test.
- **6.3** Fisher Sc entific Co. plain grass microscope slides (1 "  $\times$  3"), catalog number 12-549, were used to develop this test. Equivalent slides may be used for testing
- **6.4** Fisher Scientific Co straight medicine droppers, catalog number 13,700, were used to develop this test. Equivalent droppers or disposable pipettes may be used.

- **6.5** Fisher Scientific Co. 60 ml (2 oz.) capacity rubber squeeze bubs, catalog number 14-070D (or equivalent), are suitable for this use when fitted with a straight glass medicine dropper
- **6.6** The actual identification of the contaminant(s) may be accomplished using IPC Test Method 2.3.39, if dentification is to be performed the specimen can be transferred to an MIR plate. See paragraph 5.3.1 of IPC Test Method 2.3.39.

Surface Organic Contaminant Identification Test (Infrared Analytical Method)

2/88

Α

#### 1.0 Scope

1.1 This infrared spectrophotometric analysis test method is for use in dentifying the nature of non-onic organic contaminants present on printed wiring board and assembly surfaces by use of the Multiple internal Reflectance (MIR) Method, once their presence has been established by the solvent extraction procedure in IPC-TM-650, Test Method 2 3.38. This test should be performed only by an experienced spectroscopist.

#### 2.0 Applicable Documents

**IPC-TP-383** "Organic Surface Contamination.—Its Identification, Characterization Removal, Effects on Insulation Resistance and Conformal Coating Adhesion."

**IPC-TM-650** Test Method 2.3.38, "Surface Organic Contaminant Detection Test (In-House Method)."

#### 3.0 Test Specimen

**3.1** A bare printed wring board or completed assembly at least 51 mm x 51 mm [2" x 2"] x thickness.

#### 4.0 Apparatus & Materials

- **4.1** An intrared spectrophotometer capable of scanning the 2.5–16 micron range.
- **4.2** A multiple internal reflectance (MIR) attachment with a KRS-5 or ZnSe plate. (See 6.10).
- **4.3** The test fluid is Spectro or High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) grade acetonitrile. Other appropriate solvents may be used as agreed upon by user and vendor
- **4.4** Disposable glass medicine dropper with rubber squeeze bulb or 2 m , capacity glass syringe.

#### 5.0 Procedure

**5.1** Clean an MIR plate by moistening a soft tissue with test fluid, then gently wiping the surface of the plate until all residues have been removed. Since the KRS-5 plate scratches easily, stubborn stains may be removed by ultrasonic cleaning in acetone.

- 5.2 Obtain the contam nated microscope side specimen prepared in Test Method 2 3 38
- **5.3 Test** Hold the contaminated microscope slide by the edges at an angle above the clean MIR plate. The spec men should not touch the plate
- **5.3.1** Transfer the residue from the microscope slipe as described below. Slowly drip 0.25–0.50 mll of test fluid onto the contaminated microscope slide, allowing it to wash across the surface and drip onto the M R plate (See Figure 1)

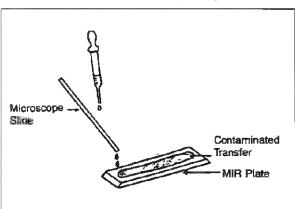


Figure 1 Contaminant transfer to MIR plate

- **5.3.2** Evaporate the test fluid with a gentle stream of dry, oil-free air or nitrogen in a well-ventilated fume hood
- **5.3.3** The same procedures may be followed if test is performed by applying test fluid directly on a bare board or completed assembly and depositing the washed contaminant directly onto an MIR plate. (See Figure 2)
- **5.3.4** Place the MIR plate in the MIR attachment. Generate an infrared spectrum of the residue according to the instrument manufacturer's recommended procedure. Remove and clean the MIR plate.
- 5.4 Evaporate the same amount of test fluid on clean MIR plate to obtain a control specimen

#### 5.5 Evaluation

5.5.1 Compare the test and control spectra

1 -

Surface Organic Contaminant Identification Test (Infrared Analytical Method)

#//B

A

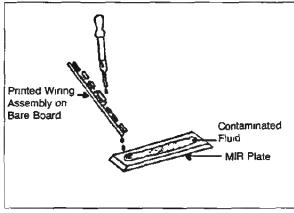


Figure 2 Contaminant collection on MIR plate

- **5.5.2** If the spectra are not identical, the test specimen is contaminated.
- **5.5.3** The chemical class for the contaminant may be determined from the major bands in the spectrum in Table 1

Table 1 Organic Contaminant Class Identification by Major Infrared Spectrum Bands

Organic Contaminant Class	Major Contaminant Class Infrared Spectrum Bands Needed For Identification (expressed in microns)
Ether, Aliphatic	8 8-9 1
Ether, Aryl	7.8-8.0
Carboxylic Acid ,	3.2-4.1 5.8-5 9 6.9-7 1 10.4-10 9
Carboxylic Acid Salts	6 2-6.4 7 1-7 4
Ester,	5 7-5 8 8 0-8.5
Amide	2 8-3 3 5 9-6 5
Nitrile (cyano)	4 4-4 5
Alcohol (includes hydroxyl glycols, polyots, etc.)	2.8 3 1 8 7-9.7

**5.5.4** See Figures 3 and 4, comparative examples of spectrum graphics.

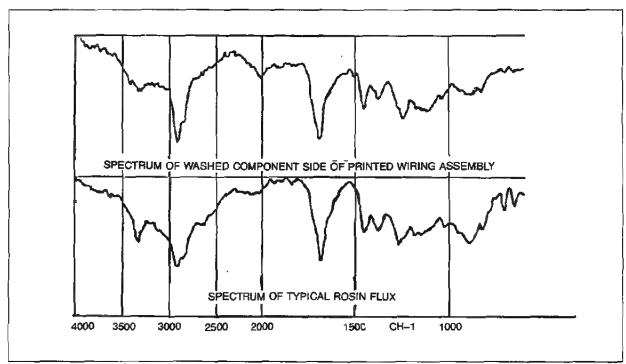


Figure 3 Typical spectrum comparison

Ā

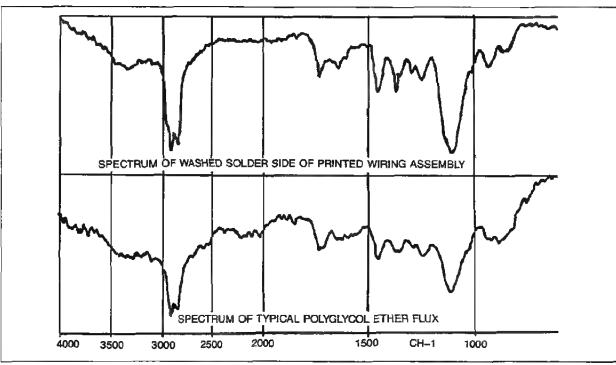


Figure 4 Typical spectrum comparison

#### 6.0 Notes

- **6.1** A Perkin Elmer Model 283 infrared Spectrophotometer was used to develop this test method. Equivalent instruments from other manufacturers should be satisfactory if they have provision for a multiple internal reflectance (MiR) attachment.
- **6.2** The test fluid Fisher Scientific Co High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) grade acetonitrile was used to develop this test method. Equivalent material from other suppliers may be used, provided no residue remains after evaporation as described in this test method. Other solvents may be required to dissolve specific residues.
- **6.3** Fisher Scientific Co straight medicine droppers, catalog number 13–700, were used to develop this test. Equivalent droppers or disposable pipettes may be used.
- **6.4** The American Conference of Governmental and Industrial Hygienists has adopted a 40 ppm (v/v) Threshold Limit Value (TLV) for acetonitrile. It is recommended that the application and evaporation of acetonitrile be carried out in a well-ventilated

furne hood. Rubber gloves and safety glasses should be provided for person(s) running the test.

- **6.5** Modified procedures permit detect on and identification of contaminant residues containing carboxylic acid, carboxylic acid salts, ester, hydroxyl, amide, or nitrile (cyano) functional groups. For example, dicyandiamide ("dicy"), dehydroabietic acid, unpolymerized bisphenoi-A type epoxy resins, rosin and long chain amides have also been identified on printed wring surfaces.
- **6.6** Although the test fluid is also capable of dissolving very small amounts of various inorganic compounds, their presence would generally be masked by the much higher levels of the organic contaminants.
- **6.7** Rapid evaporation of the acetonitrile must be avoided to prevent evaporative cooling of the MIR plate and subsequent moisture condensation from the air onto the plate. Application of sufficient heat to evaporate the water may volatilize part or all of the residue and invalidate the results. The present I mit of detection of arylalkyl polyether residues by this method is 10 micrograms/cm<sup>2</sup>.

# Surface Organic Contaminant Identification Test (Infrared Analytical Method)

2/88

A

- **6.8** The maximum organic surface contamination levels that will still permit reliable end-use operation of printed wiring assemblies of differing component densities and conductor line specings have not been established for the various contaminants
- **6.9** The present imit of detection can be easily extended by an order of magnitude using more sophisticated instrumentation and computer enhanced spectra. (See Figure 3 and 4)
- **6.10** The KRS–5 plate is very toxic; it should be handled only with gloved hands, and should be polished with recommended polishing compound to minimize generation of hazardous dust

**д** д

#### 2.6.3.1

Moisture and Insulation Resistance— Polymeric Solder Masks and Conformal Coatings

2/88

В

**1.0 Scope** This test method is to determine the moisture and insulation resistance of applied polymer solder mask or conformal coatings under two separate prescribed conditions of temperature and humidity. One is a set of conditions for qualification testing of the material as applied to IPC-B-25 test boards after the material has passed the raw material qualification tests and one is for production quality conformance testing of the material as applied to the standard "Y" pattern coupons. The electrical measurement methods are different for qualification testing and production quality conformance testing, in that insulation resistance measurements are made during and after the environmental exposure for the quality conformance testing.

#### 2.0 Applicable Documents

IPC-SM-840 Qualification and Performance of Permanent Poymer Coating (Solder Mask) for Printed Boards

IPC-CC-830 Qualification and Performance of Electrical insulating Compound for Printed Board Assemblies

#### 3.0 Test Specimens

IPC Multipurpose Test Board Number PC-B-25 (see illustration for qualification testing)

Standard Military "Y" pattern test coupons for coating conformable testing. The spacing in the "Y" pattern should be either 25 mill intes/25 mill spaces or the minimum spacing on the production board, whichever is smaller.

#### 4.0 Apparatus

- **4.1** A clean test chamber capable of programming and recording an environment of 25 ±2°C [77°F] to at least 65 ±2°C [149°F] and 90% to 98% relative humidity minimum.
- **4.2** A power supply capable of producing a standing bias potential of 100 volts do with a tolerance of  $\pm 10\%$
- **4.3** A resistance meter capable of reading high resistance (10<sup>12</sup> ohms or greater) with a test voltage of 500 volts
- 4.4 Metal tongs.
- 4.5 Soft bristle brush

- **4.6** Deionized or distilled water (2 megohimi-cm minimum resistivity recommended)
- 4.7 sopropy aconol
- 4.8 Drying oven capable of maintaining at least 120°C
- 5.0 Test

#### 5.1 Test Conditions

- 5.1.1 Class 1-35 ±5°C 90 to 98% RH min. 4 days (static)
- **5.1.2** Class 2-50 ±5°C 90 to 98% RH min., 7 days (static)
- **5.1.3** Class 3-25  $\pm 2^{\circ}$ C to 65  $\pm 2^{\circ}$ C 90 to 98% RH min \*, 6 2/3 days (cycling)
- \*May drop to 80% RH min during temperature drop See 5.3.5

#### 5.2 Specimen Preparation

- **5.2.1** Positive, permanent and non-contaminating dentification of test specimen is of paramount importance
- **5.2.2** Visually inspect the test specimens for any obvious defects, as described in IPC-A-600. If there is any doubt about the overall quality of any test specimen, the test specimen should be discarded.

#### 5.2.3 Electrical Connections

- **5.2.3.1** For qualification specimens, solder an individual stranded Tefion insulated wire to each pad of Coupons B and E of the IPC-B-25 test pattern. These wires will be used to connect each pad of Coupon B and E to polarization and insulation resistance testing.
- **5.2.3.2** For quality conformance specimens, solder single stranded Teflor insulated wires in each of the connection points of the "Y" pattern specimens. These wires will be used to connect the "Y" patterns to polarization and insulation resistance testing.
- **5.2.4** Soldering Flux Removal Remove flux from lead ands as follows

69

2.6.3.1

#### Moisture and Insulation Resistance—Polymeric Solder Masks and Conformal Coatings

2788

В

- **5.2.4.1** Wet test lead terminals with delonized or distilled water and sorub with a soft bristle brush for a minimum of 30 seconds. During the remainder of the specimen preparation, handle test specimens by the edges only.
- **5.2-4.2** Spray rinse thoroughly with delonized or distilled water Hold test specimen at an approximate 30° angle and spray from top to bottom
- **5.2.4.3** Wet test lead terminals with clean sopropyl alcohol and agitate for a minimum of 30 seconds. Scrub with a soft bristle brush to remove flux residue
- **5.2.4.4** Rinse cleaned area thoroughly with fresh isopropyl alcohol.
- **5.2.4.5** Dry test specimens in a drying oven for a minimum of three hours at 49 to 60°C
- **5.2.5 Specimen Storage** if non-treated boards are to be stored prior to testing, place the boards in clean plastic bags, and close the bags (do not heat seal)

#### 5.2.6 Coatings

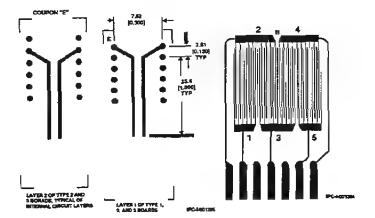
- **5.2.6.1 Application** Apply coating(s) to the appropriate area of the test specimen, in a manner consistent with user's production techniques, as specified by the vendor. Maintain uncoated (bare) board(s) to use as control specimens during testing.
- **5.2.6.2** After the application of coating, the test specimens are to be cured, as specified by the vendor.
- **5.2.6.3** After curing, both bare and coated test specimens are to be conditioned at laboratory ambient temperature for 24 hours.
- **5.2.7 Test Specimen Cleanliness** For the remainder of the test specimen preparation and testing, the surface of the test specimens either uncoated or coated either with soider mask or conformal coating, depending on which is under test, should not be handled or exposed to any other contaminating influence.

#### 5.3 Procedure

- **5.3.1** Condition specimens at 50°C ±5° (122°F) with no added humidity, for a period of 24 hours.
- **5.3.2** Allow specimens to cool and take the initial insulation resistance measurements at laboratory ambient temperature.

See Note 6.3 Apply 500 vots DC on the specimen sitest points as specified in 5.3.2.1 with the resistance meter and take the reading after 1 minute.

**5.3.2.1** The test points for qualification tests are 1 to 2 2 to 3. 3 to 4 4 to 5 of specimen B and/or E on PC-B-25 test boards (see diagram below). Test points 1 3 5 are connected to the positive (+) terminal and test points 2-4 are connected to the negative terminals of the resistance meter. For quality conformance, test points are at all connection points on the "Y" pattern test coupons.



- **5.3.3** Place specimens in a chamber, in a vertical position and under a condensation drip shield by connecting the DC voltage source to the specimen test points as indicated in paragraph 5.3.2.1. Apply a 100 volt dc polarization voltage to all specimens. Each chamber load shall contain at least one uncoaled specimen subjected to the same processing (except coating) as the coated specimens. All specimens shall be processed through step 5.2 at the same time.
- **5.3.4** Expose the class 1 and 2 test specimen(s) to the static conditions described under 5.1.1 and 5.1.2, respectively. An uncoated specimen(s) shall be included to act as a control.
- **5.3.5** Expose the class 3 test specimens to 20 cycles of temperature and humidity. An uncoated specimen shall be included to act as a control. The uncoated specimen should be shielded to prevent formation of surface moisture on the specimen white in the chamber Polarizing voltage shall be maintained throughout the entire 20 cycle period. Humidity shall be maintained at 90% RH minimum throughout the 20 cycle period except that when going to low temperature (stepic) the humidity may drop at 80% RH minimum.
- (a) Start test at 25°C and raise temperature to 65°C, over a time

2.6.3.1

Moisture and Insulation Resistance—Polymeric Solder Masks and Conformal Coatings 2/8B

В

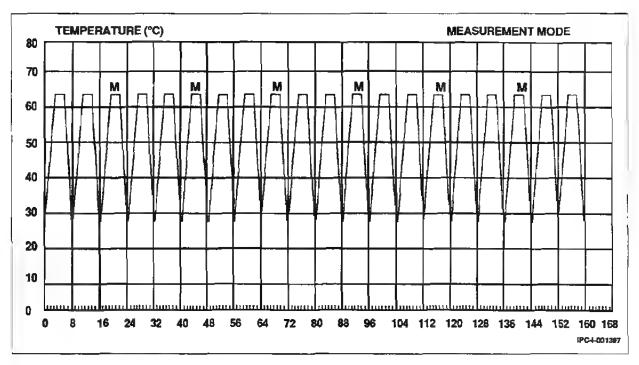


Figure 1 Moisture and insulation resistance test graph

span of 1-3/4  $\pm$ 3/4 hours.

- (b) Maintain temperature at 65°C over a time span of 3 hours to 3.1/2 hours.
- (c) Lower temperature from 65°C to 25°C over a time span of 1-3/4 ±1/2 hours

This constitutes one complete cycle. There shall be no delay between cycles. Siee Figure 1

#### 5.4 Measurement

- **5.4.1** Disconnect 100 volts do polarized voltage source before taking any insulation resistance measurement. Insulation resistance shall be read as specified in paragraph 5.3.2. Electrical connections to the specimen or the "Y pattern of B/E of the IPC test board shall be made so that electrical polarization voltage and the test voltage of the same polarity, are connected to the same terminal.
- **5.4.2** For qualification testing, measure and record insulation resistance (as specified in 5.3.2) once every 24 hours, between hours 2 and 3 of the high temperature phase of each cycle, or

under the static conditions for class 1 or 2 (see 6.4). These tests are to be conducted without opening the chamber. Completion of qualification testing shall be accomplished by disconnecting the bias voltage, removing the specimens from the chamber and taking an I/R reading after one hour and before two hours.

**5.4.3** For conformance testing, the measurements (as specified in 5.3.2) must be taken after disconnecting the bias voltage removal of specimen from the chamber and after 1 hour and before 2 hours stabilization at ambient (25  $\pm 2$ °C [77°F] 50  $\pm 3$ % RH). See 6.5.

#### 5.5 Evaluation

**5.5.1** Each test specimen shall be evaluated for insulation resistance quality for its class and type, following and/or during the above conditions as applicable. Although several I/R readings are taken during the test only the final readings in the chamber and the reading taken outside the chamber shall be used to determine pass/fail criterion. (Other readings may be used for diagnostic information or aborting the test). When coatings fail to pass the prescribed I/R requirements the I/R performance of the uncoated control board shall be evaluated. If the uncoated specimen also failed, the test shall be repeated with new specimens

2,6.3.1

# Moisture and Insulation Resistance—Polymeric Solder Masks and Conformal Coatings

2/88

В

that have been properly prepared and cleaned

**5.5.2** After completion of all electrical testing, the test specimens shall be examined for measing, blisters, deamination, or other forms of degradation, following 24 hour stabilization at aboratory ambient temperature (25  $\pm 2$  °C [77 °F] 50  $\pm 3$ % RH)

#### 6.0 Notes

- **6.1** Documented alternative cleaning procedures may be implemented if there is concern that scrubbing will adversely affect test results. i.e., when the test specimens have very fine spacing and/or are plated with soft metals (tin/lead gold, etc.)
- **6.2** The board should not be allowed to dry between steps 5.2.4.1 and 5.2.4.4
- **6.3** Initial wire placement must be maintained to ensure reproducible results
- **6.4** Note: The first five measurements are made for diagnostic purposes only or to determine if the test should be aborted, only the sixth reading is used for passifial criteria. See 5.5.1
- **6.5** Specimens may be stabilized at ambient conditions specified, inside the chamber.

This Page Intentionally Left Blank



Committees affected by this term:

# ANSI/IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits Definition Submission/Approval Sheet

SUBMITTOR NFORMATION: The purpose of this form is to keep current with terms routinely used in Name: \_\_\_\_ the industry and their definitions. Individuals or companies are invited to comment. Please City: \_\_\_\_\_ complete this form and return to: State/Zip: \_\_\_\_ 2215 Sanders Road Telephone: \_\_\_\_ Northbrook, IL 60062-6135 Fax: 847 509.9798 ☐ This is a **NEW** term and definition being submitted ☐ This is an ADDITION to an existing term and definition(s). ☐ This is a CHANGE to an existing definition.

Term		Definition		
		•	If s	pace not adequate, use reverse side or attach additional sheet(s
Artwork:	<ul><li>□ Not Applicable</li><li>□ Included: Elect</li></ul>	•	☐ To be supplied e:	
Documer	nt(s) to which this te	rm applies:		

	Office Use
IPC Office	Committee 2-30
Date Received:	Date of Initial Review:
Comments Collated:	Comment Resolution:
Returned for Action:	Committee Action: ☐ Accepted ☐ Rejected
Revision Inclusion:	Accept Modify
	IEC Classification
Classification Code • Serial Number	
Terms and Definit on Committee Final App	proval Authorization:
Committee 2-30 has approved the above	term for release in the next revision.
Name <sup>-</sup>	Committee: IPC 2-30 Date:

74

This Page Intentionally Left Blank

### **Technical Questions**

The IPC staff will research your technical question and attempt to find an appropriate specification interpretation or technical response. Please send your technical query to the technical department via.

tel 847/509-9700 www.ipc.org

fax 84//509-9798 e-mail: answers@ipc.org

## IPC World Wide Web Page www.ipc.org

Our home page provides access to information about upcoming events, publications and videos, membership, and industry activities and services. Visit soon and often

### IPC Technical Forums

IPC technical forums are opportunities to network on the Internet. It's the best way to get the help you need today. Over 2,500 people are already taking advantage of the excellent peer networking available through e-mail forums provided by IPC. Members use them to get time.y, relevant answers to their technical questions. Contact KeachSasamori@ipc.org for details. Here are a few of the forums offered.

### TechNet@ipc.org

TecnNet forum is for discussion of issues related to printed circuit board design, assembly, manufacturing, comments or questions on IPC specifications, or other technical inquiries. IPC also uses TechNet to announce meetings, important technical .ssues, surveys, etc.

#### ComplianceNet@ipc.org

ComplianceNet for am covers environmental, safety and related regulations or issues.

#### DesignerCouncil@ipc.org

Designers Council forum covers information on upcoming IPC Designers Council activities as well as information, comments, and feedback on current designer issues, .oca. chapter meetings, new chapters forming, and job opportunities. In addition, IPC can set up a mailing list for your individual Chapter so that your chapter can share information about upcoming meetings, events and issues related specifically to your chapter.

#### Gencam@ipc.org

Gencam deals with issues regarding the Gencam™ standards and specifications for Printed Circuit Board Layout and Design.

#### LeadFree@ipc.org

This forum acts as a peer interaction resource for staying on top of lead elimination activities worldwide and within IPC.

#### IPC\_New\_Releases@ipc.org

This is an announcement forum where subscribers can receive notice of new IPC publications, updates and standards.

#### ADMINISTERING YOUR SUBSCRIPTION STATUS:

All commands (such as subscribe and signoff) must be sent to listserv@ipc.org, Please DO NOT send any command to the mail list address, (i.e < mail list > @.pc.org), as it would be d.str.buted to all the subscripers.

Example for subscribing:

Example for signing off:

To: LISTSERV@IPC.ORG

To: LISTSERV@IPC.ORG

Subject:

Subject.

Message: subscribe TechNet Joseph H. Smith

Message: signoff DesignerCouncil

Please note you must send messages to the mail list address ONLY from the e-mail address to which you want to apply changes. In other words, if you want to sign off the mail list, you must send the signoff command from the address that you want removed from the mail list. Many participants find it helpful to signoff a list when travelling or on vacation and to resubscribe when back in the office.

#### How to post to a forum:

To send a message to all the people currently subscribed to the list, just send to <mail list>@ipc.org. Please note, use the mail list address that you want to reach in place of the <mail list> string in the above instructions.

Example:

To: TechNet@IPC.ORG Subject: <your subject> Message: <your message>

The associated e-mail message text will be distributed to everyone on the list, including the sender. Further information on how to access previous messages sent to the forums will be provided upon subscribing.

For more information, contact Keach Sasamori

tel 847/790-5315

fax 847/504 2315

e ma.l: sasako@ipc.org

www.ipc.org/htm./forum.htm

## **Education and Training**

IPC conducts loca, educational workshops and national conferences to help you better understand conventional and emerging technologies. Members receive discounts on registration fees, Visit www.ipc.org to see what programs are coming to your area.

### **IPC Certification Programs**

IPC provides world class training and certification programs based on several widely used IPC standards, including the IPC-A-610, the J-STD 001, and the IPC-A-600. IPC-sponsored certification gives your company a competitive advantage and your workforce valuable recognition.

For more information on programs, contact Alexandra Curtis

tel 847,790-5377

fax 847/509 9798

e mail: curtal@ipc.org

www.ipc.org

### **IPC Video Tapes and CD-ROMs**

IPC video tapes and CD-ROMs can increase your industry know-how and on the job effectiveness. Members receive discounts on purchases.

For more information on IPC Video/CD Training, contact Mark Pritchard

tel 505/758-7937 ext. 202

fax 505/758-7938

e mail: markp@ipcvideo.org

www.ipc.org

# **IPC Printed Circuits Expo®**



IPC Printed Circuits Expo is the largest trade exhibition in North America devoted to the PWB manufacturing industry. Over 90 technical presentations make up this superior technical conference. Visit www.ipcprintedcircuitexpo.org for upcoming dates and information.

Exhibitor information:

Registration information:
A.icia Ba.onek tel 847/790 5361

Contact: Mary MacKinnon Sales Manager

Exhibits Manager

fax 847/509 9798

tel 847/790-5386

tel 847/790-5398

e-mail: registration@ipc.org

e-mai.: MaryMackinnon@ipc.org

e-mail AliciaBalonek@ipc.org

# APEX® / IPC SMEMA Council Electronics Assembly Process Exhibition & Conference



APEX is the premier technical conference and exhibition dedicated ent.rely to the electronics assembly industry. Visit www.GoAPEX.org for upcoming dates and more information.

Exhibitor information:

Registration information:

Contact: Mary MacKinnon

tel 847/790-5360

tel 847/790 5386

fax 84//509-9798

e-mail. MaryMacKinnon@ipc.org

e mail: goapex@ipc.org

### How to Get Involved

The first step is to join IPC. An application for membership can be found in the back of this publication. Once you become a member, the opportunities to enhance your competitiveness are vast Join a technical committee and learn from our industry's best while you help develop the standards for our industry. Participate in market research programs which forecast the future of our industry. Participate in Capitol Hill Day and lobby your Congressmen and Senators for better industry support. Pick from a wide variety of educational opportunities: workshops, tutorials, and conferences. More up to date details on IPC opportunities can be found on our web page: www.ipc.org.

For information on how to get involved, contact:

Jeanette Ferdman, Membership Director

tel 847/790-5309

fax 847/509-9798

e-mail: JeanetteFerdman@ipc org

www ipc.org



or not-for-profit organization.)

# Application for Site Membership

Thank you for your decision to join IPC members on the "Intelligent Path to Competitiveness"! IPC Membership is **site specific**, which means that IPC member benefits are available to all individuals employed at the site designated on the other side of this application.

To help IPC serve your member site in the most efficient manner possible, please tell us what your facility does by choosing the most appropriate member category. (Check one box only.)

Independent Printed Board Ma	anufacturers						
This facility manufactures and sells interconnection products on the me		g boards (PWBs) or other electronic you make for sale?					
One-sided and two-sided rigid printed boards	<ul><li>☐ Multilayer printed boards</li><li>☐ Flexible printed boards</li></ul>	Other interconnections					
Name of Chief Executive Officer/Pro	Name of Chief Executive Officer/President						
Independent Electronic Assem	bly EMSI Companies						
This facility assembles printed wirin products for sale.	g boards, on a contract basis, an	d may offer other electronic interconnection					
Name of Chief Executive Officer/Pro	esident						
OEM-Manufacturers of any er	nd product using PCB/PCAs or	Captive Manufacturers of PCBs/PCAs					
This facility purchases, uses and/or use in a final product, which we ma		rds or other interconnection products for					
What is your company's primary pro	oduct line?						
☐ Industry Suppliers							
This facility supplies raw materials, electronic interconnection products.		s used in the manufacture or assembly of					
What products do you supply?							
Government Agencies/Academ	nic Technical Liaisons						
We are representatives of a govern concerned with design, research, ar		technical institute who are directly nection devices. (Must be a non-profit					



# Application for Site Membership

## Site Information:

Company Name			
Street Address			
City	State Zip/Postal Code	Country	
Main Switchboard Ph	one No. Main Fax		
Name of Primary Cor	ntact		
Title	Mail Stop		
Phone	Fax 9	-mail	
Company e-mail addi	ress Website URI	L	
Please Check	One:		
\$1,000.00	O Annual dues for Primary Site Membership (Twelve months of IPC membership begins from the time the application and payment are received)		
\$800.00	Annual dues for Additional Facility Membership: Additional membership for a site within an organization where another site is considered to be the primary IPC member.		
\$600.00**	Annual dues for an independent PCB/PWA fabricator or independent EMSI provider with annual sales of less than \$1,000,000.00. **Please provide proof of annual sales.		
<b>\$250.00</b>	Annual dues for Government Agency/not-for-profit organization		
TMRC Membe	rship Please send me information a Research Council (TMRC)	bout membership in the Technology Market	
Payment Inform	nation:		
Enclosed is our	check for \$		
Please bill my credit card: (circle one) MC AMEX VISA DINERS			
Card NoExp date			
Authorized Sign	ature		
Mail application with check or money order to:  IPC Dept. 77-3491 Chicago, IL 60678-3491  Fax/Mail application with credit card payment to:  IPC 2215 Sanders Road		Please attach business card of primary contact here	
Northbrook, IL 60062-6135 Tel: 847 509.9700 Fax: 847 509.9798 http://www.ipc.org			



# **Standard Improvement Form**

## IPC-SM-839

The purpose of this form is to provide the Technical Committee of IPC with input from the industry regarding usage of the subject standard.

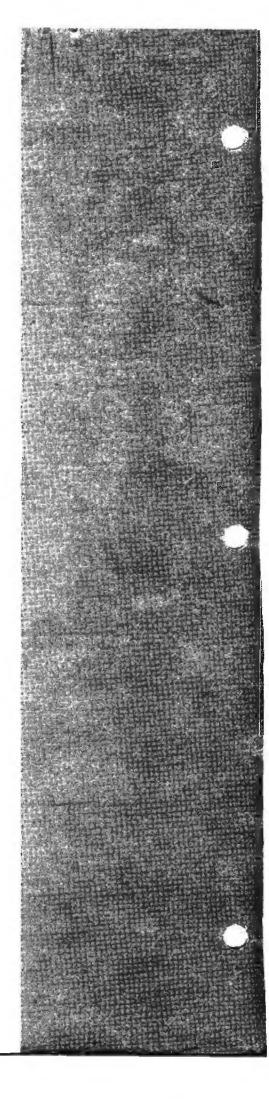
Individuals or companies are invited to submit comments to IPC. All comments will be collected and dispersed to the appropriate committee(s).

If you can provide input, please complete this form and return to:

IPC

2215 Sanders Road Northbrook, IL 60062-6135 Fax 847 509,9798

1. I recommend changes to the following:	
Requirement, paragraph number	
Test Method number, paragraph number	
The referenced paragraph number has proven to be:	
Unclear Too Rigid In Error	
Other	
2. Recommendations for correction:	
3. Other suggestions for document improvement:	
Submitted by:	
Name	Telephone
Company	E-mail
Address	
City/State/Zip	Date





2215 Sanders Road, Northbrook, IL 60062-6135 Tel 847 \$09,9700 Fax 847,509 9798 www.ipc.org

ISBN #1-580981-27-5